

アナログ・ミックスドシグナルにおけるシステム設計セミナー

MathWorks 主催

# デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の アルゴリズム・回路設計とアナログFPGA実現

群馬大学 大学院理工学府 電子情報部門

小林 春夫

[k\\_haruo@el.gunma-u.ac.jp](mailto:k_haruo@el.gunma-u.ac.jp)

講演者の研究室で研究開発を行ってきています、  
2つのクロック間の立ち上がり時間差を高時間分解能で測定する  
デルタシグマ型タイムデジタイザ回路について  
下記の内容をご紹介します。

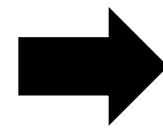
- (1) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
- (2) 開発した高精度化のアルゴリズムと  
そのMATLABシミュレーションによる効果確認
- (3) 回路設計、アナログFPGA(PSoC) 実現、測定評価結果
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

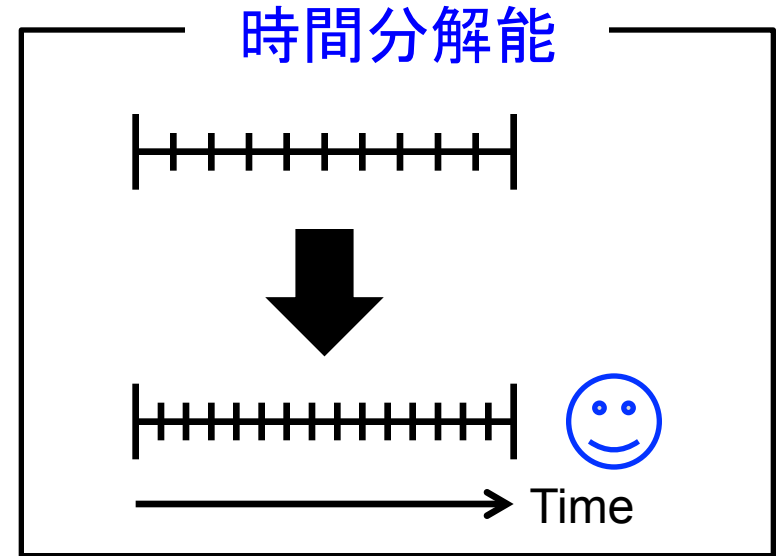
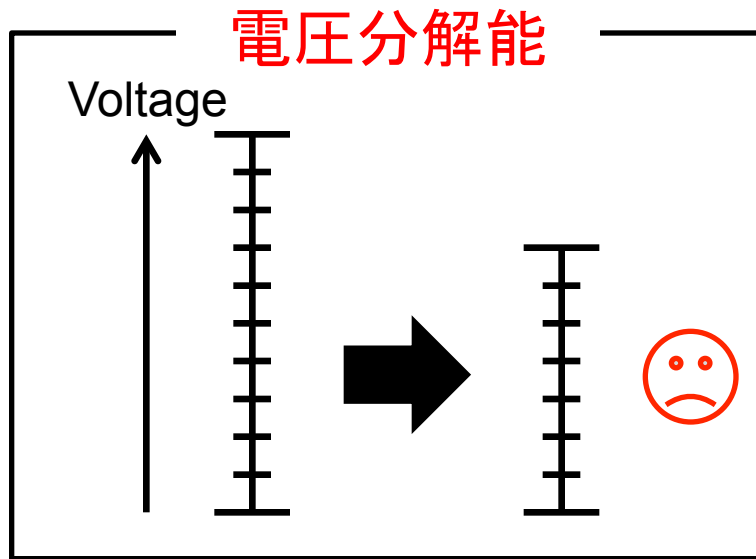
# 時間分解能回路の研究背景

集積回路プロセスの微細化



低電源電圧化

高速スイッチング化



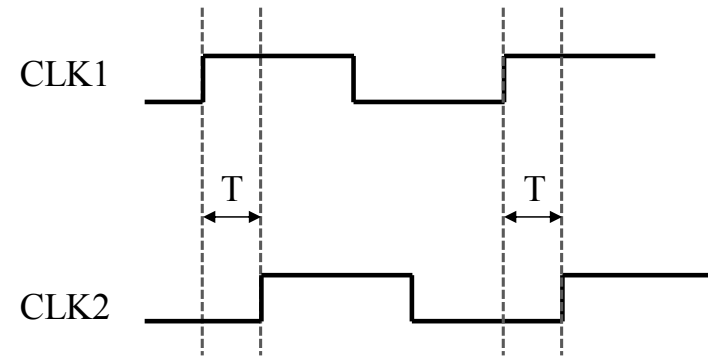
時間信号測定回路は時間領域アナログ回路のキーコンポーネント



高性能化が要求

# 研究目的 (1)

- 2つの繰返しクロック間の時間差テスト
  - DDR(Double Data Rate)メモリのデータ - クロック間の時間差テスト等
- 組み込み可能な測定回路



## 研究目的

- 短時間、高精度でテストする回路の実現

### $\Delta\Sigma$ TDC

- 高時間分解能
- 回路量：小
- 測定時間：長 (測定時間  $\propto$  精度)



- マルチビット $\Delta\Sigma$  TDCの提案
- マルチビット化に伴う非線形性補正手法の提案

## 時間信号測定回路の高性能化とアプリケーションの開発

時間信号測定回路：タイムディジタイザ回路  
(Time-to-Digital Converter: TDC)

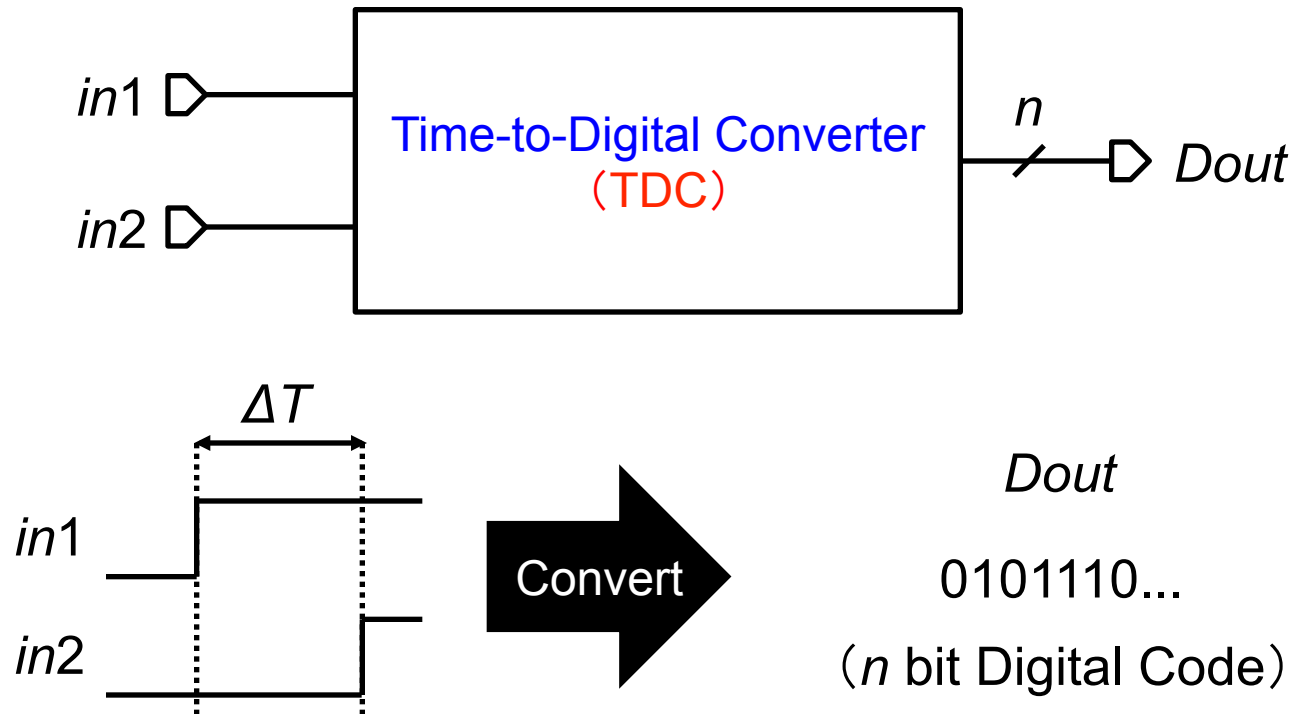
### 高性能TDCの開発と実装

- 自己校正機能を備えたフラッシュ型TDC (Flash TDC)
- デルタシグマ型TDC ( $\Delta\Sigma$  TDC)

### TDCを用いた新しいアプリケーションの開発

- $\Delta\Sigma$  TDCによる位相ノイズ測定

# タイムデジタイザ回路

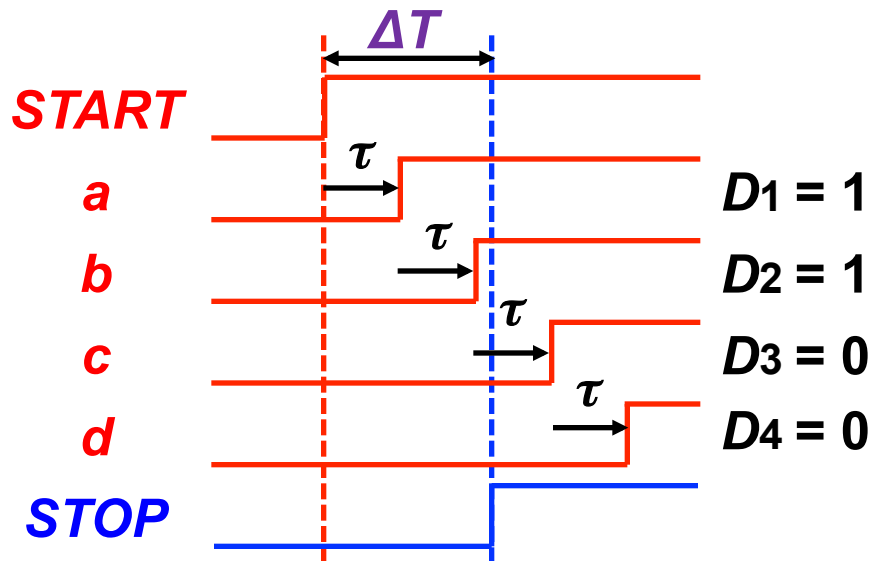
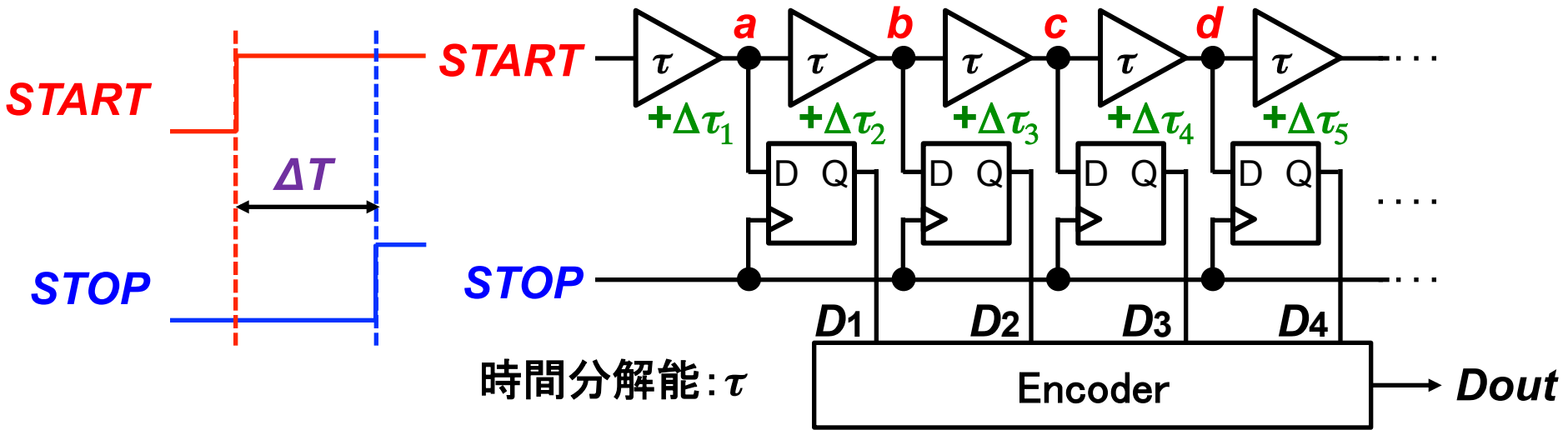


2つのデジタル信号間の時間差  $\Delta T$  をデジタル値に変換

出力のデジタル値より  $\Delta T$  を測定可能



# フラッシュ型 TDCの構成と動作

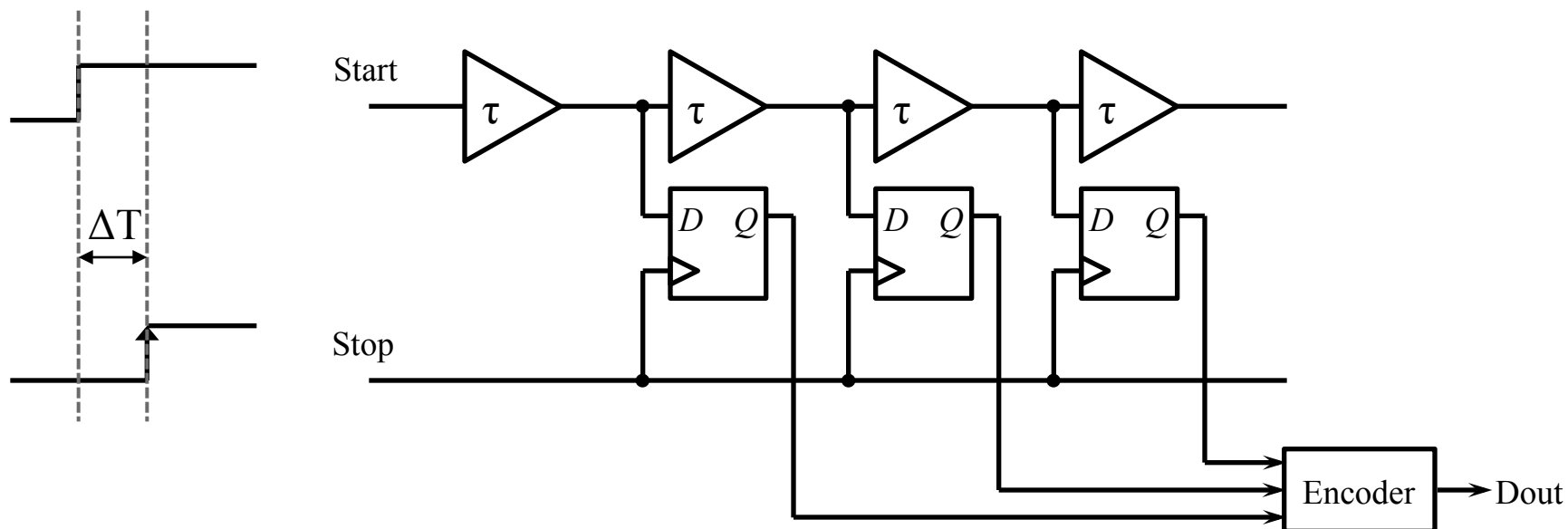


●  $\Delta T$  の大きさに比例したデジタル値 Dout を出力

● 時間分解能  $\tau$

高エネルギー加速器研究機構  
素粒子原子核研究所  
新井康夫氏による発明

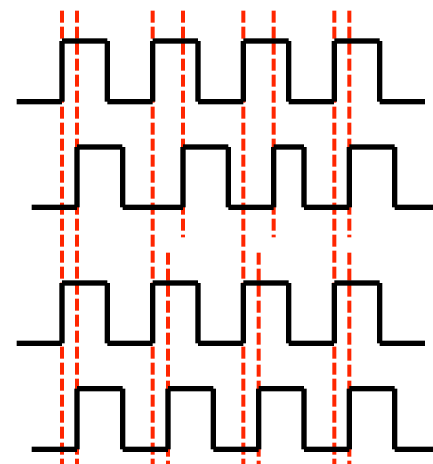
## •フラッシュ型TDC



- 任意の信号でも1回の入力で計測可
- 回路規模：大
- 時間分解能： $\tau$ で決まる
- 繰返し信号の計測
  - 何回も入力 ⇒ 高精度で測定

任意信号：Tが変化する

繰返し信号：Tが一定

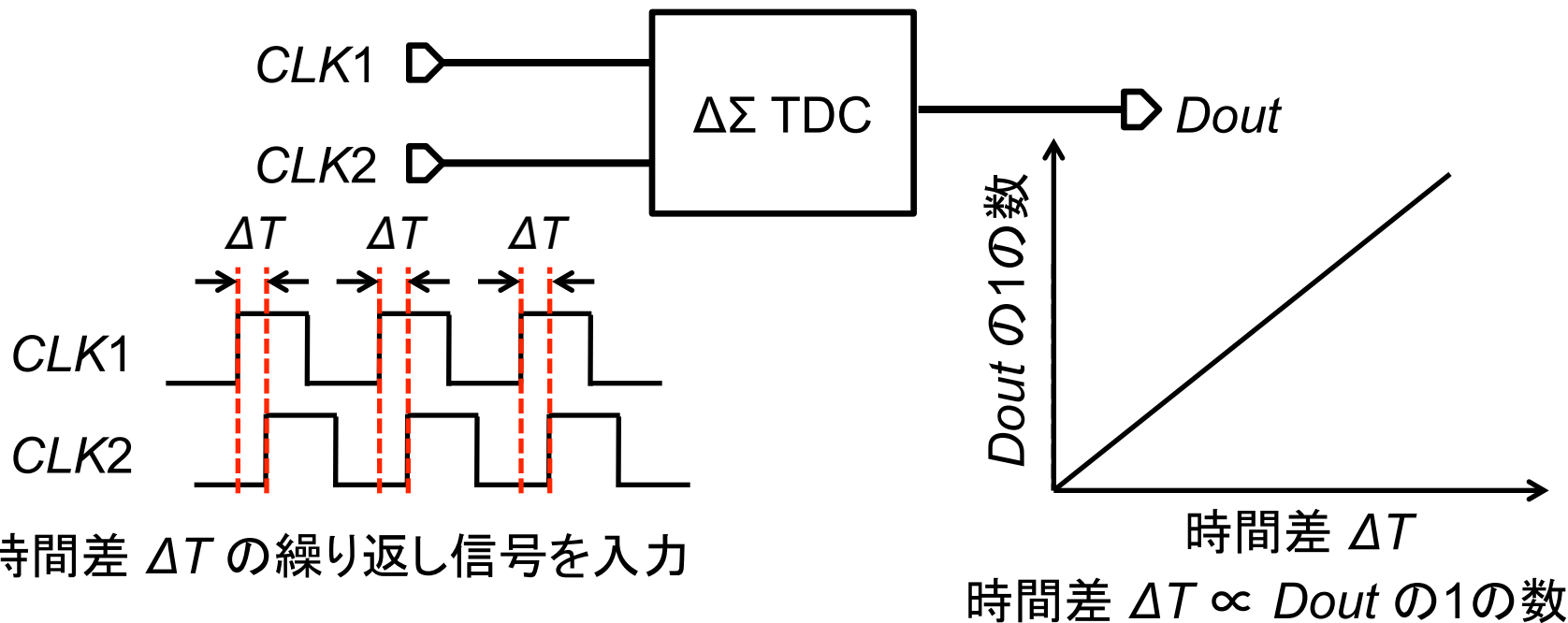


# $\Delta\Sigma$ TDCについて

繰り返し信号の時間差  $\Delta T$  の測定



デルタシグマ型TDC ( $\Delta\Sigma$  TDC)



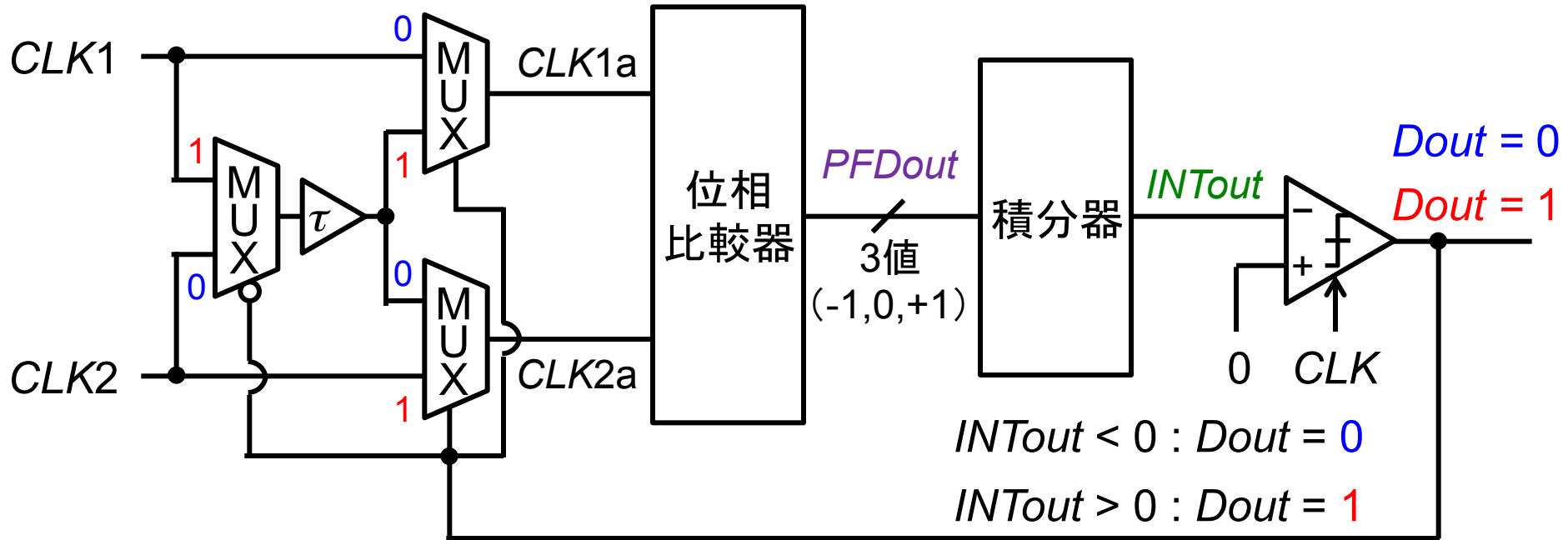
## $\Delta\Sigma$ TDCの特長

- 簡単な回路構成で回路量が少ない
- 高線形性
- 測定時間に比例して時間分解能が向上

米国  
オレゴン州立大学  
による発明

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - **デルタシグマ変調技術**
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

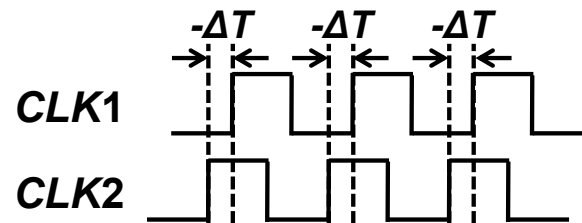
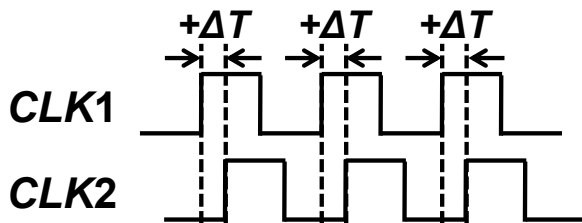
# ΔΣ TDCの構成



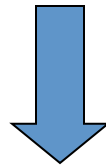
デレイライン, 位相比較器, 積分器, コンパレータによって構成

時間分解能 :  $\frac{2\tau}{Doutの全体の数N_{DATA} (0と1の合計)}$

測定可能範囲 :  $-\tau < \Delta T < +\tau$

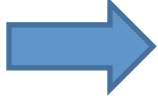


- アナログ最小、デジタルリッチな構成  
ナノCMOSではデジタルは大きな恩恵
- スピードを精度に変換  
ナノCMOSではスピードに余裕
- 高精度なデバイス、回路不要



ナノCMOSで高精度なAD/DACを  
実現するのに適した構成

1960年 **安田靖彦先生**(当時 東大大学院生  
現 東大・早稲田大学名誉教授)が考案。

- 近年の集積回路技術の進展に適した方式  
     活発に研究・開発、実用化。
- ◆ AD/DA変換器、完全デジタルPLL回路  
    時間デジタイザ回路等幅広く応用。
- ◆ 性能向上が著しい

# 発明者の安田靖彦先生に偶然にお会いする<sup>16</sup>

2011年11月29日(火)  
於 スウェーデン大使館

新津葵一先生  
エリクソン・ヤング・  
サイエンティスト・アワード  
受賞式 懇親会にて

安田先生は  
審査員のお一人



↑  
新津先生



↑  
安田先生



# $\Delta\Sigma$ か $\Sigma\Delta$ か

$\Delta\Sigma$  (デルタシグマ) 安田靖彦先生の主張

$\Sigma\Delta$  (シグマデルタ) IEEE の論文

$\Delta\Sigma$  or  $\Sigma\Delta$  ? That is a question.



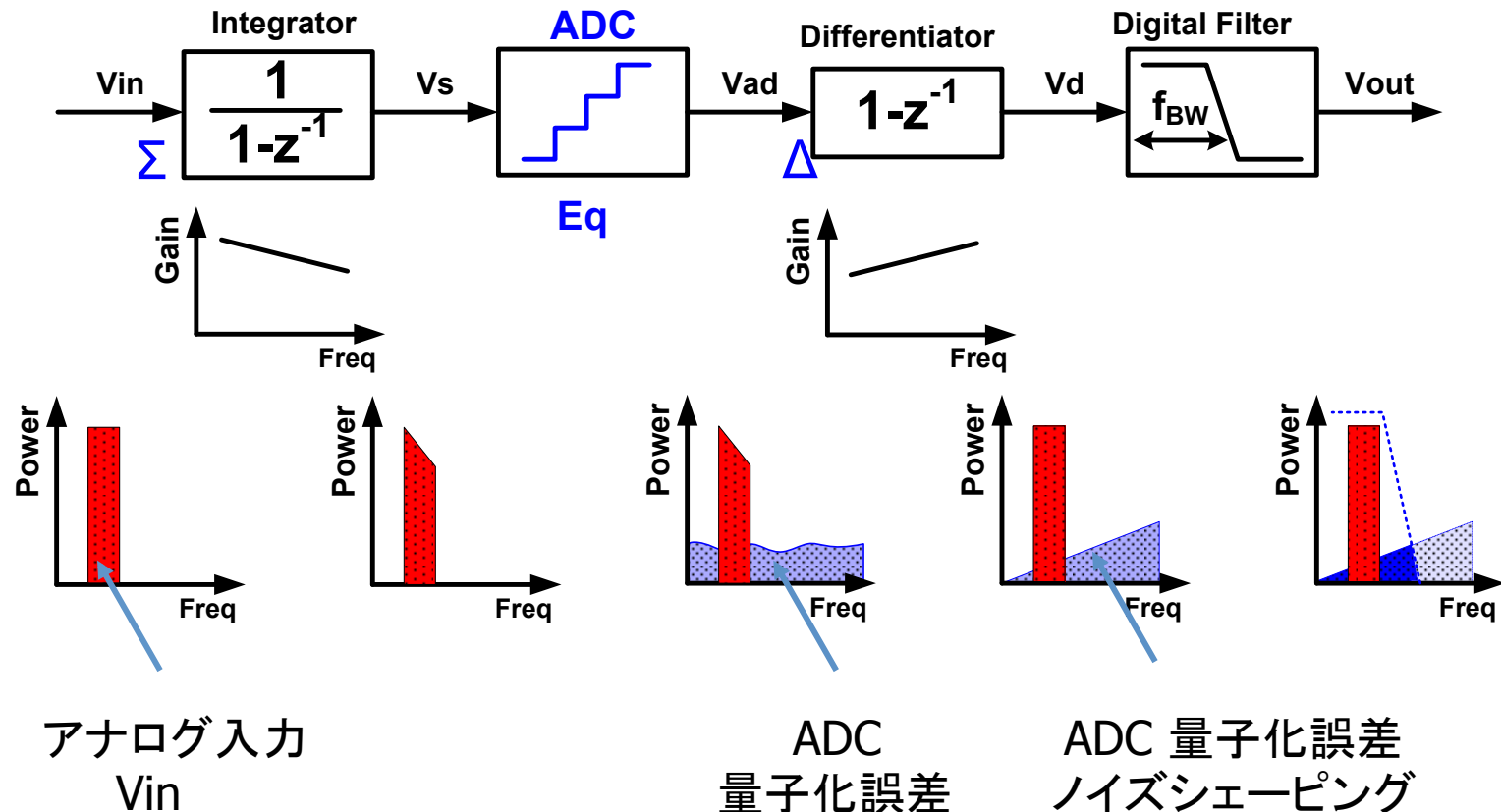
Hamlet

発明者の安田先生にしたがい

$\Delta\Sigma$

# $\Delta\Sigma$ AD変調器の構成

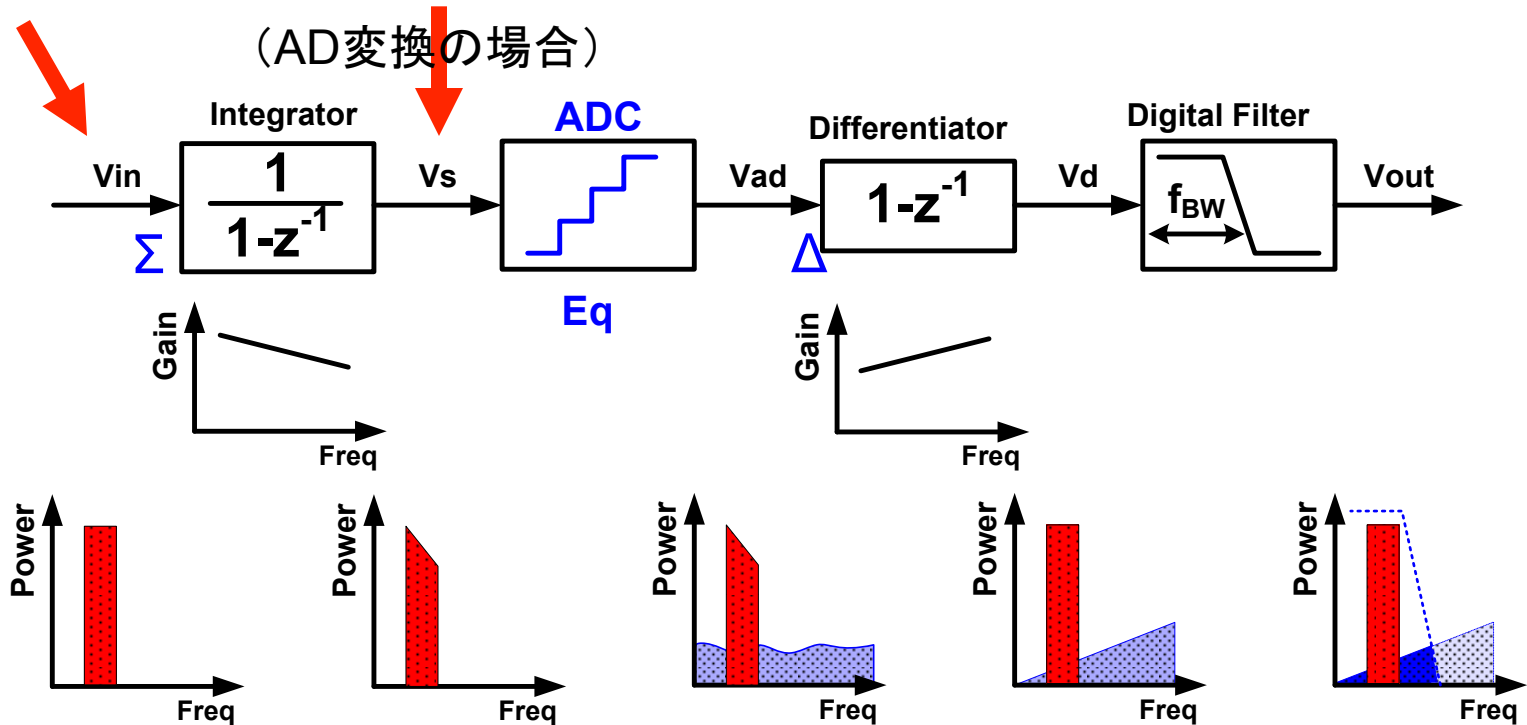
## 入力を積分してから $\Delta$ 変調



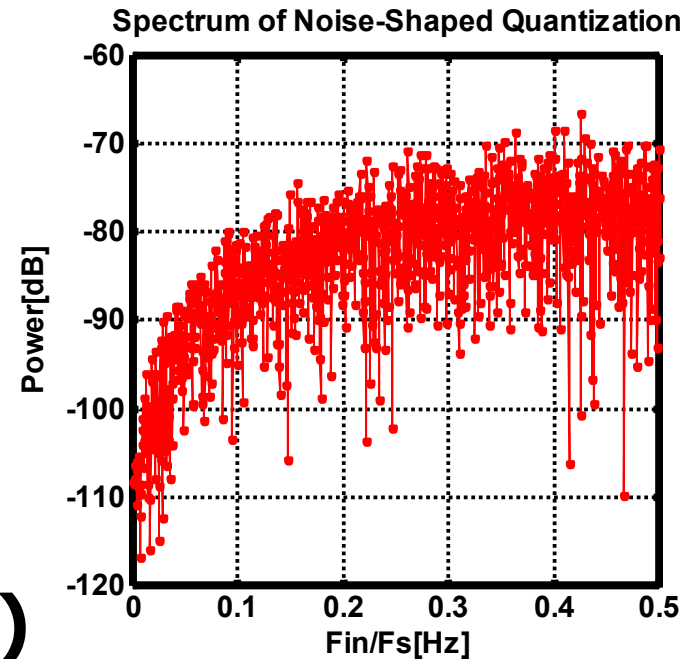
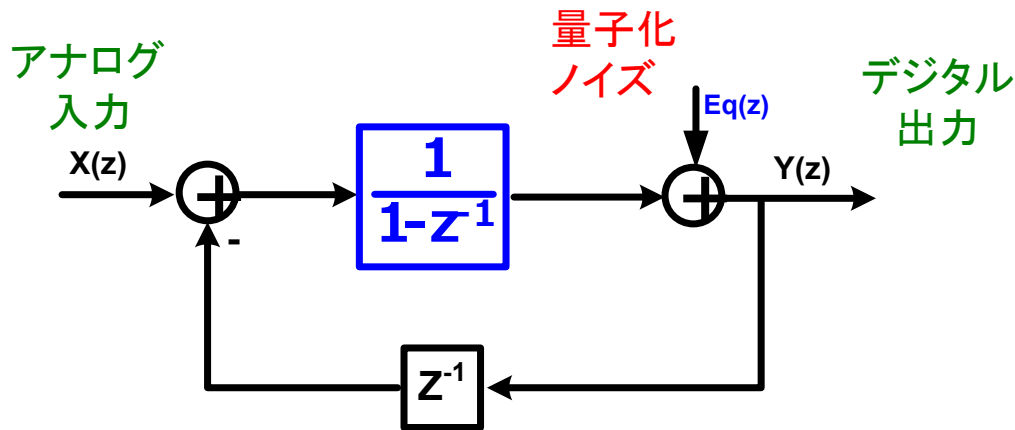
直接は実現できない

DC入力の場合

無限大になってしまう



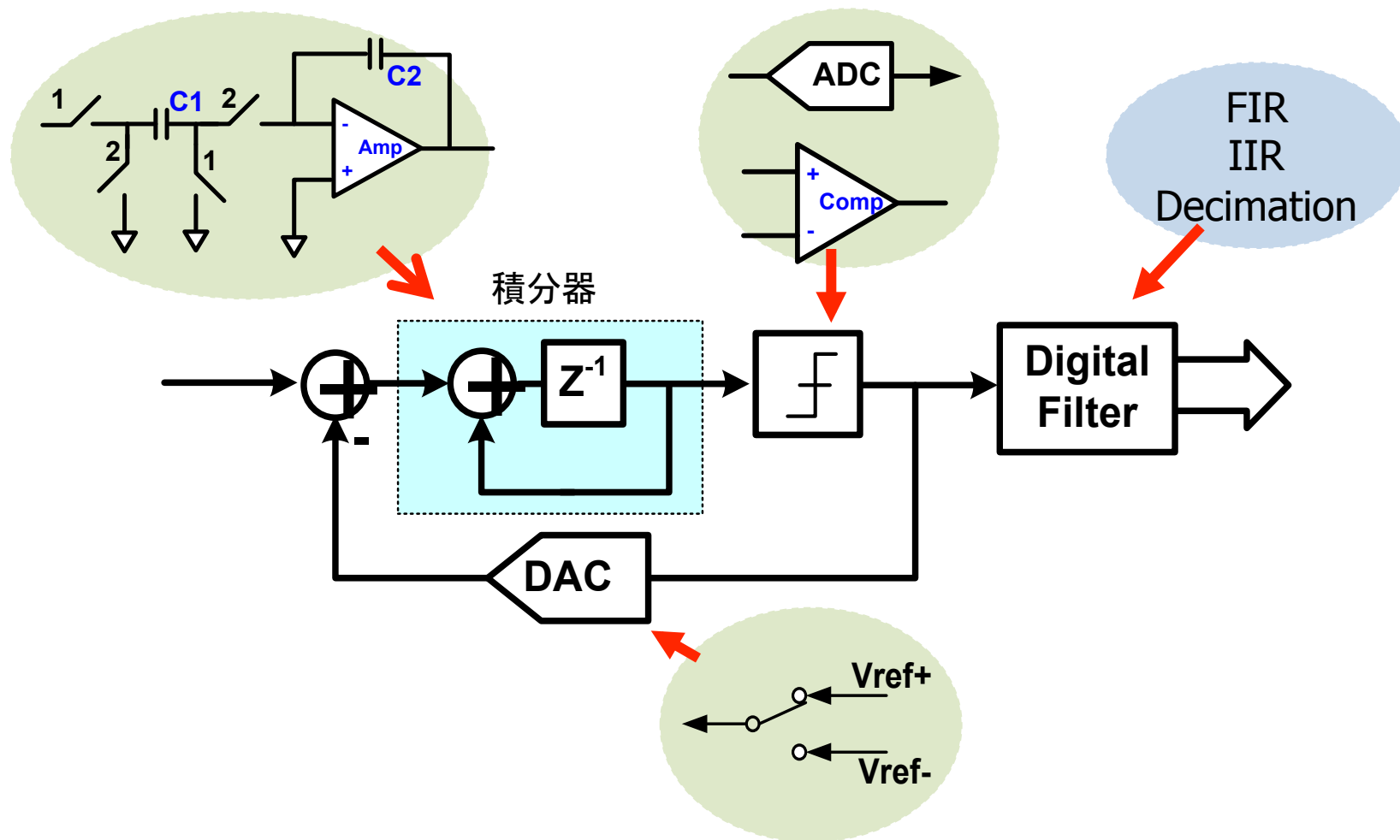
# $\Delta\Sigma$ AD変調の等価実現



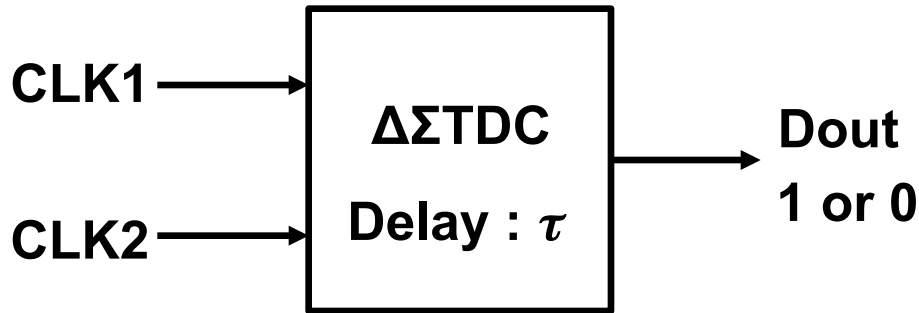
$$Y(z) = X(z) + (1 - z^{-1}) \cdot Eq(z)$$

量子化ノイズを高域に移し、帯域内ノイズを低減

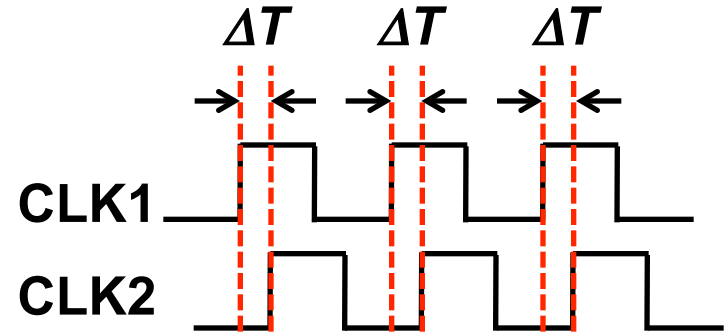
# $\Delta\Sigma$ ADCの構成と回路



- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - **デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作**
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ



繰り返しクロックの時間差： $\Delta T$



$\Delta T$ がDoutのパルス"1"の個数に比例

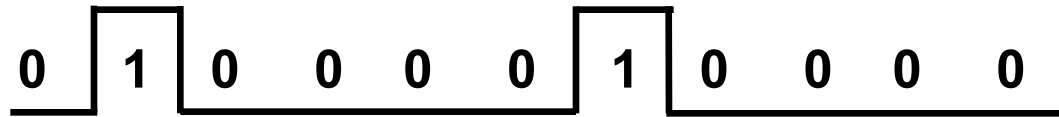
$\Delta T$

1の数

Dout

小

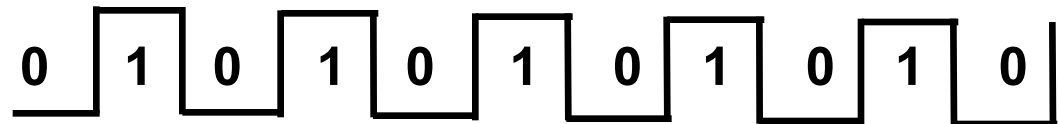
少



中

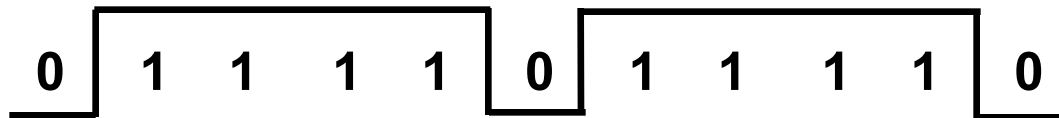


中

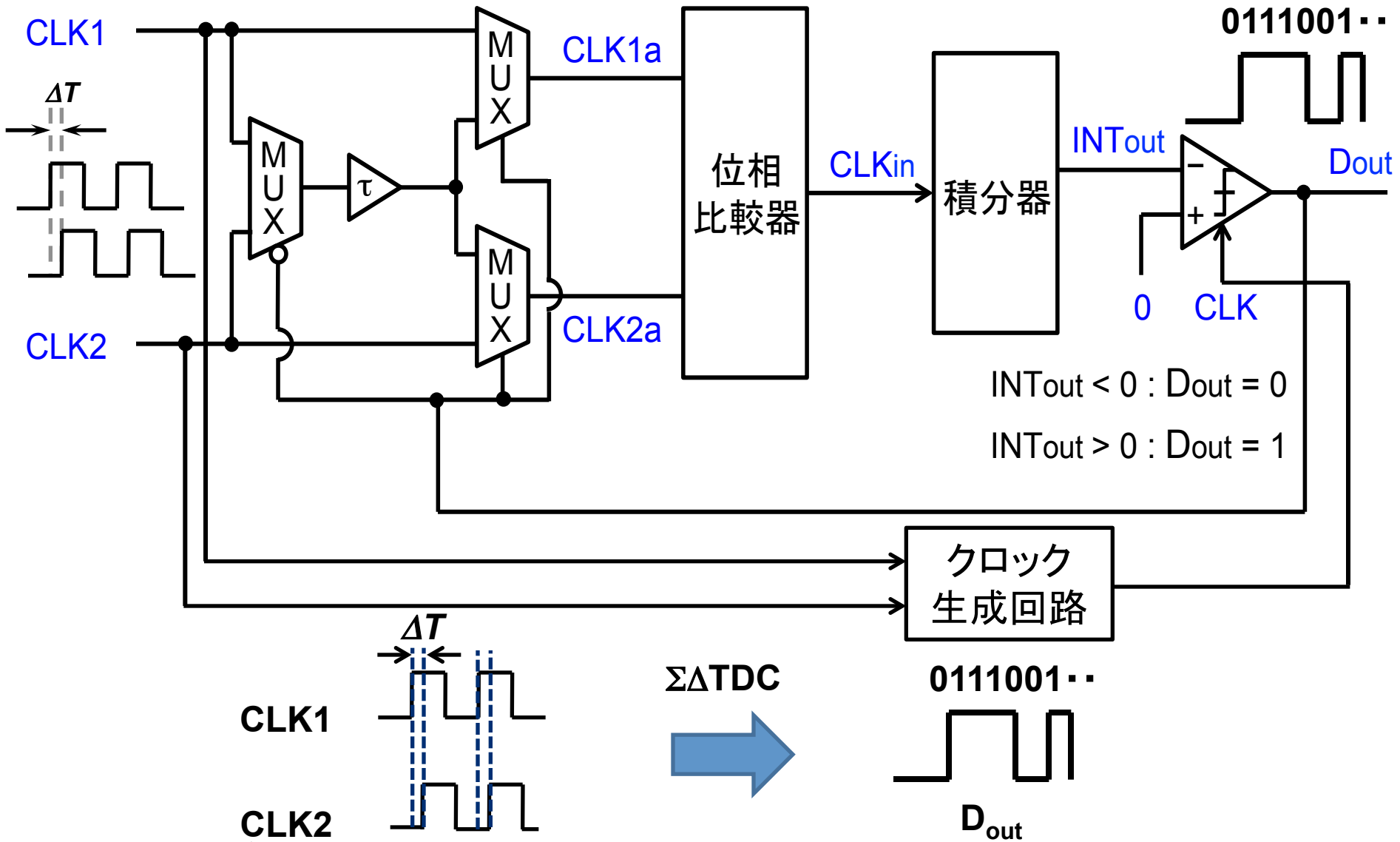


大

多

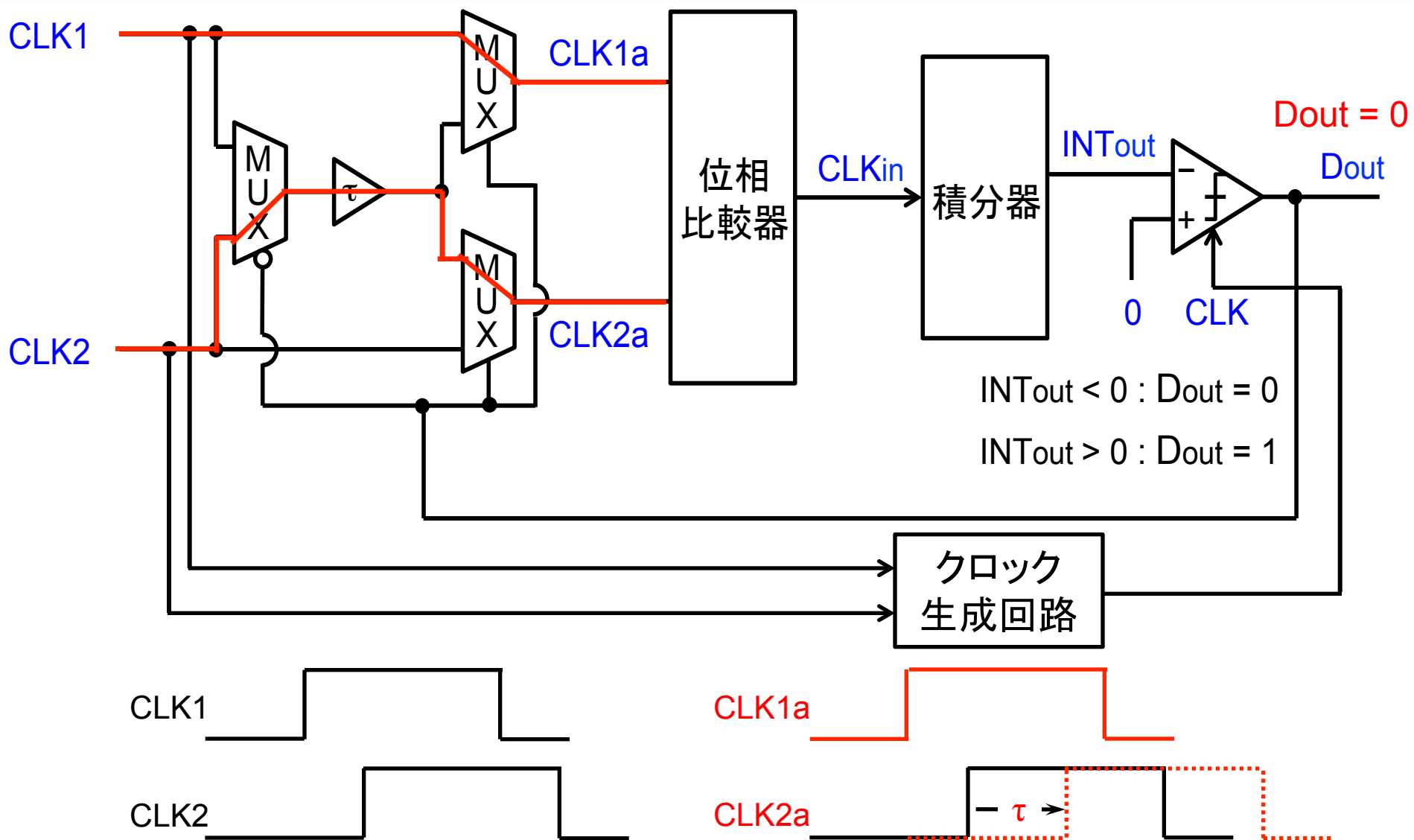


# $\Delta\Sigma$ TDCの構成

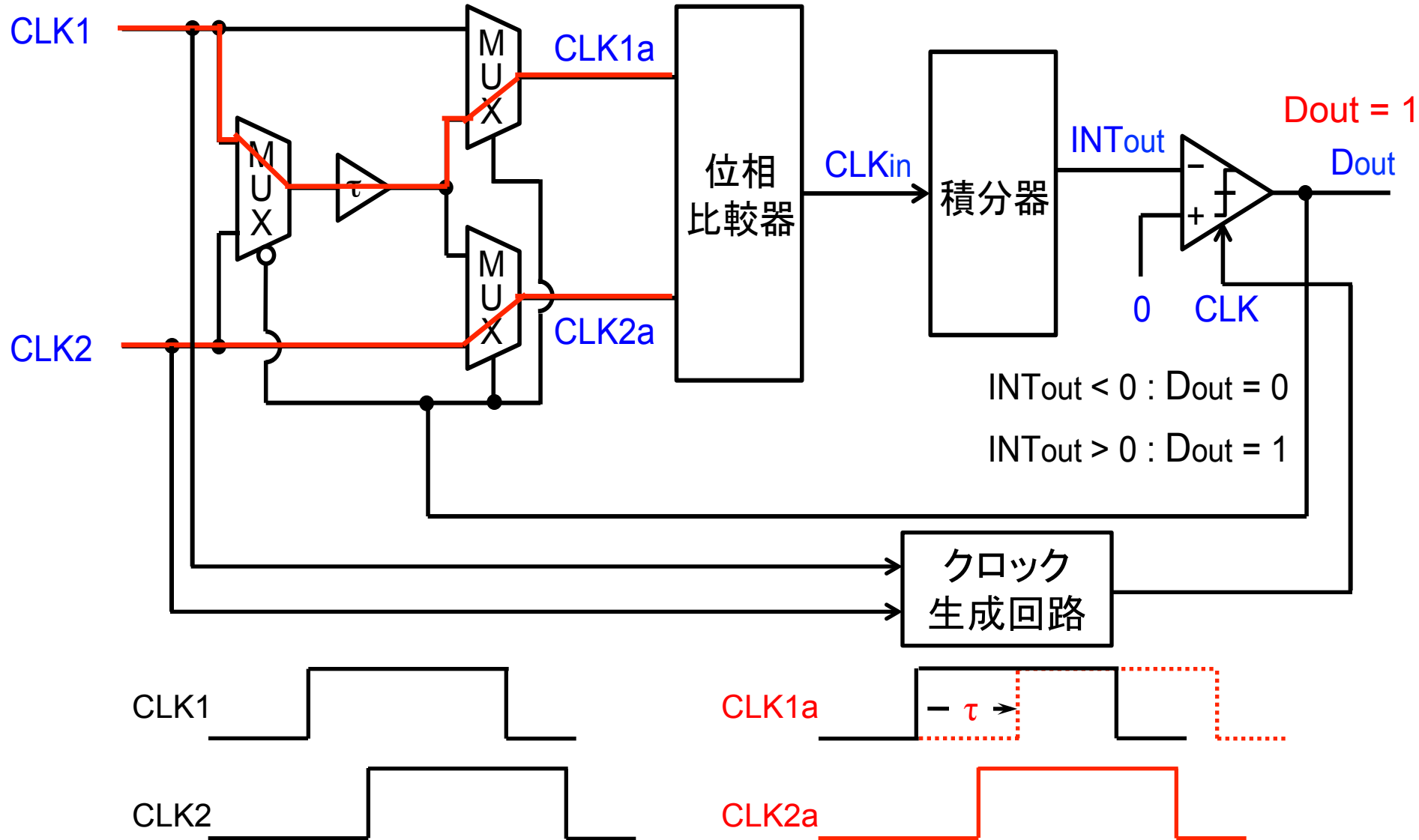


- $\Delta T$ がDoutのパルス"1"の個数に比例
- 測定可能範囲 :  $-\tau < \Delta T < \tau$

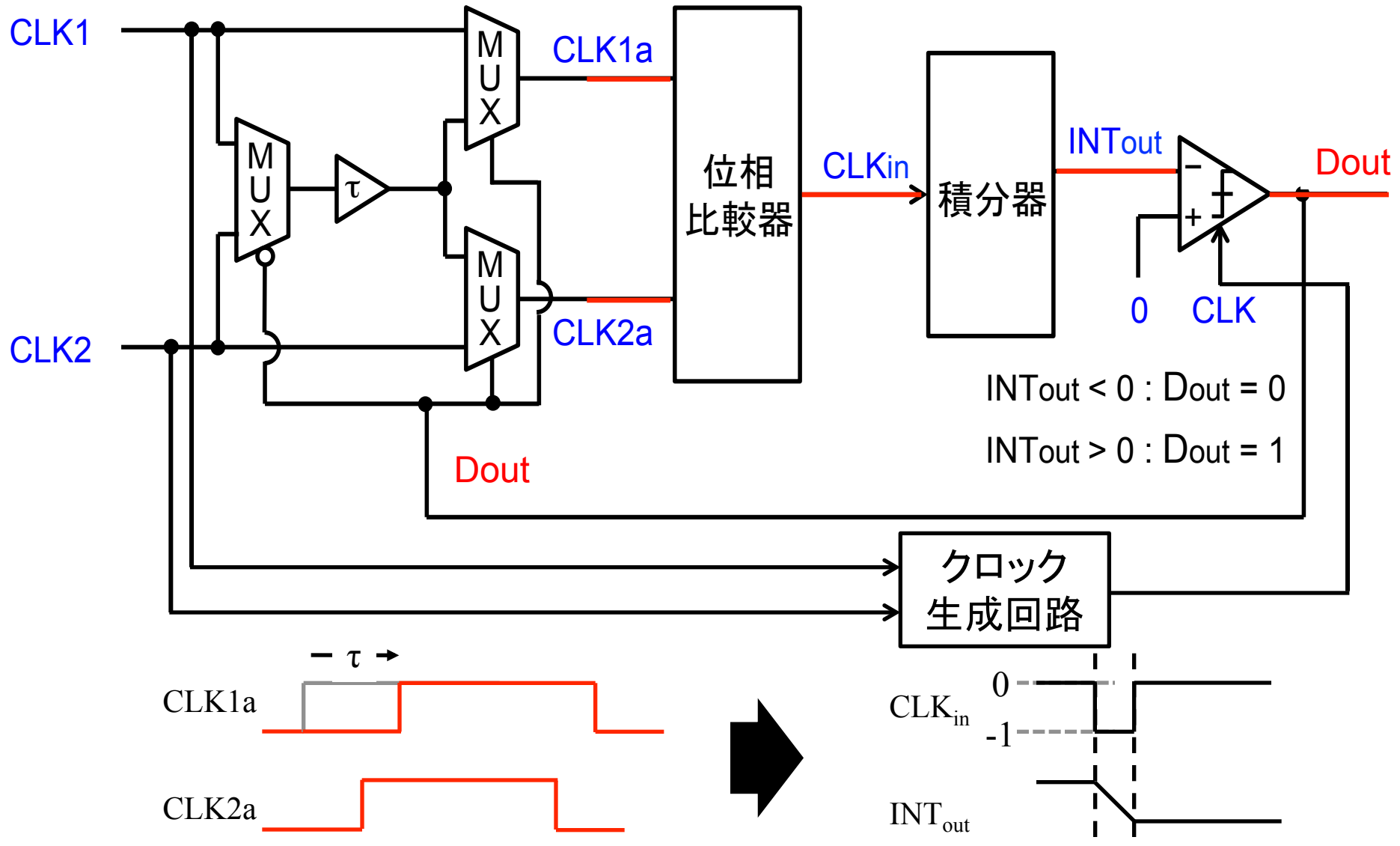




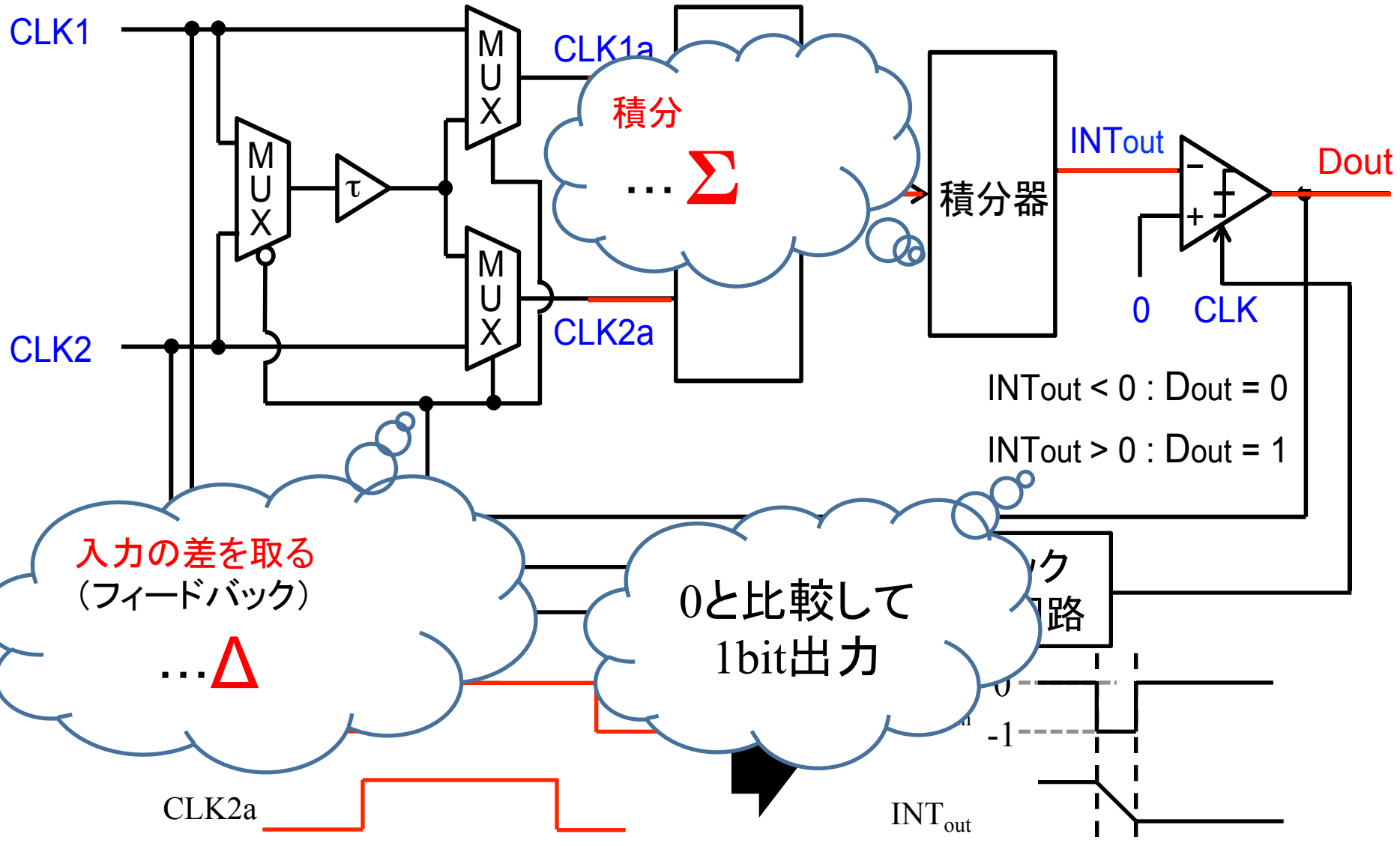
- $CLK1$ と $CLK2$ を入力
- 比較器出力により経路選択 →  $CLK1a$ ,  $CLK2a$ を得る



- CLK1とCLK2を入力
- 比較器出力により経路選択 → CLK1a, CLK2aを得る



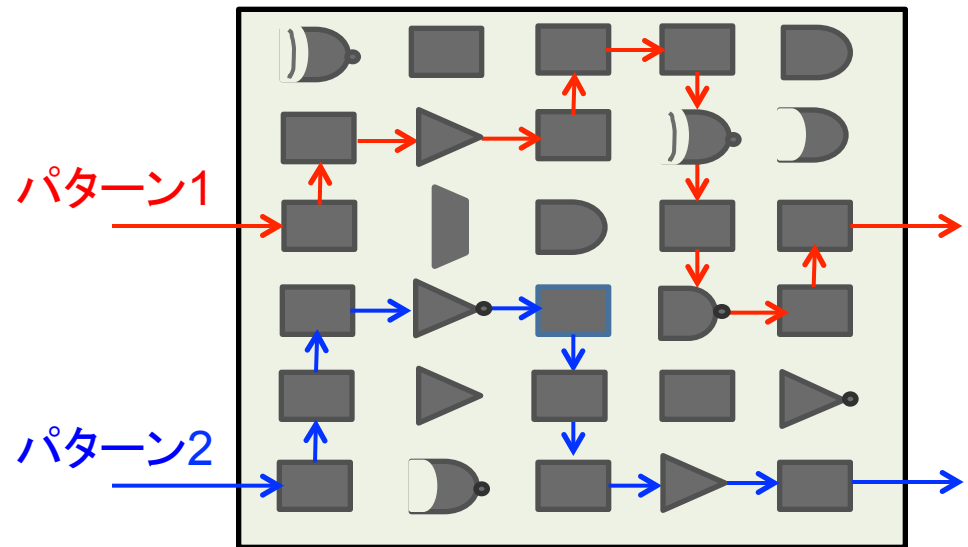
- 位相差 $CLK_{in}$ を出力
- 比較器で $INT_{out}$ を0と比較し、出力 $D_{out}$ を得る → 次のクロックでの経路を制御



- 位相差 $CLK_{in}$ を出力
- 比較器で $INT_{out}$ を0と比較し、出力 $D_{out}$ を得る → 次のクロックでの経路を制御

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - **アナログFPGA実現**
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

Programmable System-on-Chip (PSoC) Cypress Semiconductor社

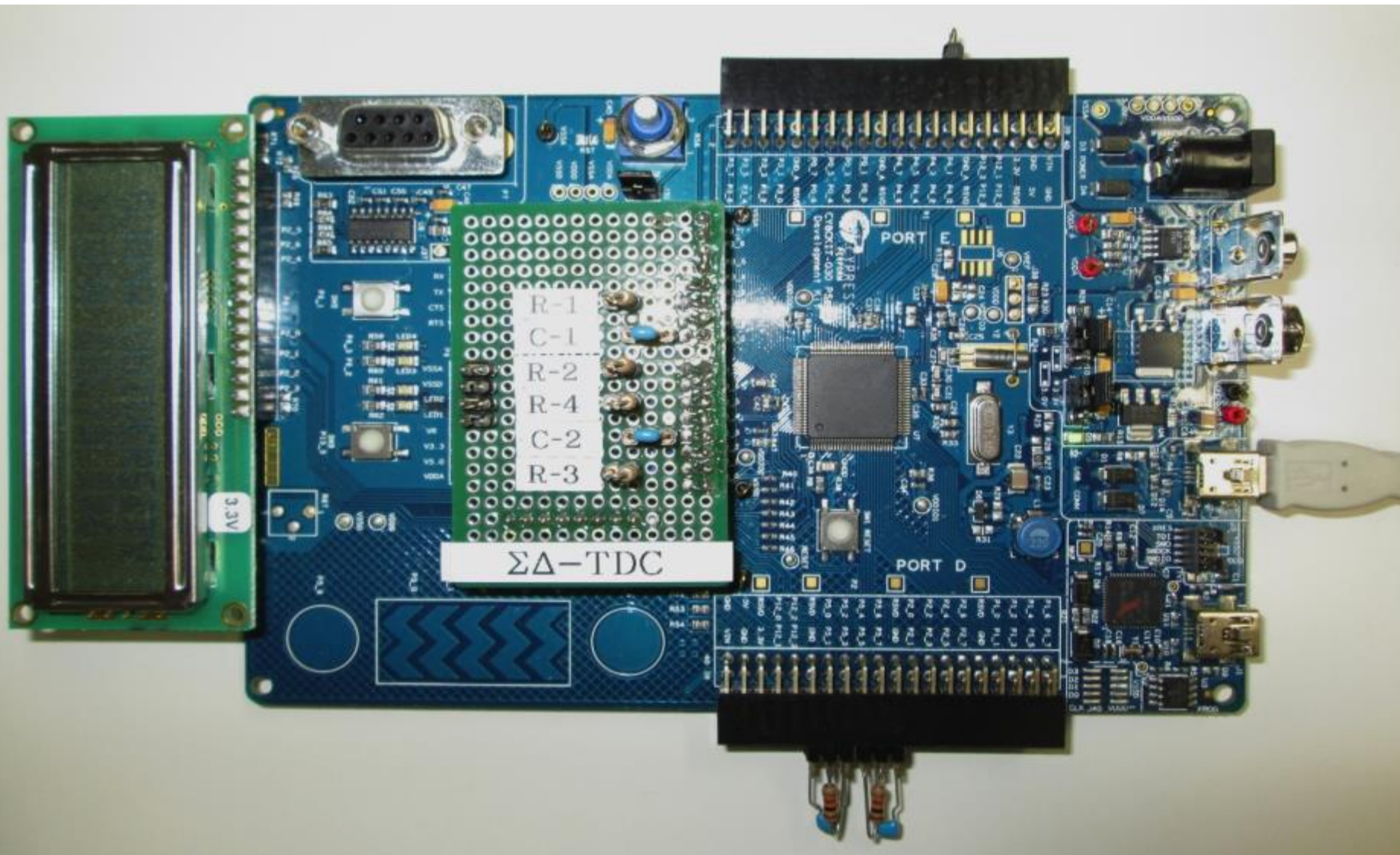


配線の変更によりアナログ・デジタル混載回路を自由に設計可能

PSoCで実現する利点

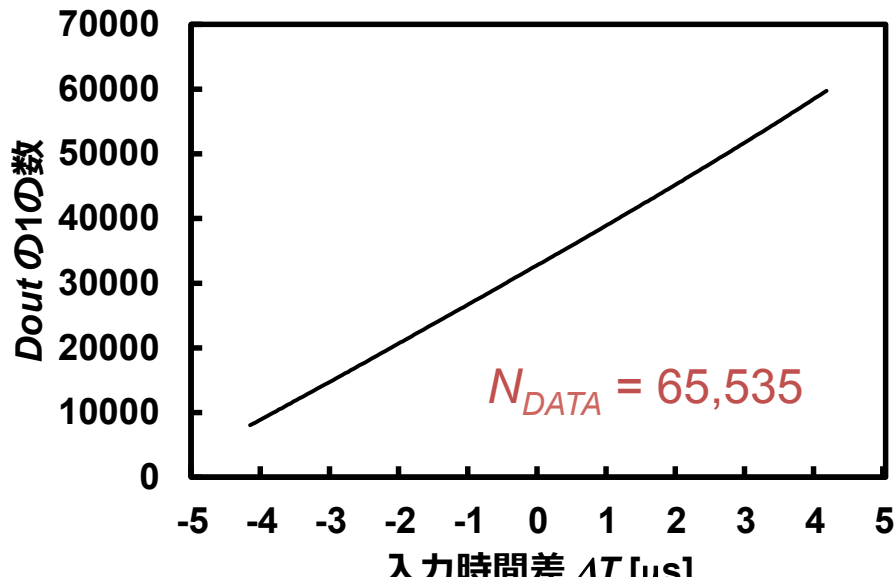
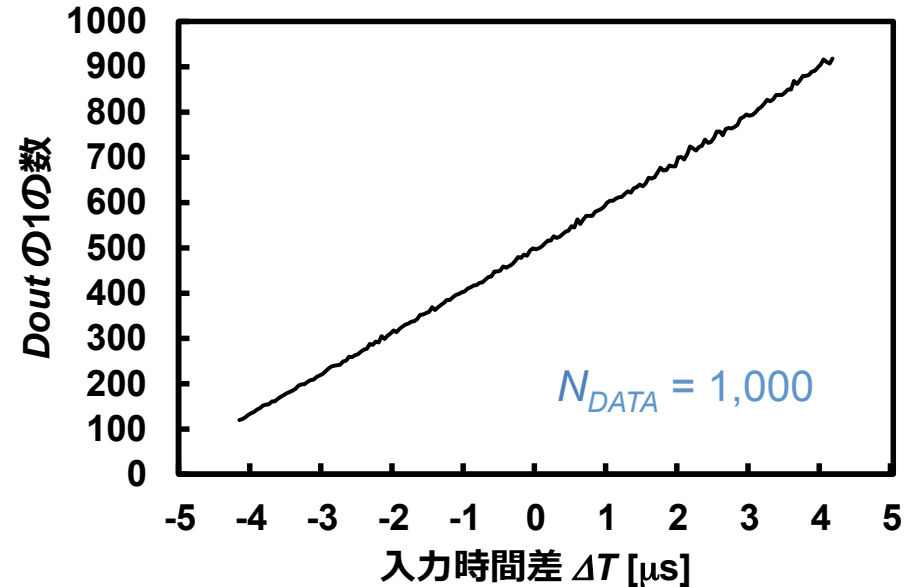
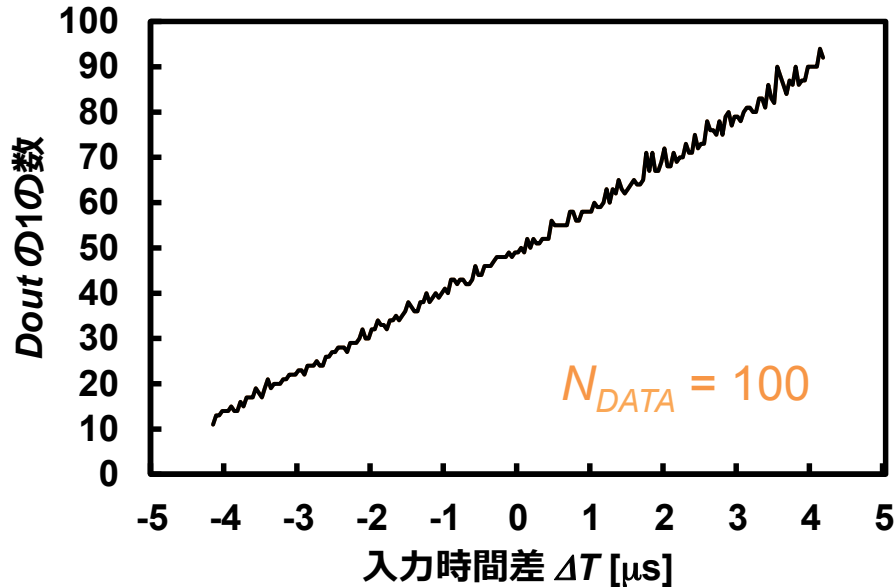
- 低コスト
- 開発期間が短い
- オンチップでデバッグ・修正が可能
- 試験結果を容易に出力可能

# $\Delta\Sigma$ TDCを実装したPSoC



# PSoC $\Delta\Sigma$ TDC測定結果

全出力数 $N_{DATA}$ を100, 1,000, 65,535としたときの測定結果



時間分解能の理論式

$$N_{DATA} = 100 : \frac{2 \times 5 \mu\text{s}}{100} = 100 \text{ns}$$

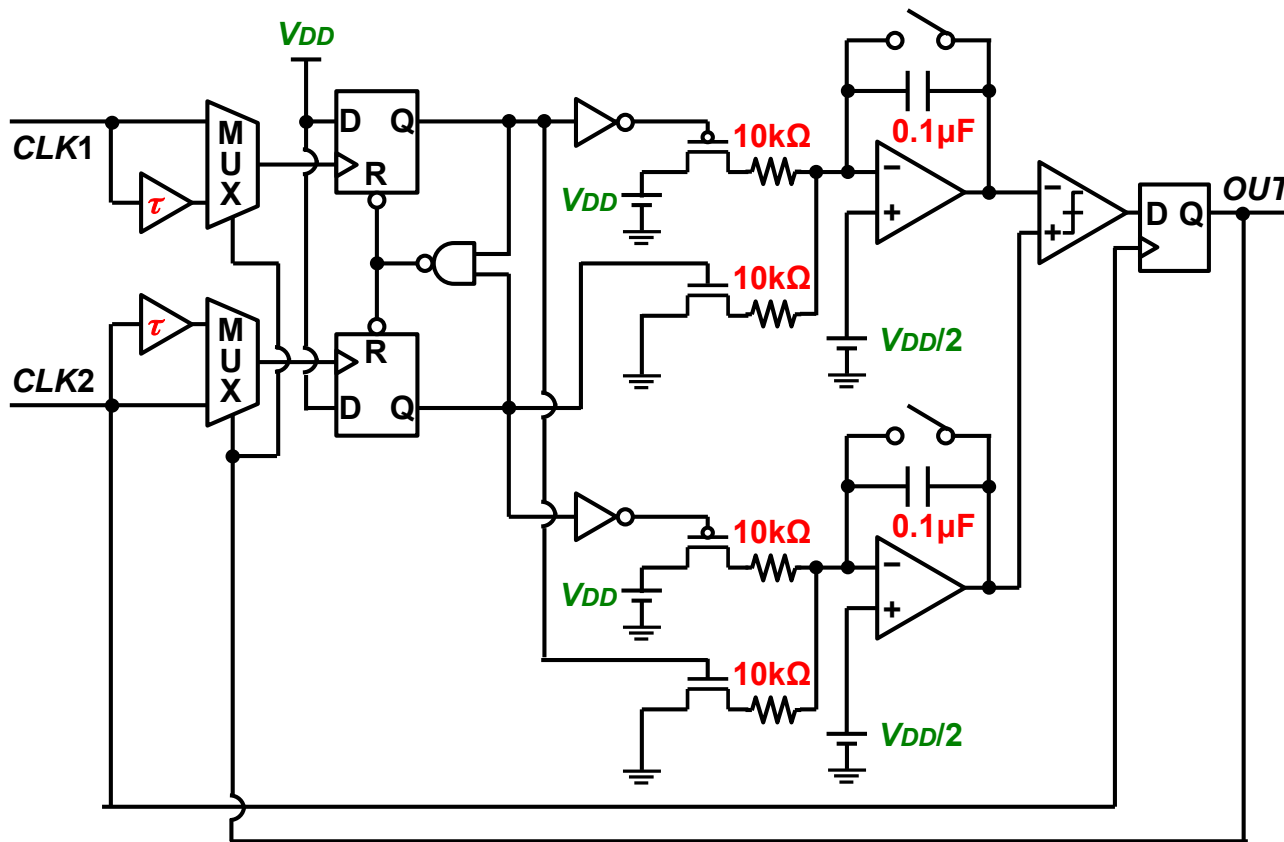
$$N_{DATA} = 1,000 : \frac{2 \times 5 \mu\text{s}}{1000} = 10 \text{ns}$$

$$N_{DATA} = 65,535 : \frac{2 \times 5 \mu\text{s}}{65535} = 153 \text{ps}$$

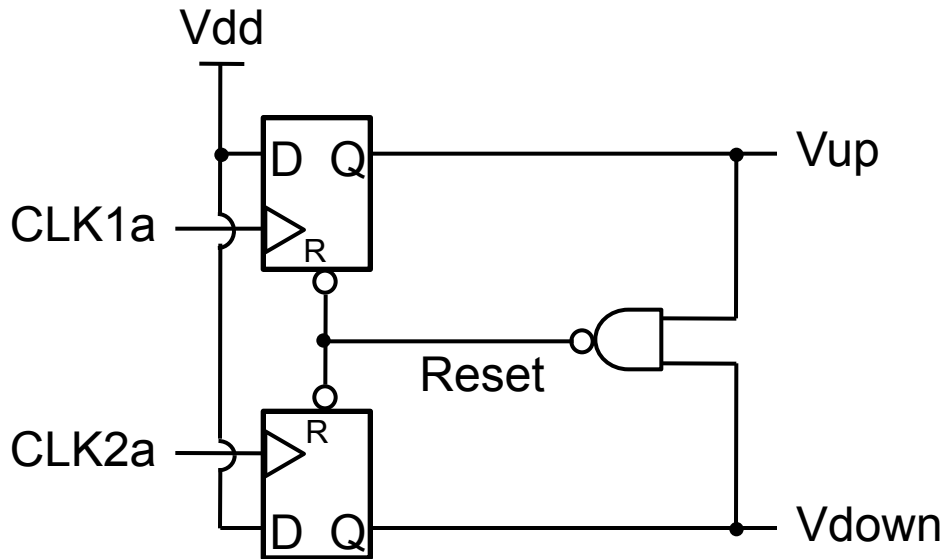
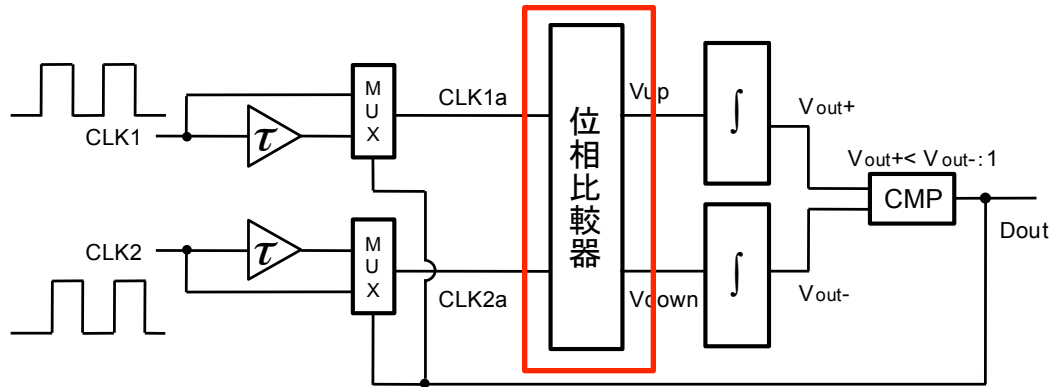
出力数増加による時間分解能を評価



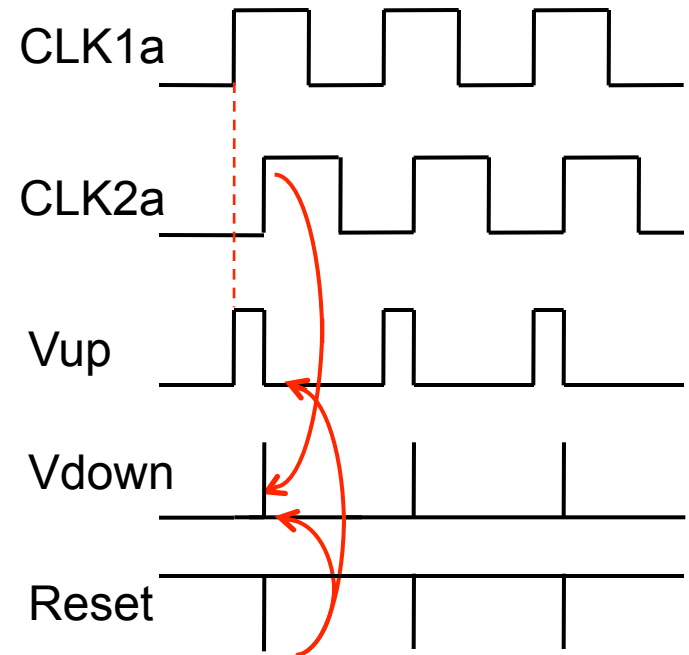
# PSoC実装した $\Delta\Sigma$ TDC回路



電源電圧 $V_{DD}$	3.3V
遅延素子 $\tau$	約 $5\mu\text{s}$
入力周波数	20kHz
入力時間差 $\Delta T$	$-4.17\mu\text{s} < \Delta T < 4.17\mu\text{s}$ 41.7ns刻みで変化

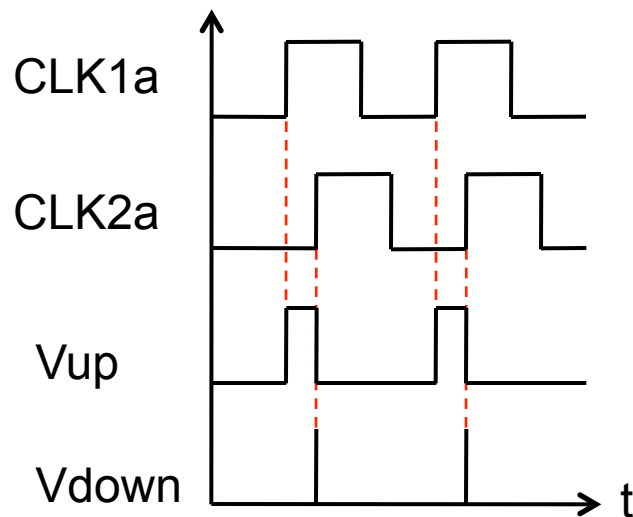


NAND型位相比較器

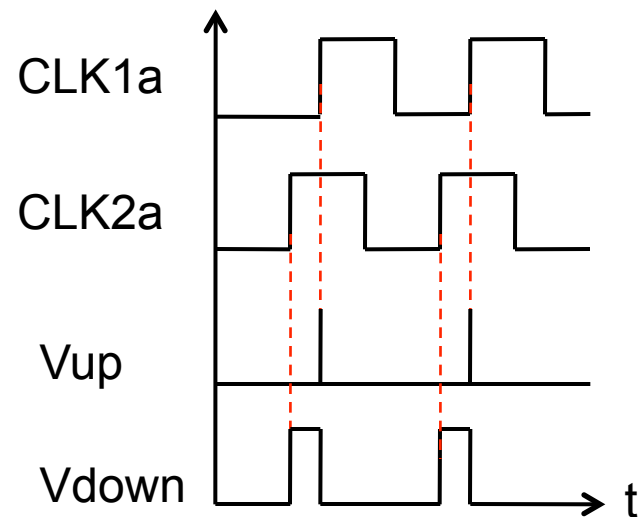


タイミングチャート

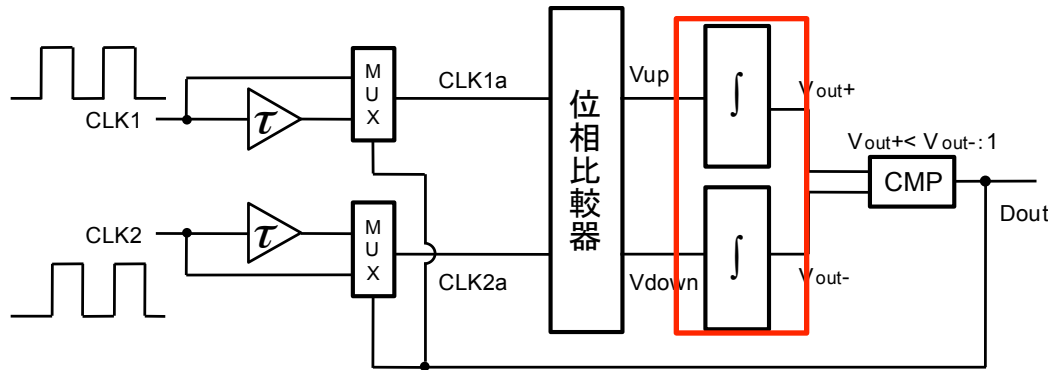
CLK1aとCLK2aの立ち上がりエッジのタイミングにより  
出力が異なる



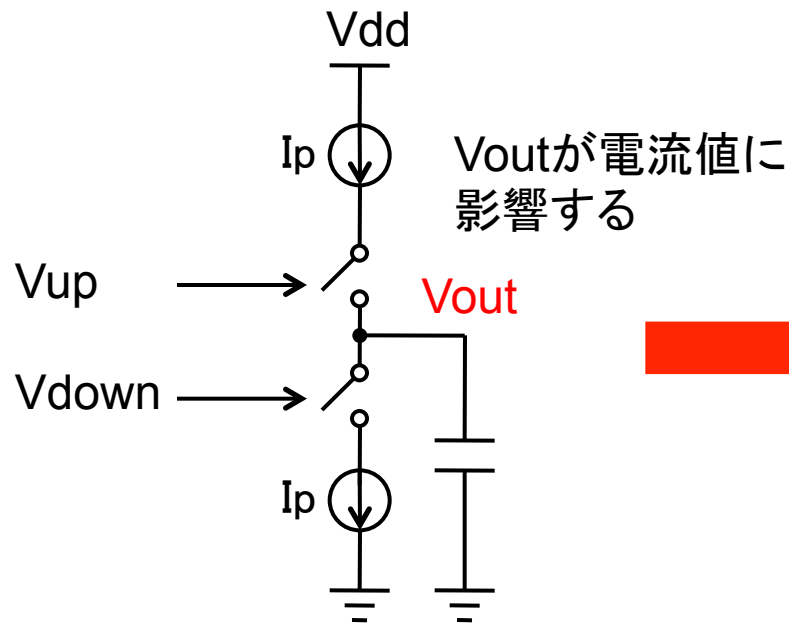
CLK1aの立ち上がりエッジが  
CLK2aのエッジよりも速い場合



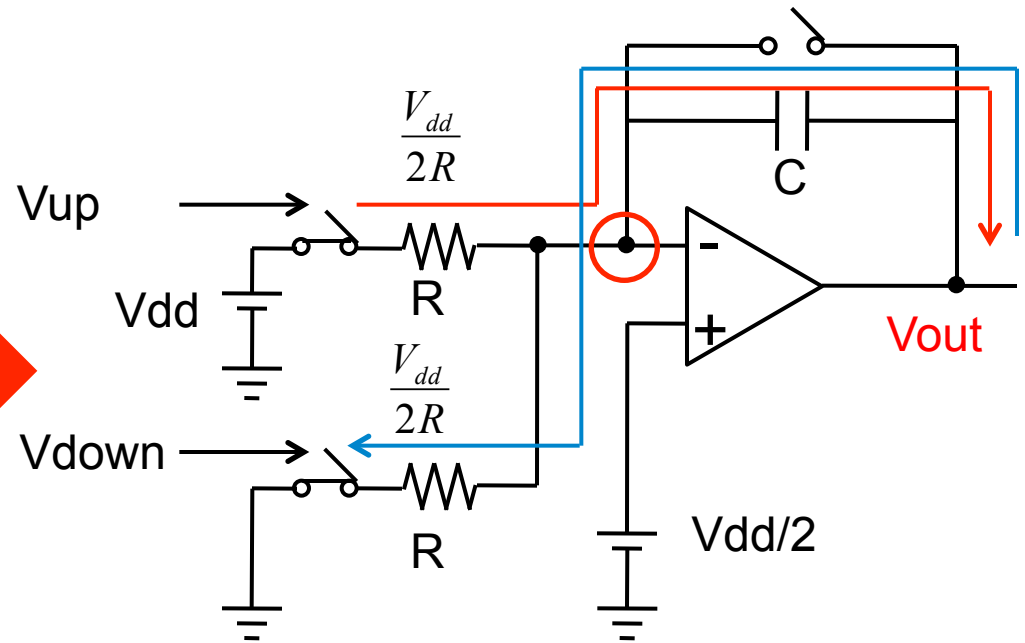
CLK2aの立ち上がりエッジが  
CLK1aのエッジよりも速い場合



- オペアンプの仮想短絡を利用
- 電圧源と抵抗で電流を発生

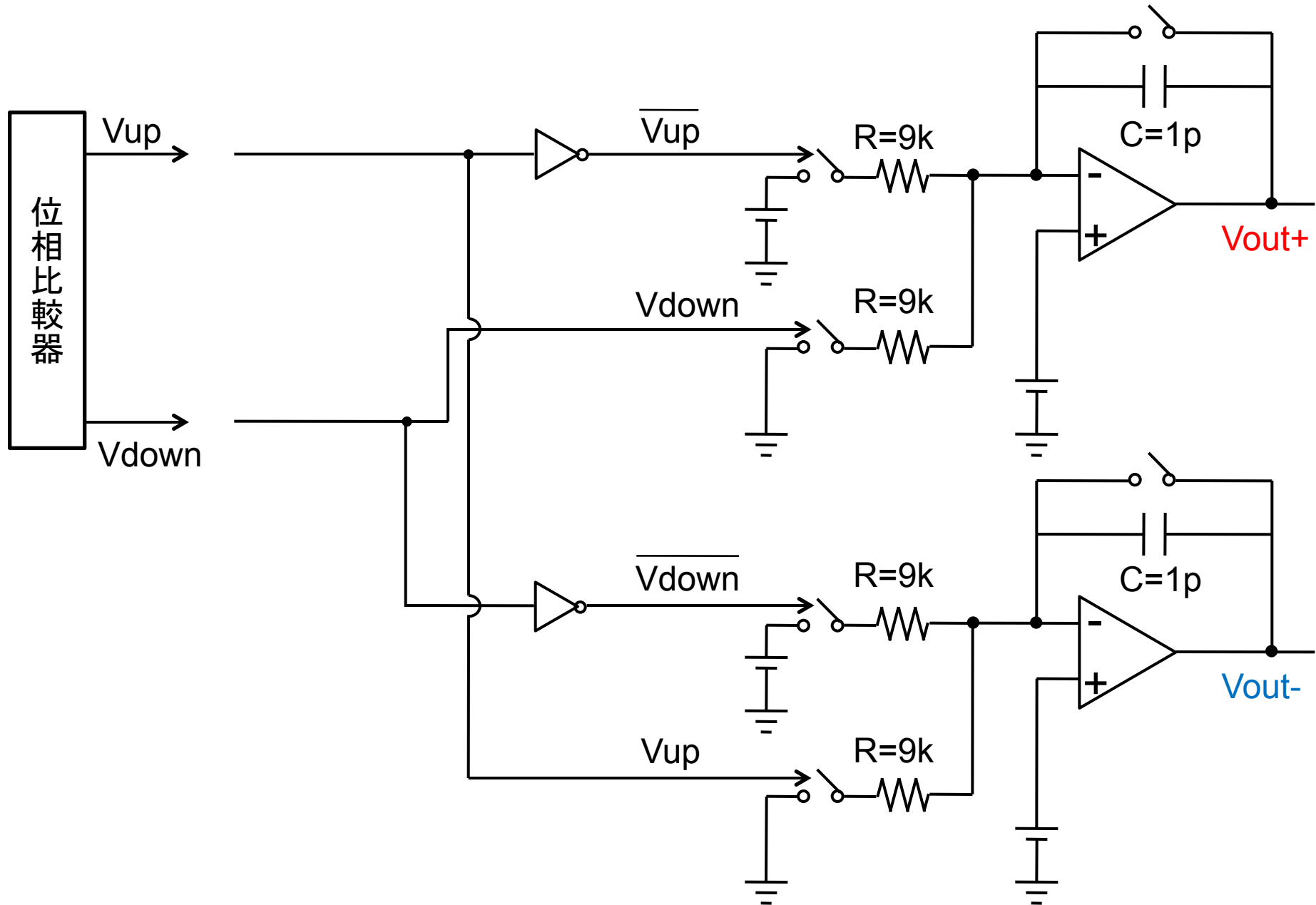


基本型チャージポンプ

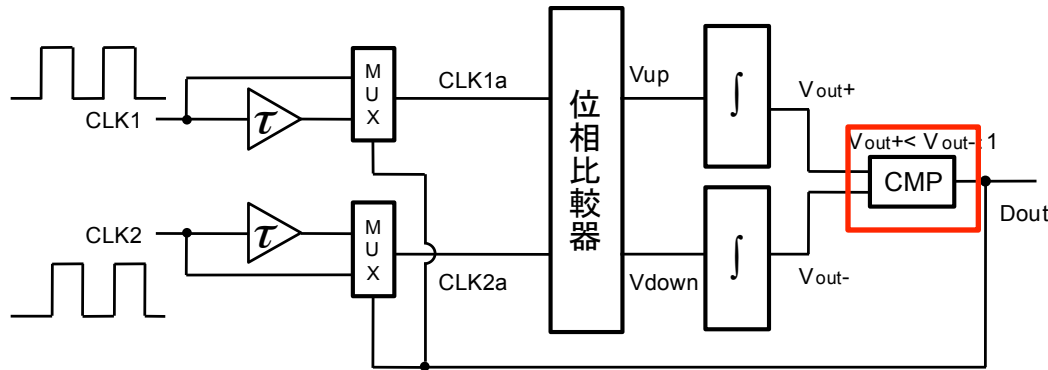


オペアンプ型チャージポンプ

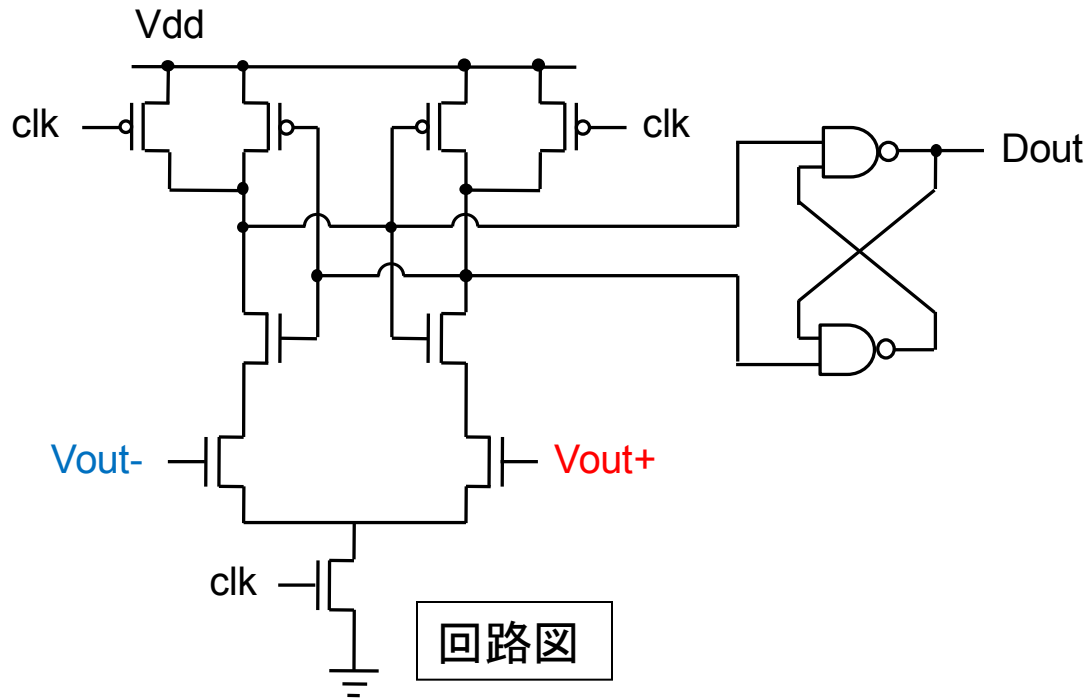
# 位相比較器とチャージポンプの接続



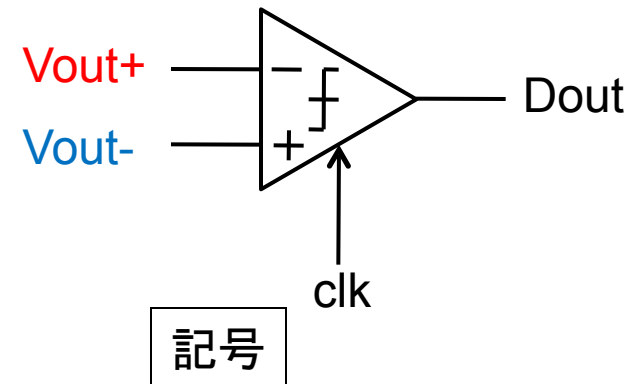
# コンパレータの回路設計



MOS	W[ $\mu$ m]/L[ $\mu$ m]
PMOS	6/0.18
NMOS	2/0.18

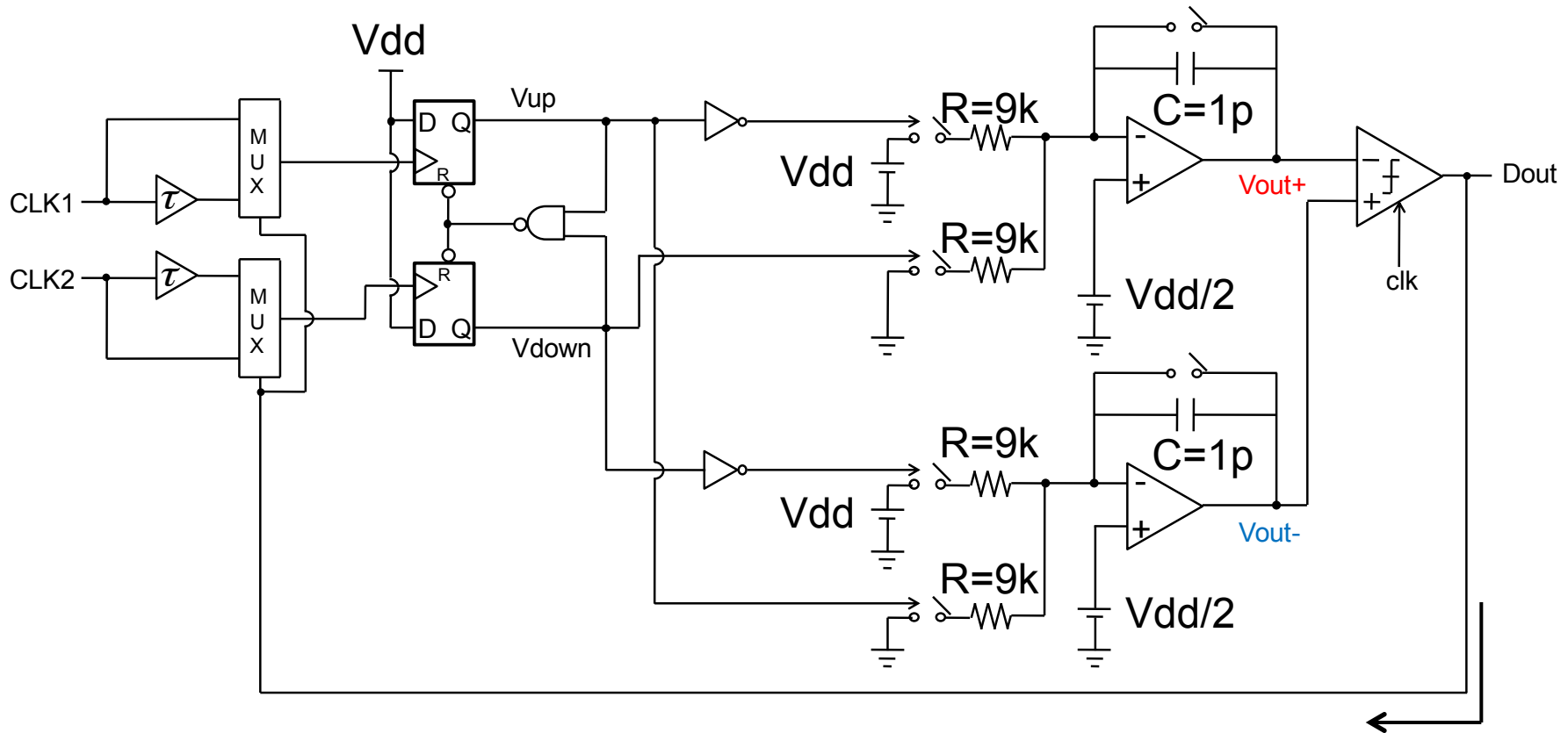


$V_{out-} > V_{out+} \rightarrow D_{out} = 1$   
 $V_{out-} < V_{out+} \rightarrow D_{out} = 0$



# 1ビット $\Delta\Sigma$ 型TDC

39



## シミュレーション条件

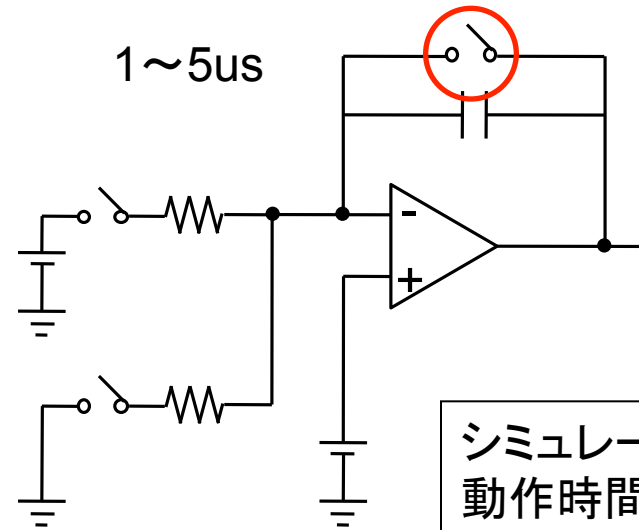
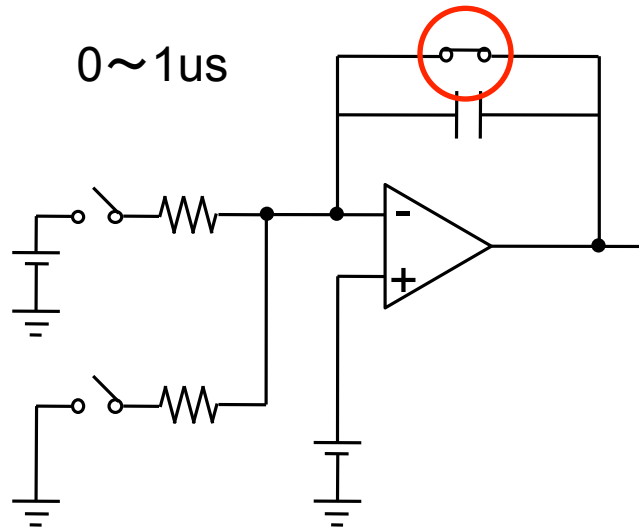
	High/Low	周波数	パルス幅
CLK1,CLK2	1.8V/0V	10MHz	50ns

電源電圧Vdd=1.8V  
シミュレーション時間5us

spectreで設計  
(TSMC0.18um CMOSプロセス)

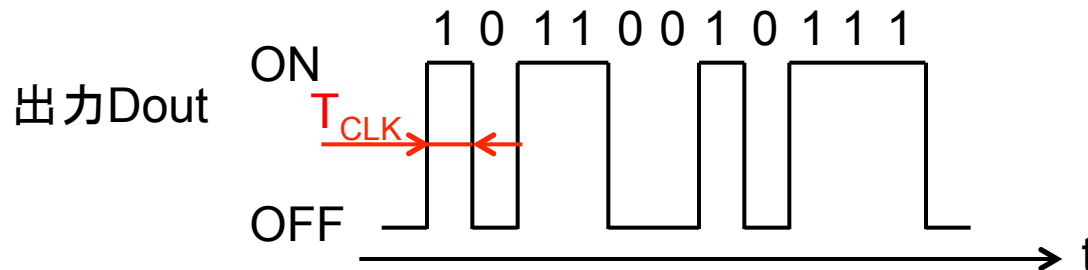
## 初期条件

- コンデンサの両端を1usまで短絡



シミュレーション時間: 5us  
動作時間: 4us

## パルスの数え方



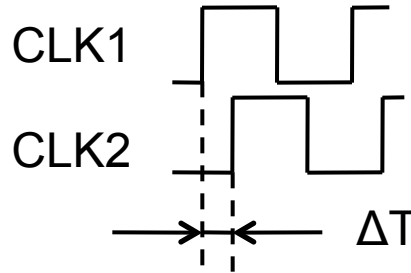
出力の総ON時間を  
入力クロック周期 $T_{CLK}$ で割る

パルス数合計: 7



# Doutの波形・CLK1先に立ち上がる場合

CLK1が先に立ち上がる場合



$\Delta T$

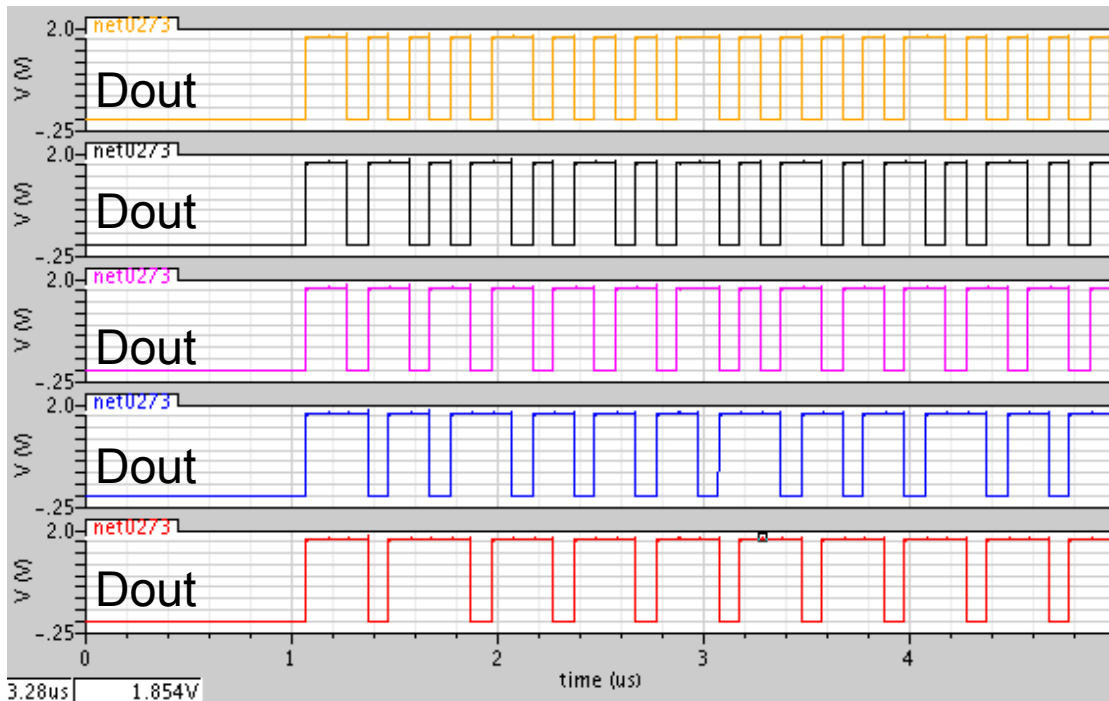
0.1ns

0.2ns

0.3ns

0.4ns

0.5ns



1のパルス数

22

24

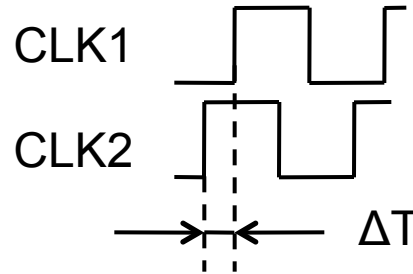
26

28

30

# Doutの波形・CLK2先に立ち上がる場合

CLK2が先に立ち上がる場合



$\Delta T$

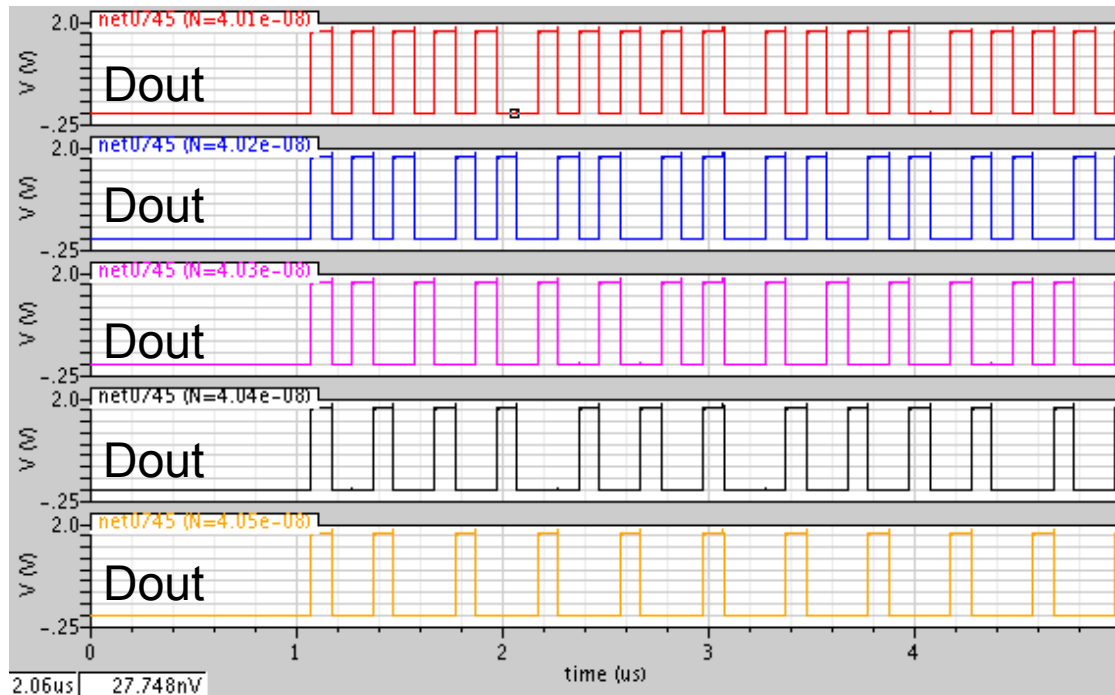
0.1ns

0.2ns

0.3ns

0.4ns

0.5ns



1のパルス数

18

16

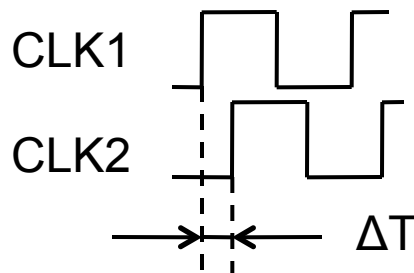
14

12

10

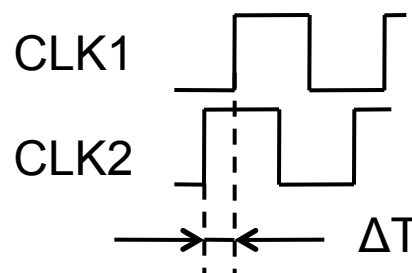
CLK1が先に  
立ち上がる

$\Delta T(\text{ns})$	1の数
0.95	39
0.9	38
0.8	36
0.7	34
0.6	32
0.5	30
0.4	28
0.3	26
0.2	24
0.1	22
0	20



CLK2が先に  
立ち上がる

$\Delta T(\text{ns})$	1の数
0.95	1
0.9	2
0.8	4
0.7	6
0.6	8
0.5	10
0.4	12
0.3	14
0.2	16
0.1	18
0	20



※動作時間4us

時間差0.1n毎  
にパルス数が  
2つつ変化

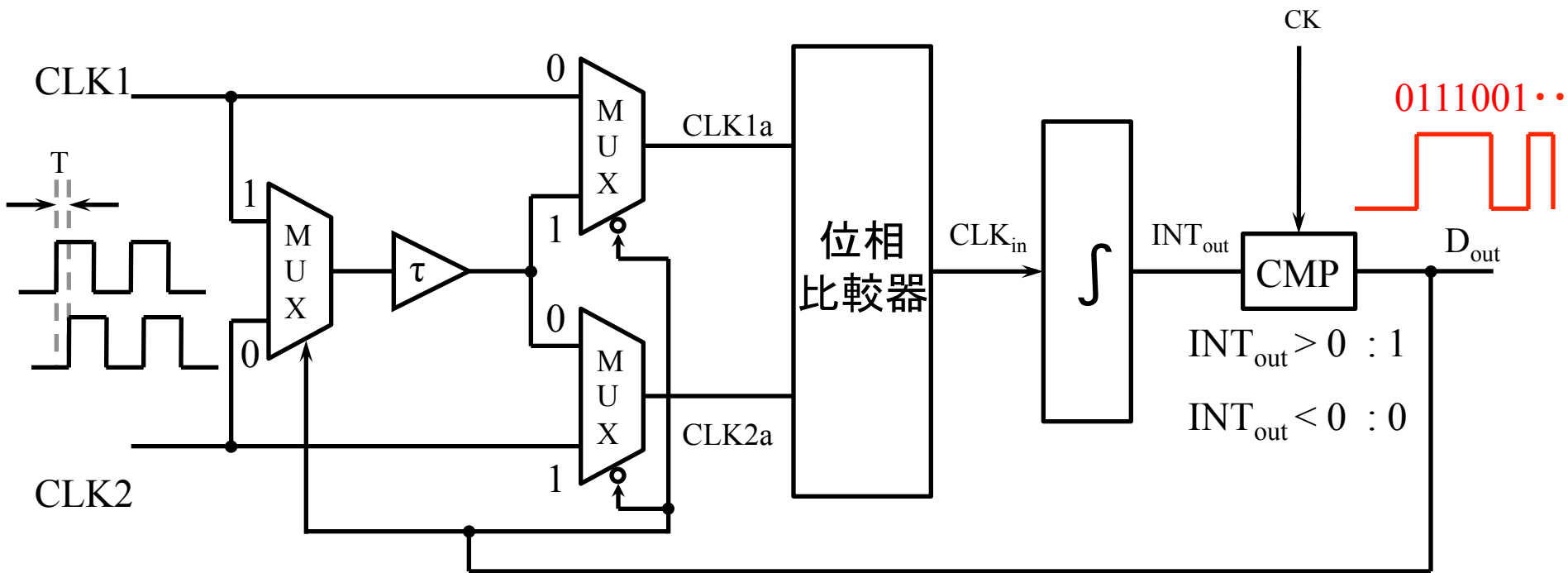


分解能50ps

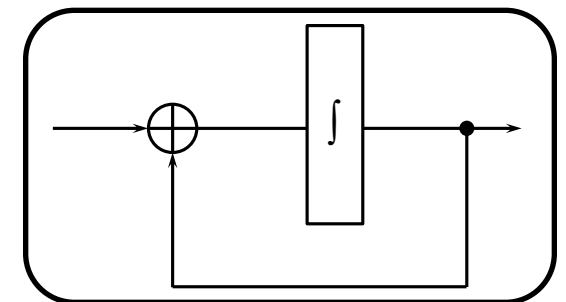
シミュレーションで確認

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - **マルチビット変調器の問題点**
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

# シングルビット $\Delta\Sigma$ TDC回路の構成

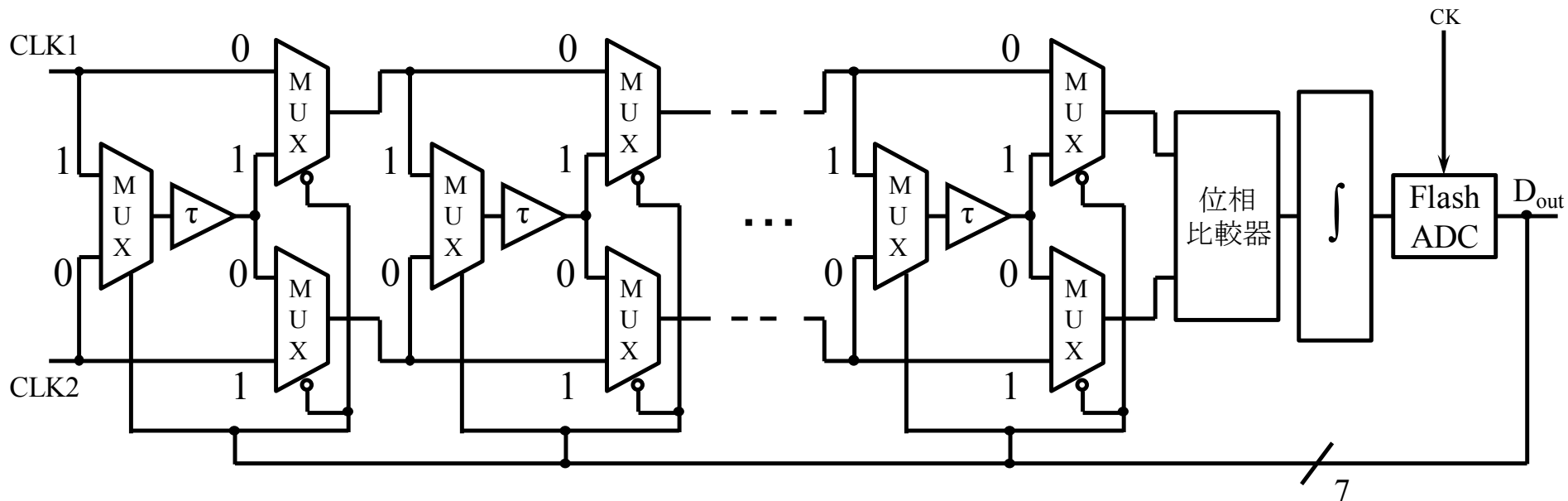


- CLK1とCLK2間の時間差を計測
- 出力は時間差Tに比例  $\Rightarrow$  1の個数でTを測定可
- $D_{out}$ で経路制御
- 測定可能範囲 :  $-\tau < T < \tau$



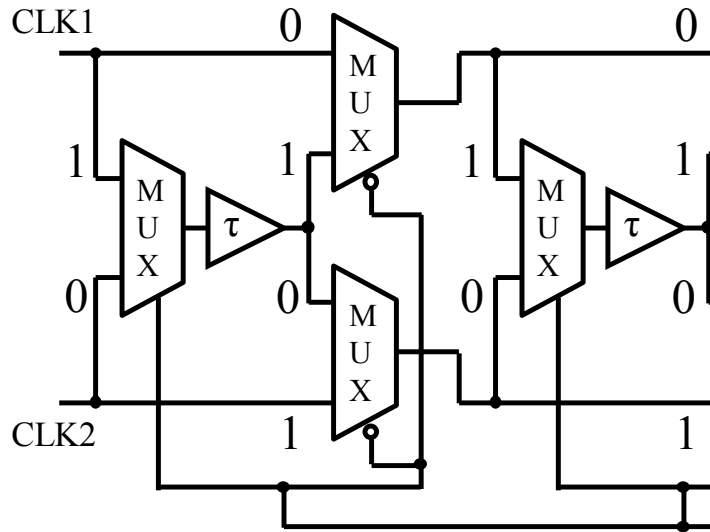
•積分制御のフィードバック構成

# マルチビット $\Delta\Sigma$ TDCの構成

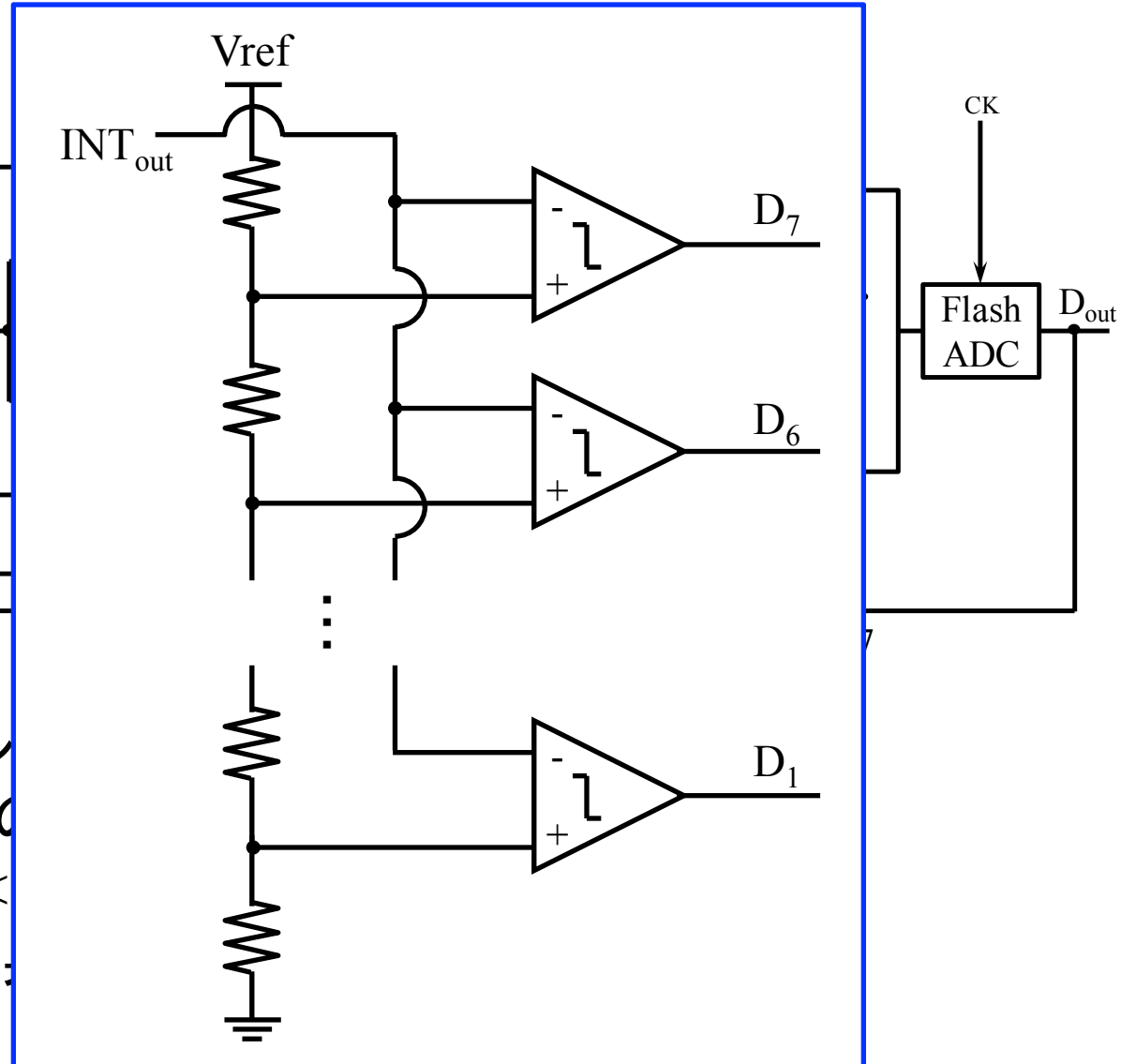


- 遅延セル, マルチプレクサを増やしマルチビット化
- $n$ -bitの場合:  $2^n - 1$ 本の出力
- 測定可能範囲:  $-7\tau < T < 7\tau$
- Flash ADCの出力結果で経路選択

# マルチビット $\Delta\Sigma$ TDCの構成



- 遅延セル, マルチプレ
- $n$ -bitの場合:  $2^n - 1$ 本の
- 測定可能範囲:  $-7\tau <$
- Flash ADCの出力結



- シングルビット $\Delta\Sigma$  TDC
  - 遅延ミスマッチが影響しない
  - 精度が出せる
  - 測定時間が長い
- マルチビット $\Delta\Sigma$  TDC
  - 測定時間を短縮可能
  - 補正技術を適用することで精度が保てる

テスト：短時間, テスト精度の向上が重要

マルチビット化によりテスト時間が短縮



テストコストを削減可能

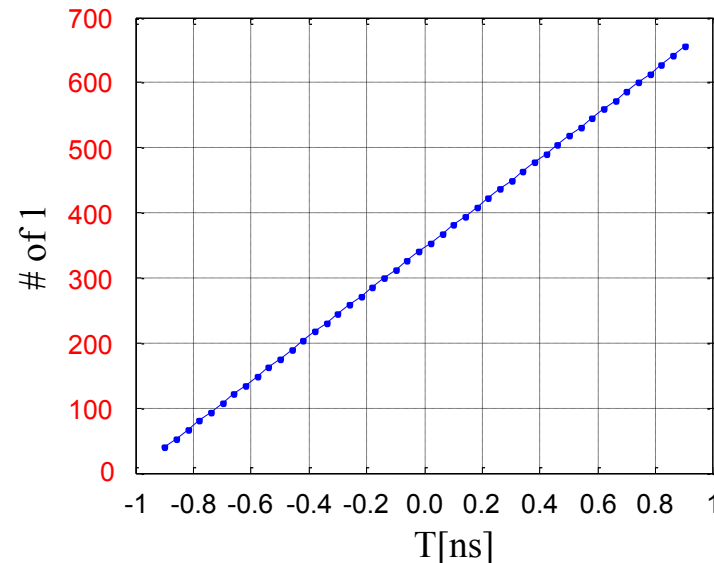
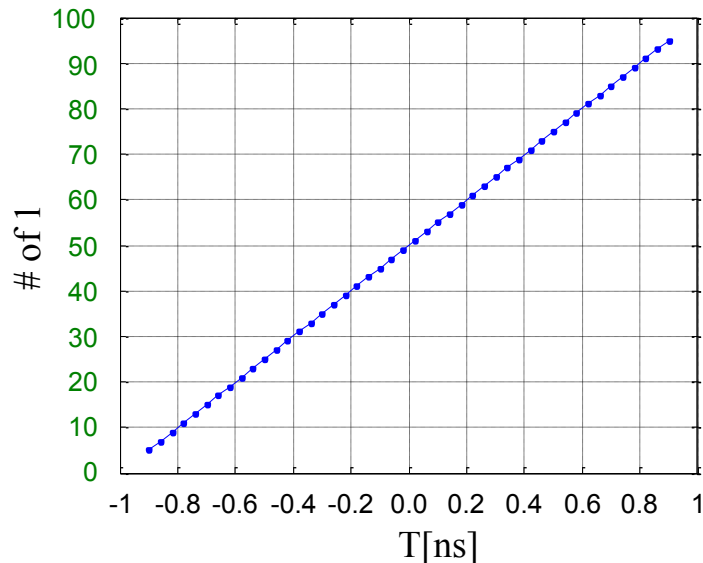


# $\Delta\Sigma$ TDCのMATLABシミュレーション結果 49

## ● シミュレーション条件

	1-bit $\Delta\Sigma$ TDC	3-bit $\Delta\Sigma$ TDC
立ち上がり時間差 T	-0.9 ~ 0.9[ns] (刻み : 0.04[ns])	-0.9 ~ 0.9[ns] (刻み : 0.04[ns])
遅延時間 $\tau$	1[ns]	0.145[ns]
出力数(比較回数)	99点	99点

## ■ 立ち上がり間隔Tに対する1の出力数



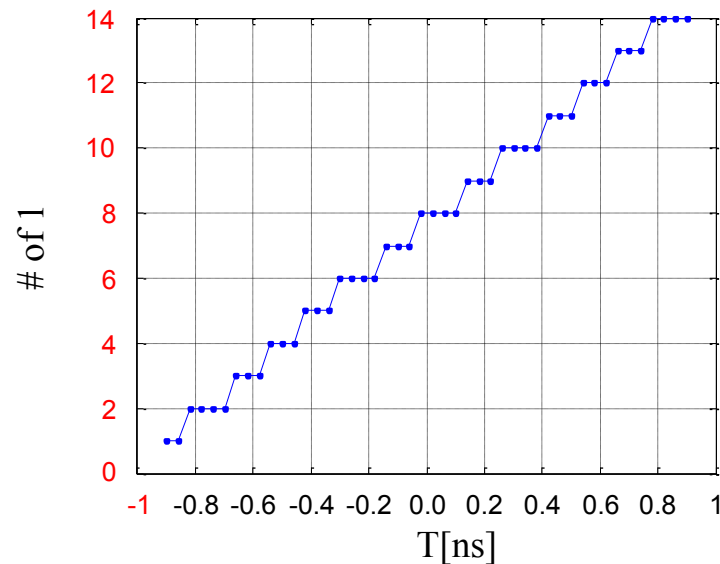
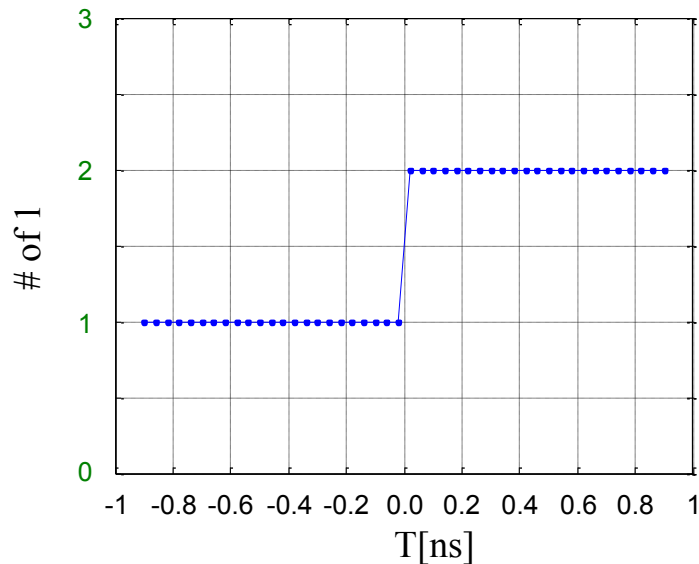
- 1の出力数は入力時間差に比例
  - 時間差測定が可能

# 測定時間を短縮した場合の検討

## ● シミュレーション条件

	1-bit $\Delta\Sigma$ TDC	3-bit $\Delta\Sigma$ TDC
立ち上がり時間差 $T$	-0.9 ~ 0.9[ns] (刻み : 0.04[ns])	-0.9 ~ 0.9[ns] (刻み : 0.04[ns])
遅延時間 $\tau$	1[ns]	0.145[ns]
出力数(比較回数)	2点	2点

## ■ 立ち上がり間隔 $T$ に対する1の出力数



# マルチビット変調器の利点

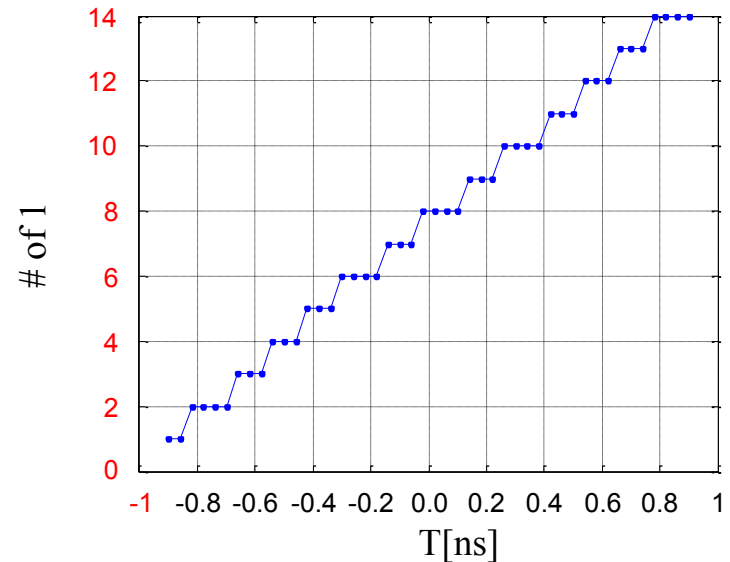
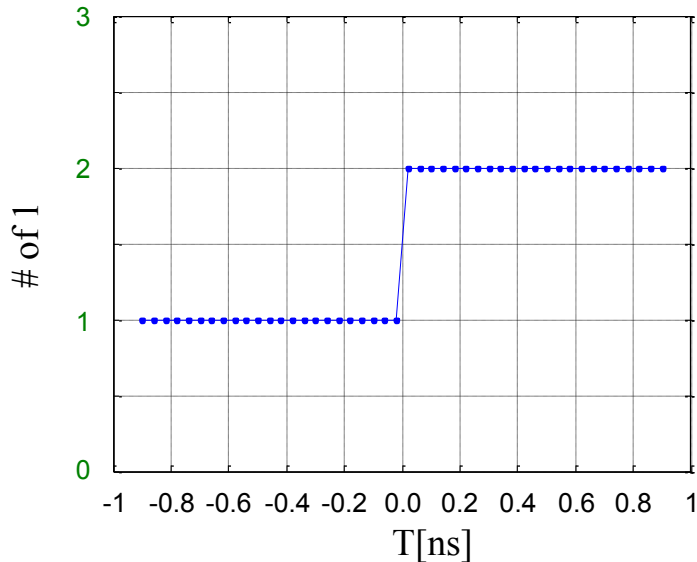
✓マルチビット化することで短時間で細かく測定可能



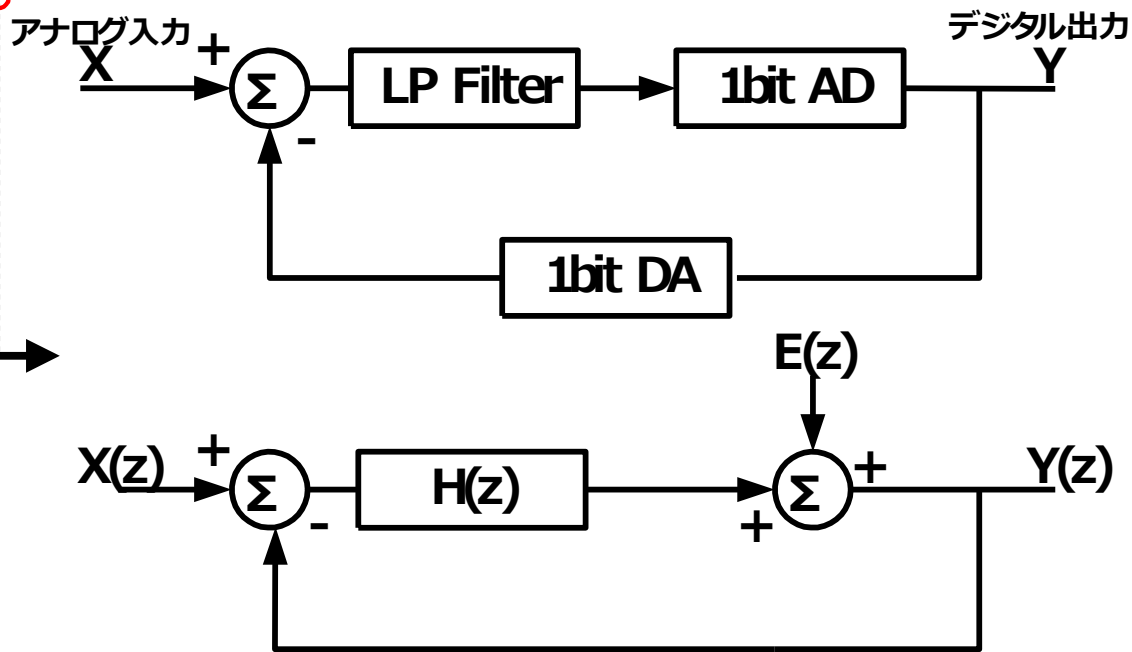
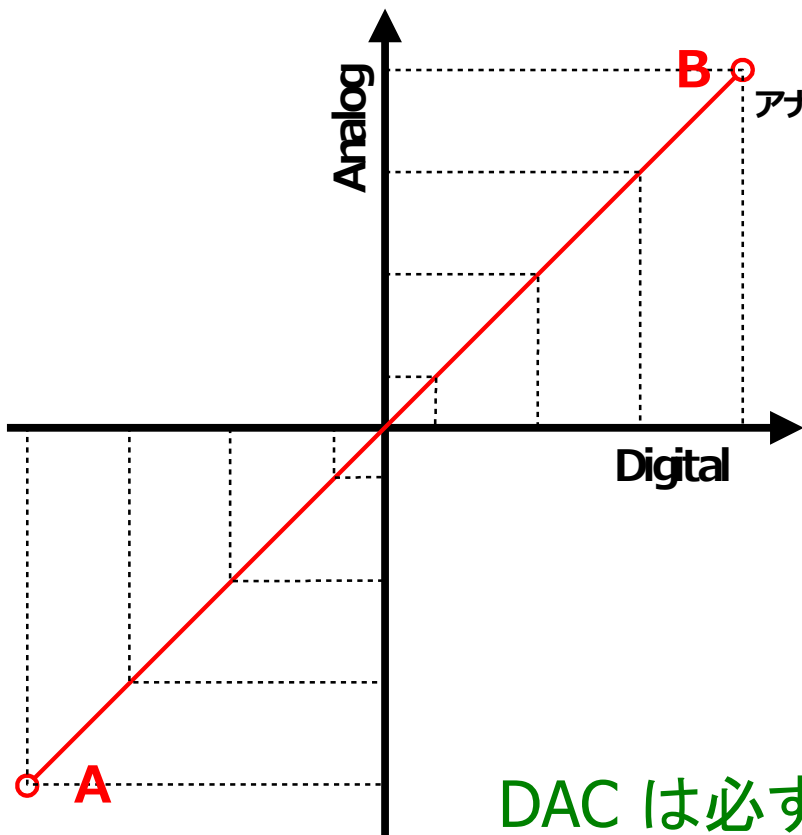
**低コスト・テスト**



■ 立ち上がり間隔 $T$ に対する1の出力数

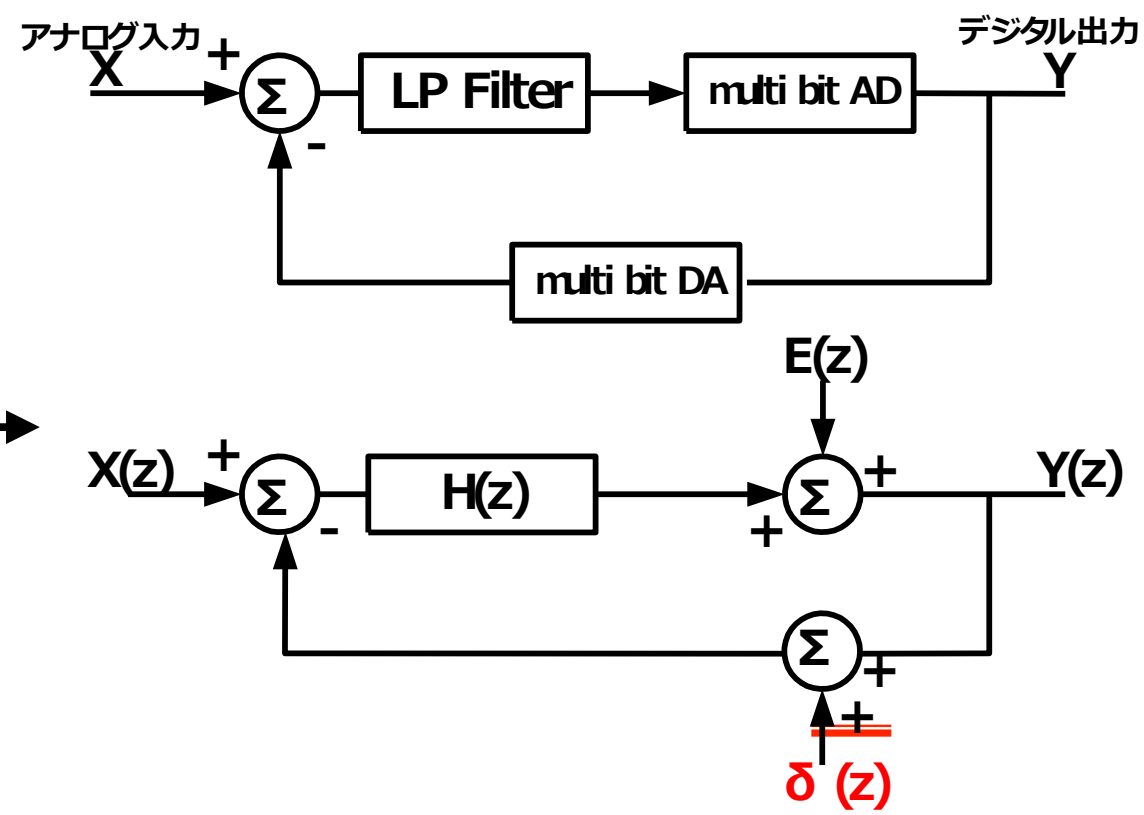
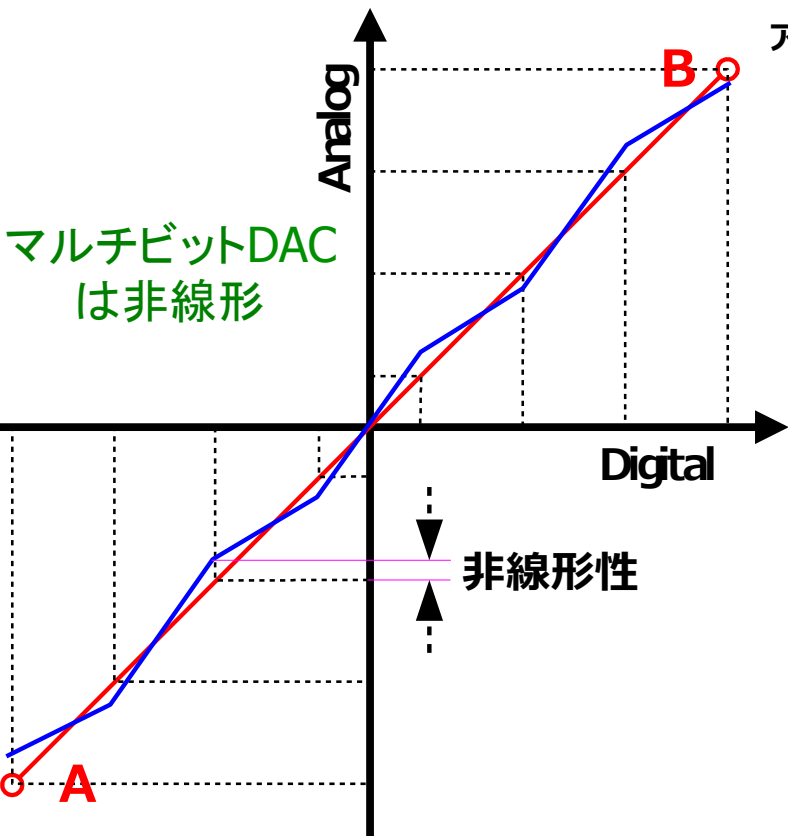


# 内部ADC/DACが1ビット



DAC は必ず線形

# 内部ADC/DACが多ビット



$$Y(z) = \frac{H(z)}{1+H(z)} (X(z) - \delta(z)) + \frac{1}{1+H(z)} \cdot E(z)$$

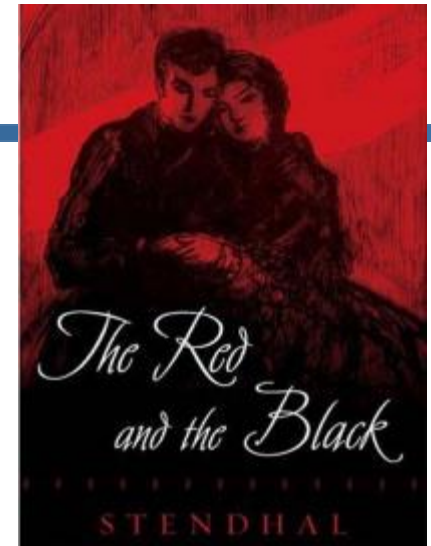
# 2値と多値

2値: 論理

Yes かNoか。

白か黒か。

誤差なし

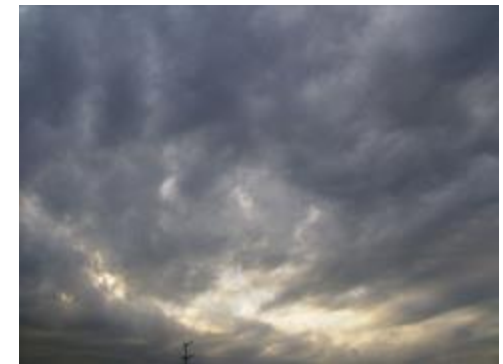


赤と黒

多値: 数値

灰色

誤差を含む



灰色の空

多少行き過ぎた行動をしても

(ADCに誤差があっても)

その結果を正しく戻せば対応できる。

(DACが正確ならば)

結果を正しく報告できなければ

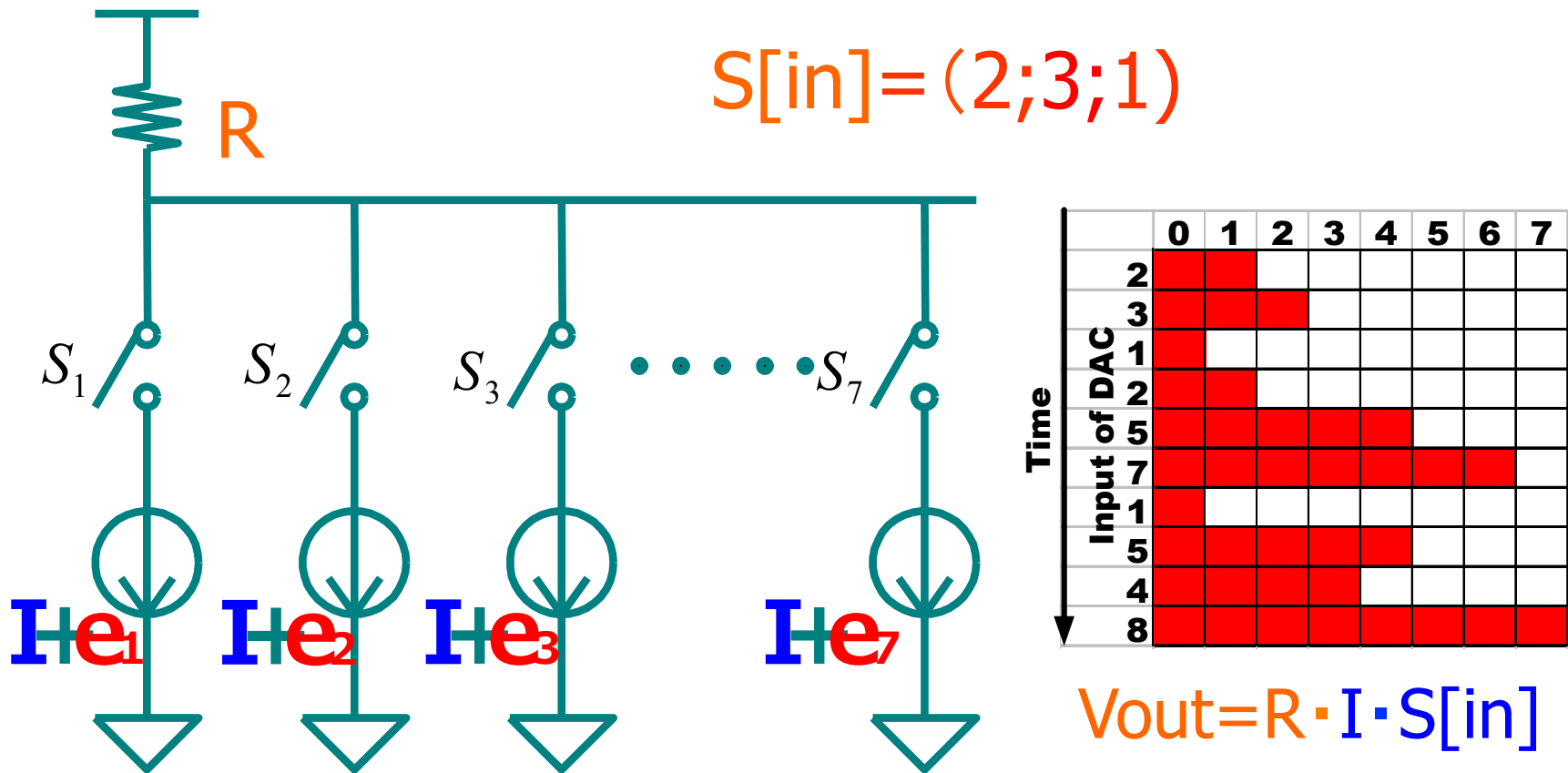
(DACが不正確なら)

システム全体の性能劣化

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - **DWAアルゴリズム**
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ



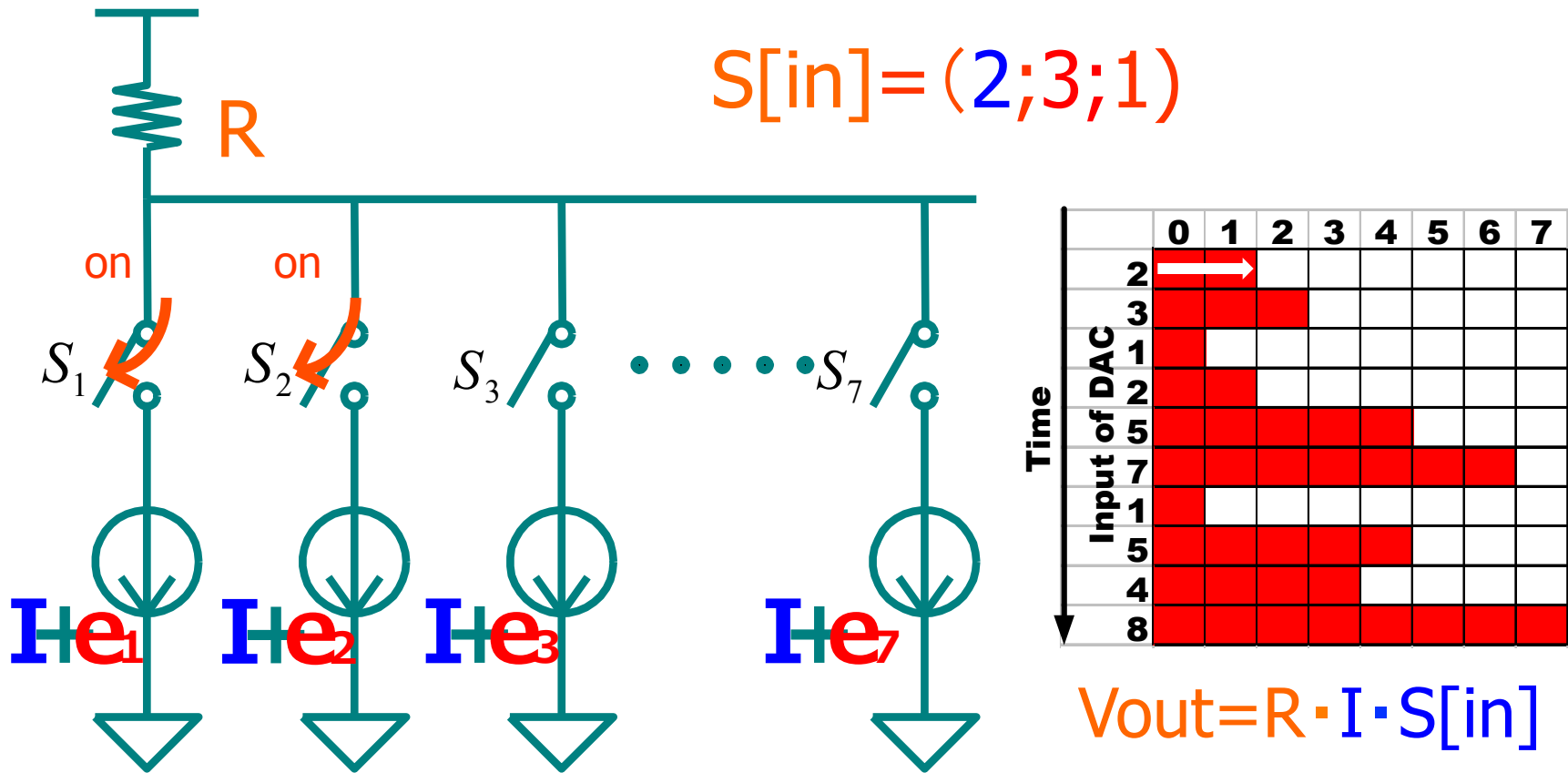
# セグメント電流セル型DACの構成



電流セルのミスマッチ ( $e_1, e_2, e_3, \dots, e_7$ ) がDACの非線形性

# セグメント電流セル型DAC 時刻1

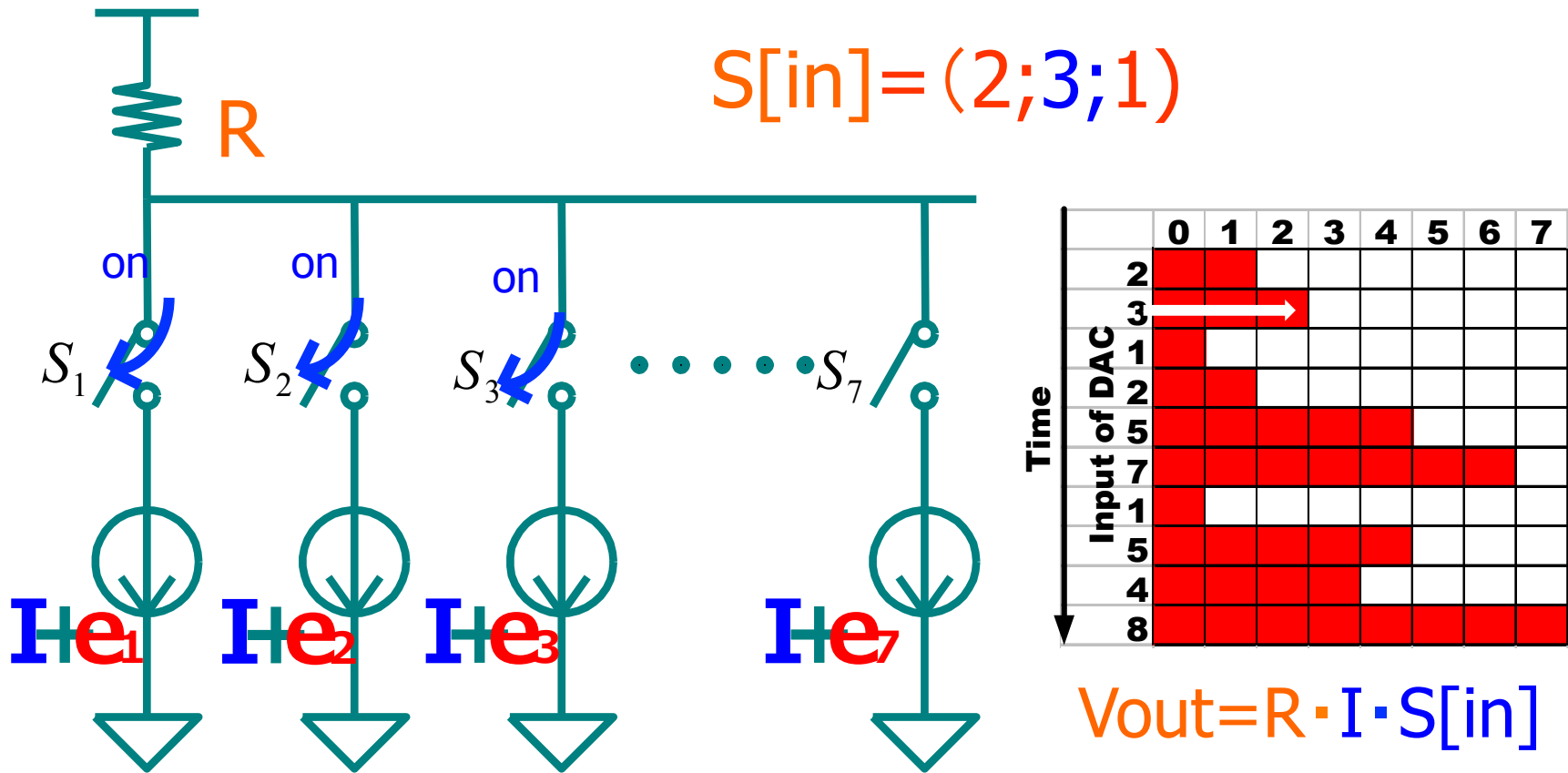
58



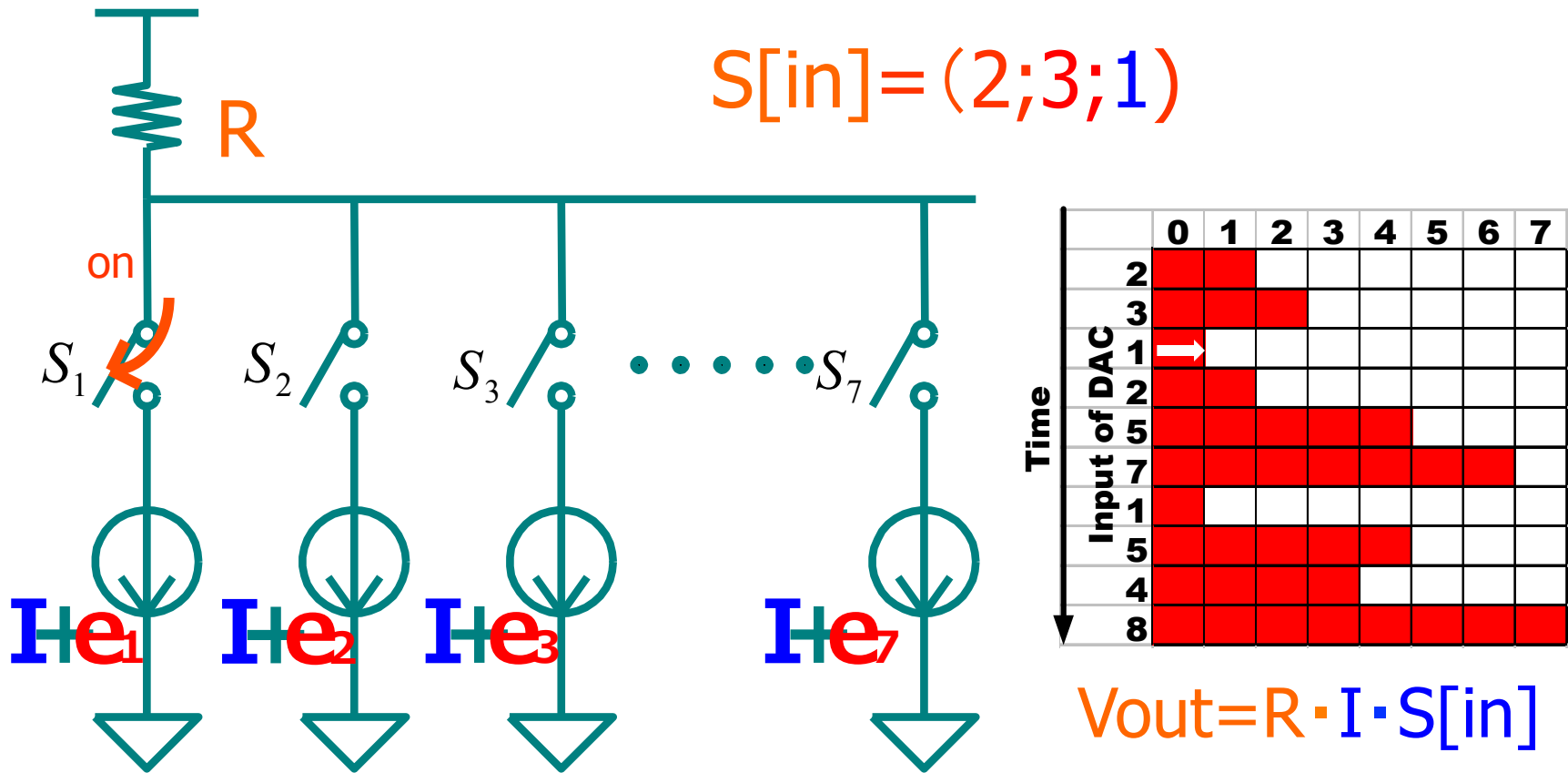
電流セルのミスマッチ ( $e_1, e_2, e_3, \dots, e_7$ ) がDACの非線形性

# セグメント電流セル型DAC 時刻2

59



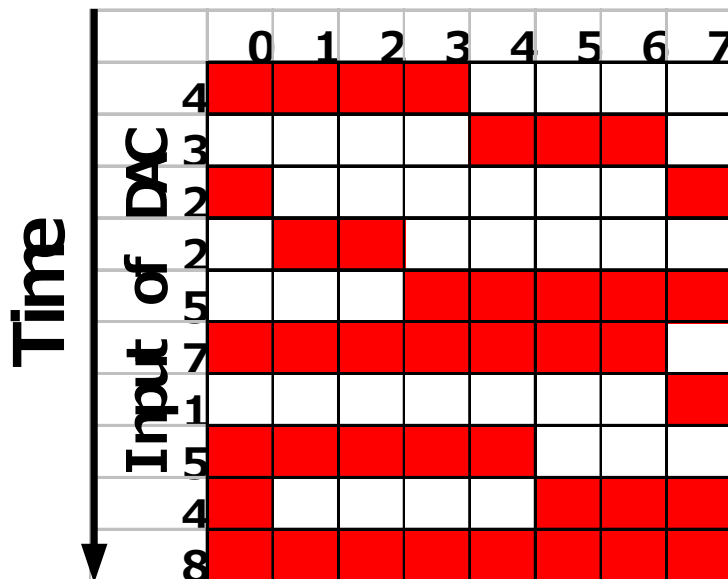
電流セルのミスマッチ ( $e_1, e_2, e_3, \dots, e_7$ ) がDACの非線形性



電流セルのミスマッチ ( $e_1, e_2, e_3, \dots, e_7$ ) がDACの非線形性

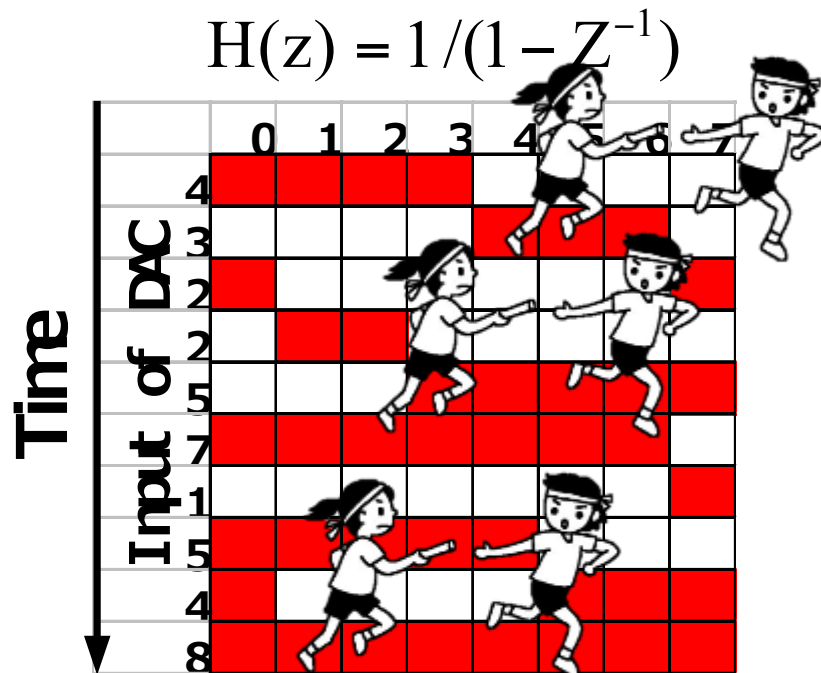
## Data Weighted Averaging (DWA)アルゴリズム

$$H(z) = 1 / (1 - Z^{-1})$$



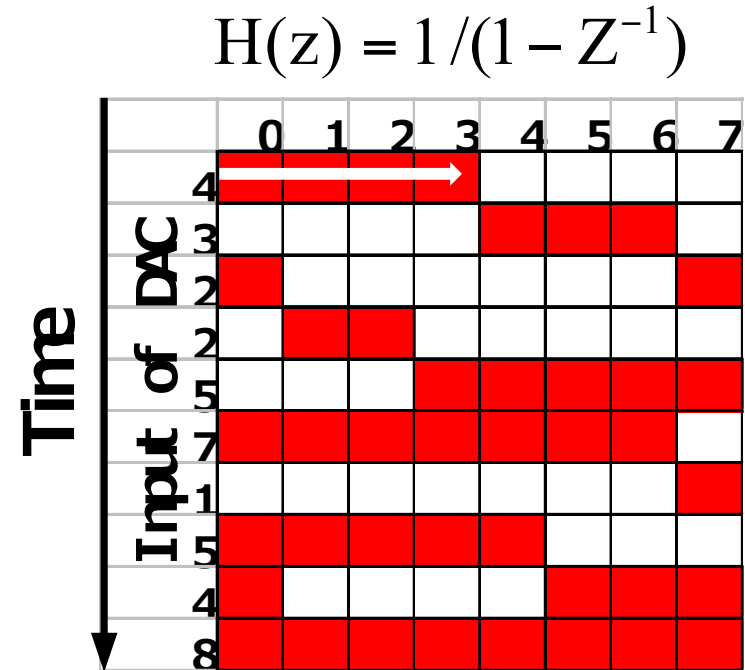
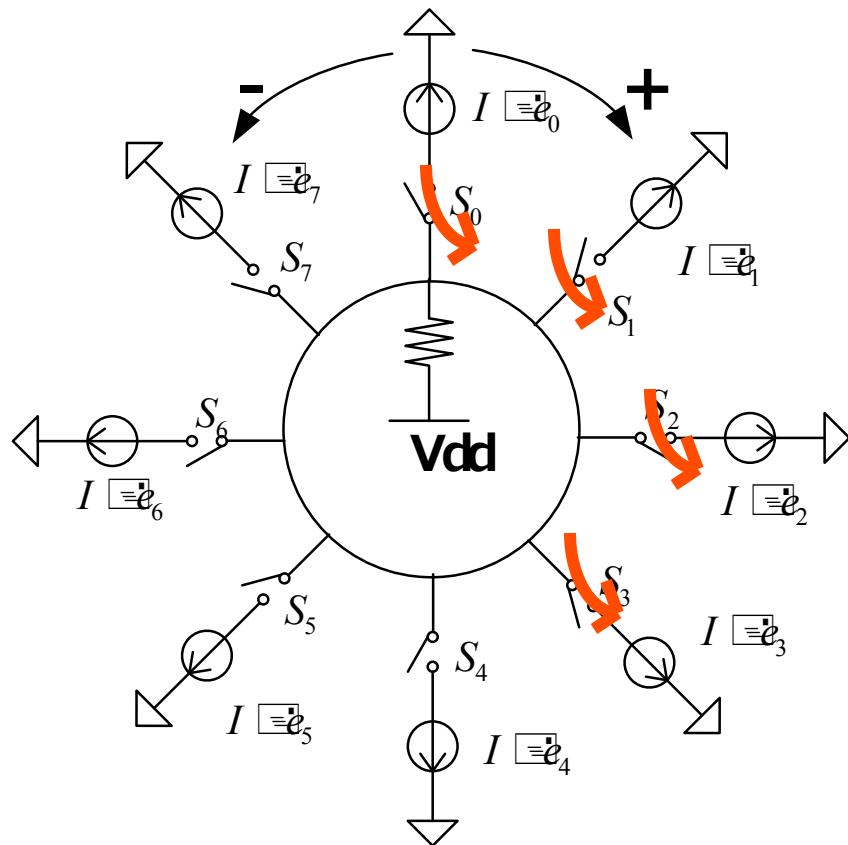
セグメント型の  
冗長性を利用

## Data Weighted Averaging (DWA)アルゴリズム セグメント型の冗長性を利用



バトンレースの動作

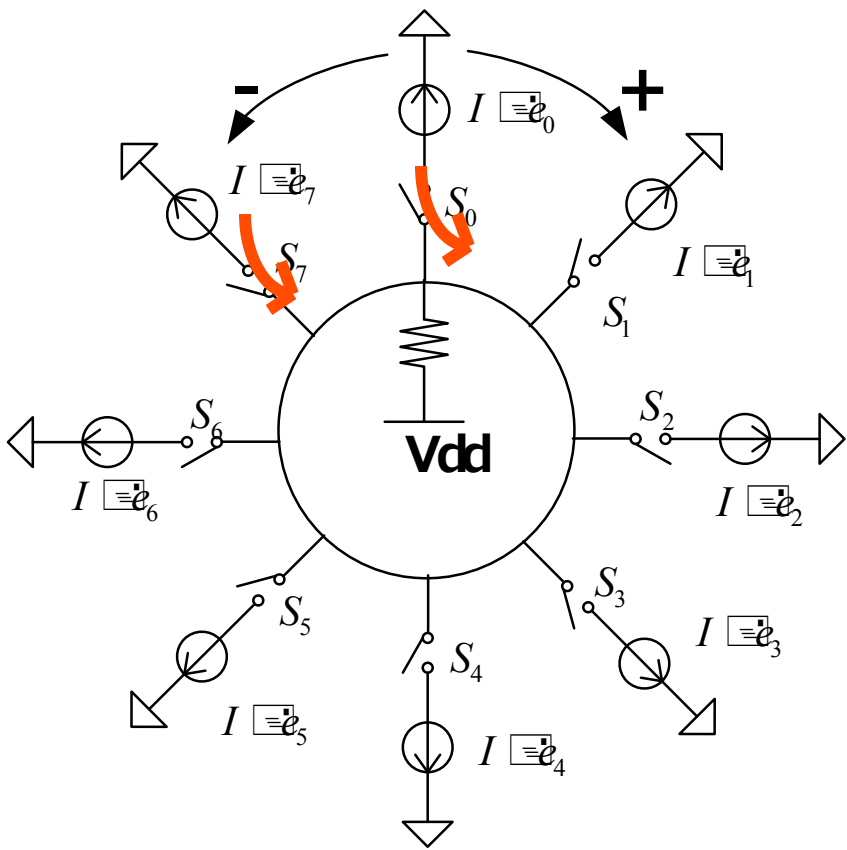
# DWAアルゴリズム使用 時刻1



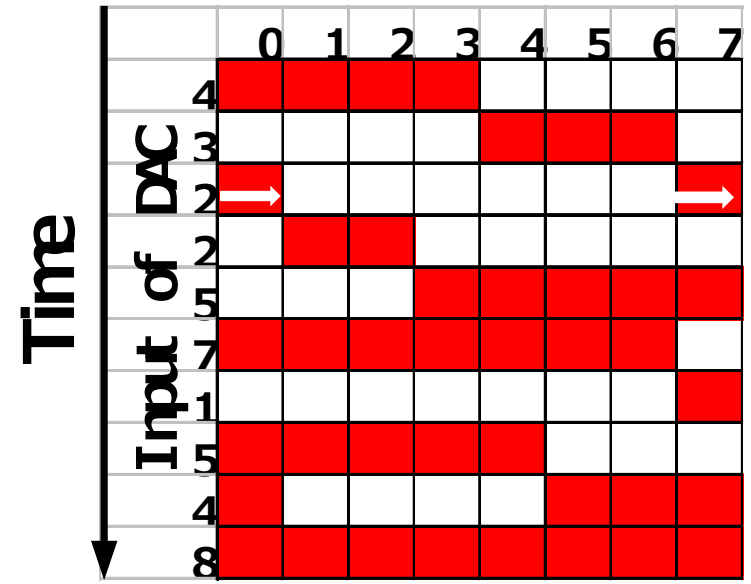




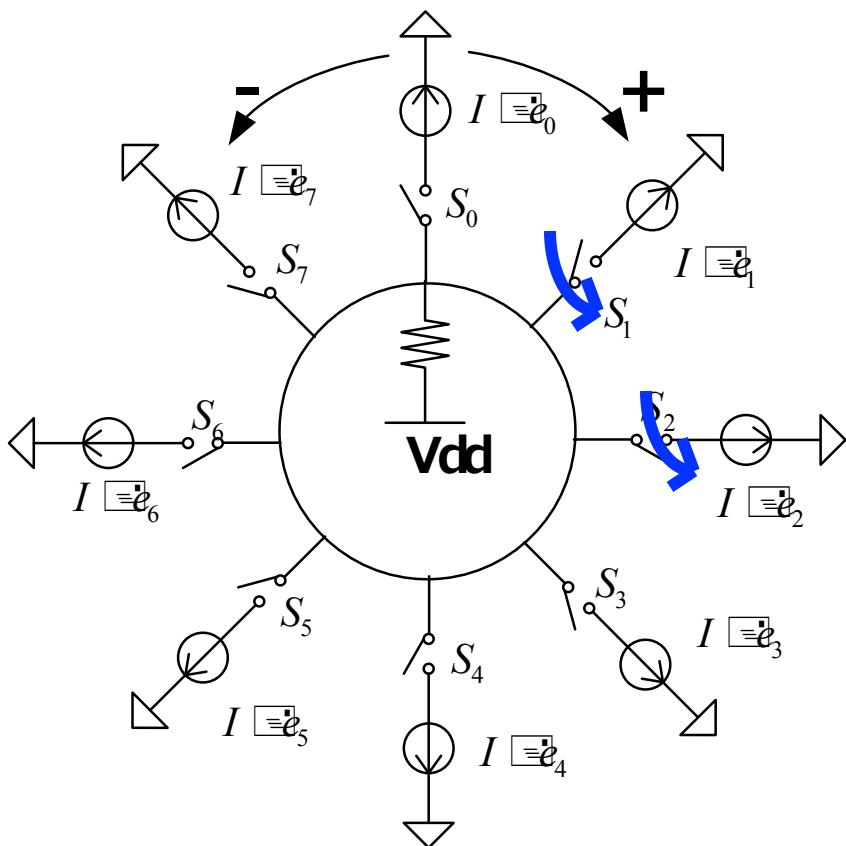
# DWAアルゴリズム使用 時刻3



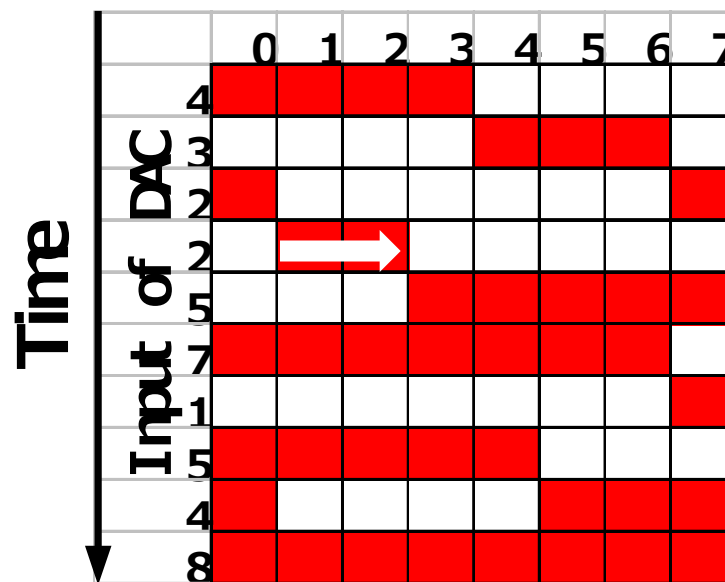
$$H(z) = 1 / (1 - Z^{-1})$$



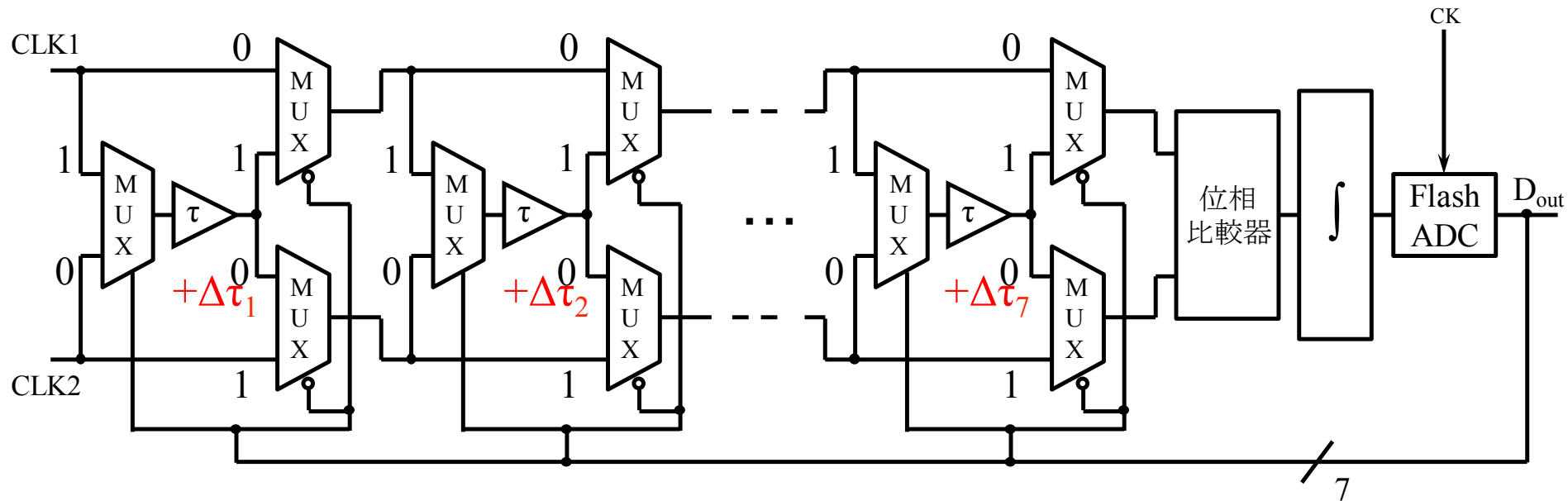
# DWAアルゴリズム使用 時刻4



$$H(z) = 1 / (1 - Z^{-1})$$

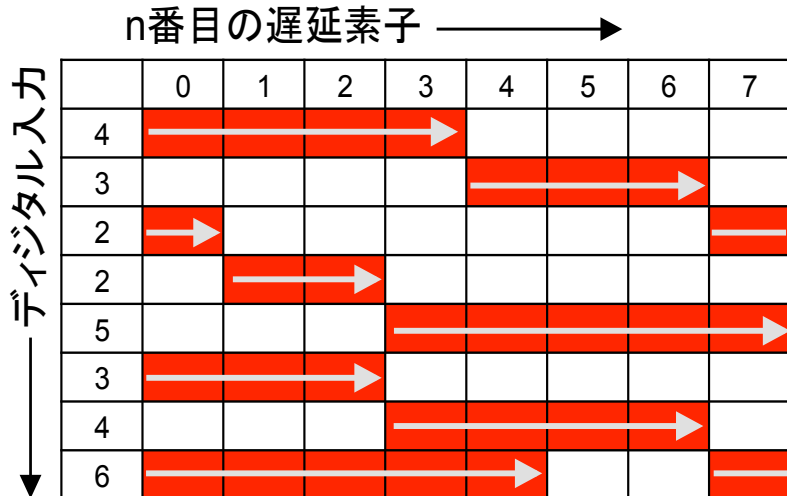
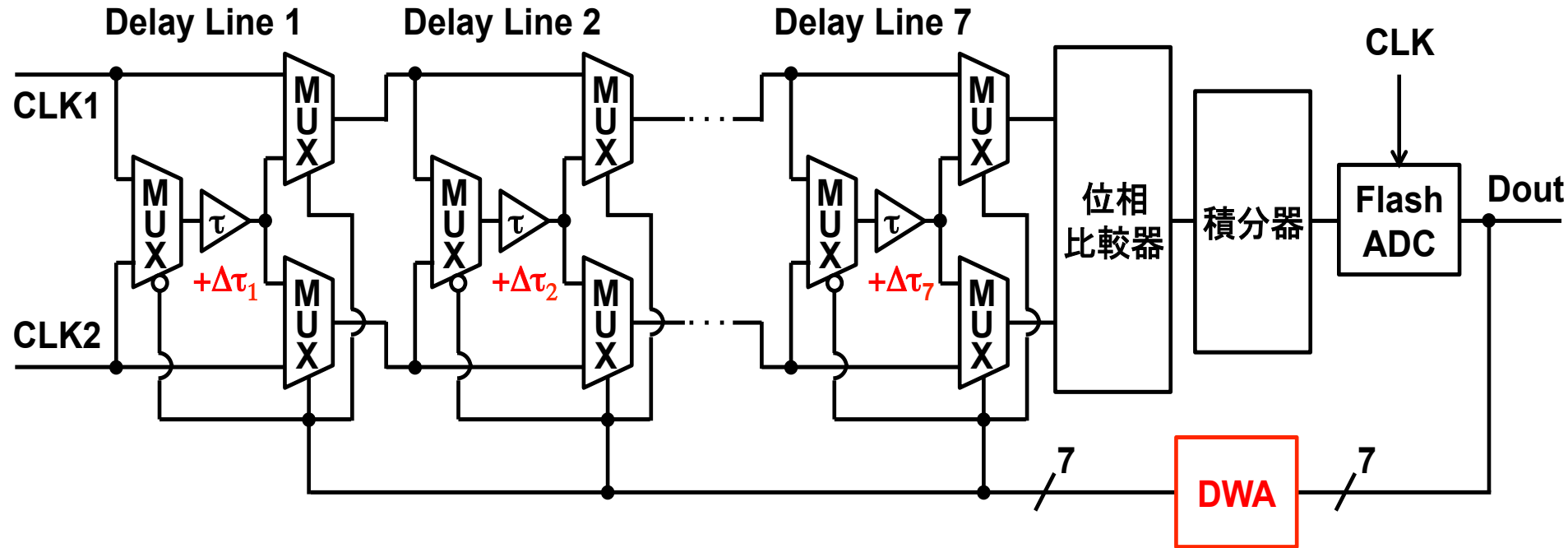


# マルチビット $\Delta\Sigma$ TDCの問題点



- 遅延セルのミスマッチにより非線形性が発生

# $\Delta\Sigma$ TDCでのDWAアルゴリズム

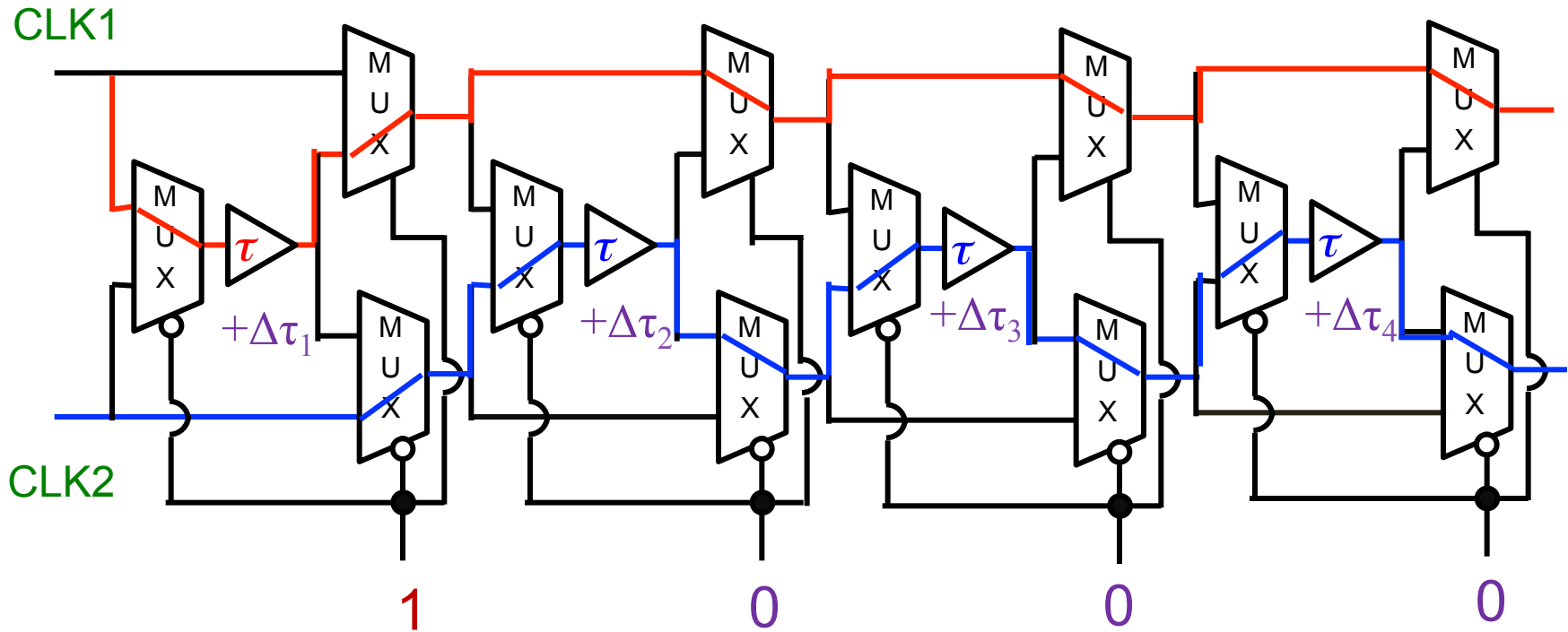


- 遅延素子のばらつきによる非線形性  
使用する遅延素子をシャッフル



非直線性誤差の低減

# DWAなし デジタル入力1 時刻1

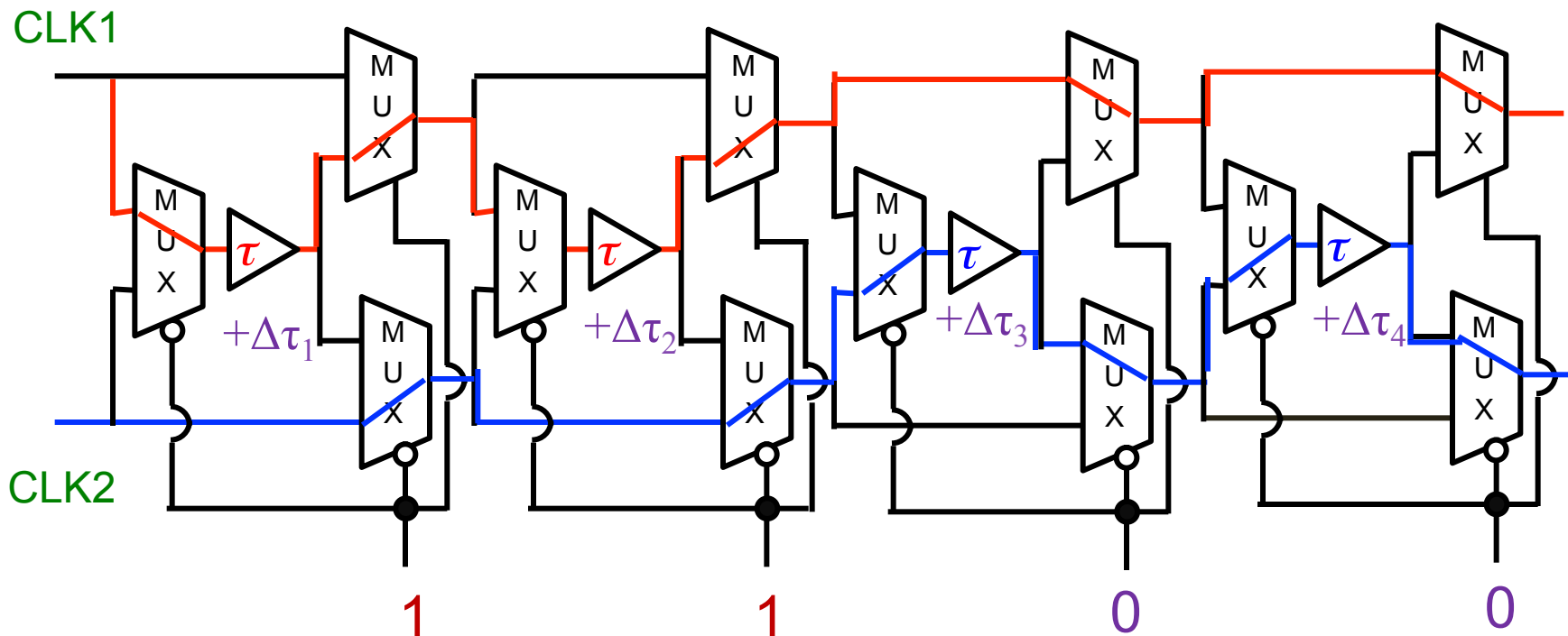


遅延セルの選択状況

CLK1  $\tau + \Delta\tau_1$

比較器配列  
出力

# DWAなし デジタル入力2 時刻2



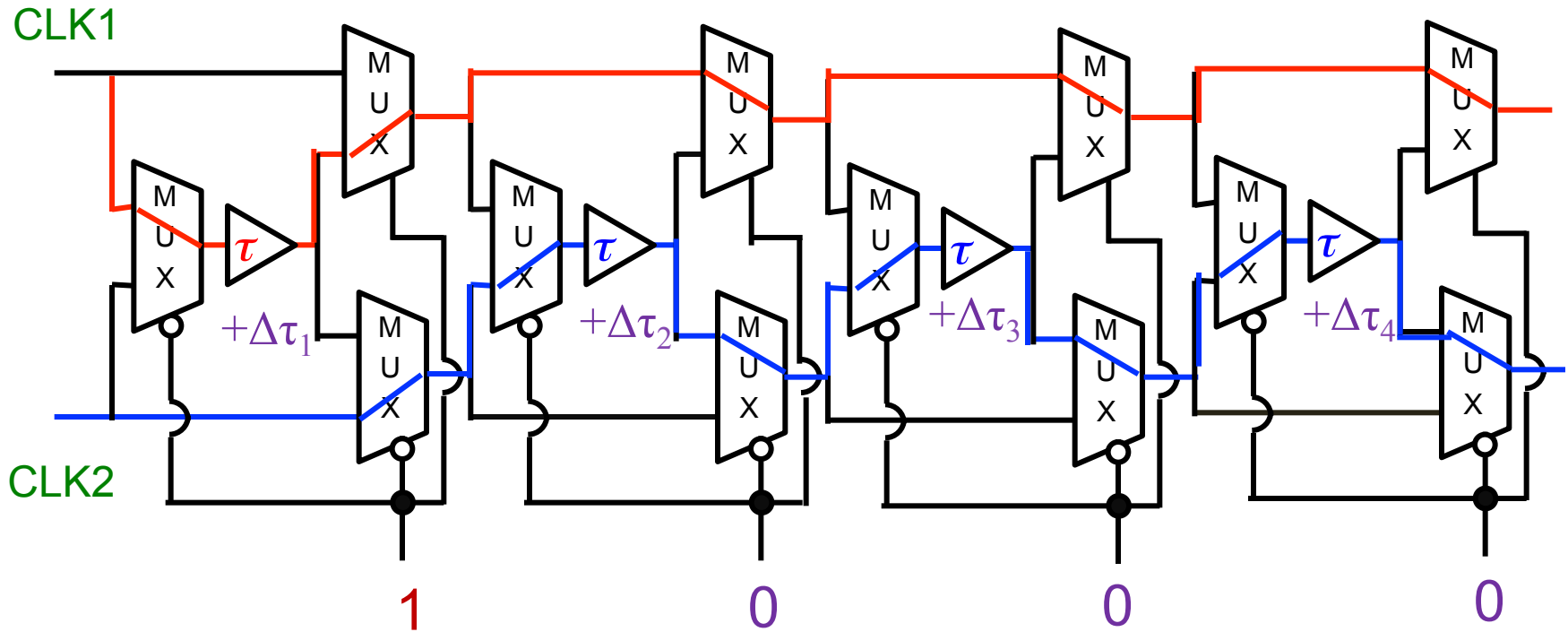
遅延セルの選択状況

CLK1

$\tau + \Delta\tau_1$

$\tau + \Delta\tau_2$

# DWAなし デジタル入力1 時刻3

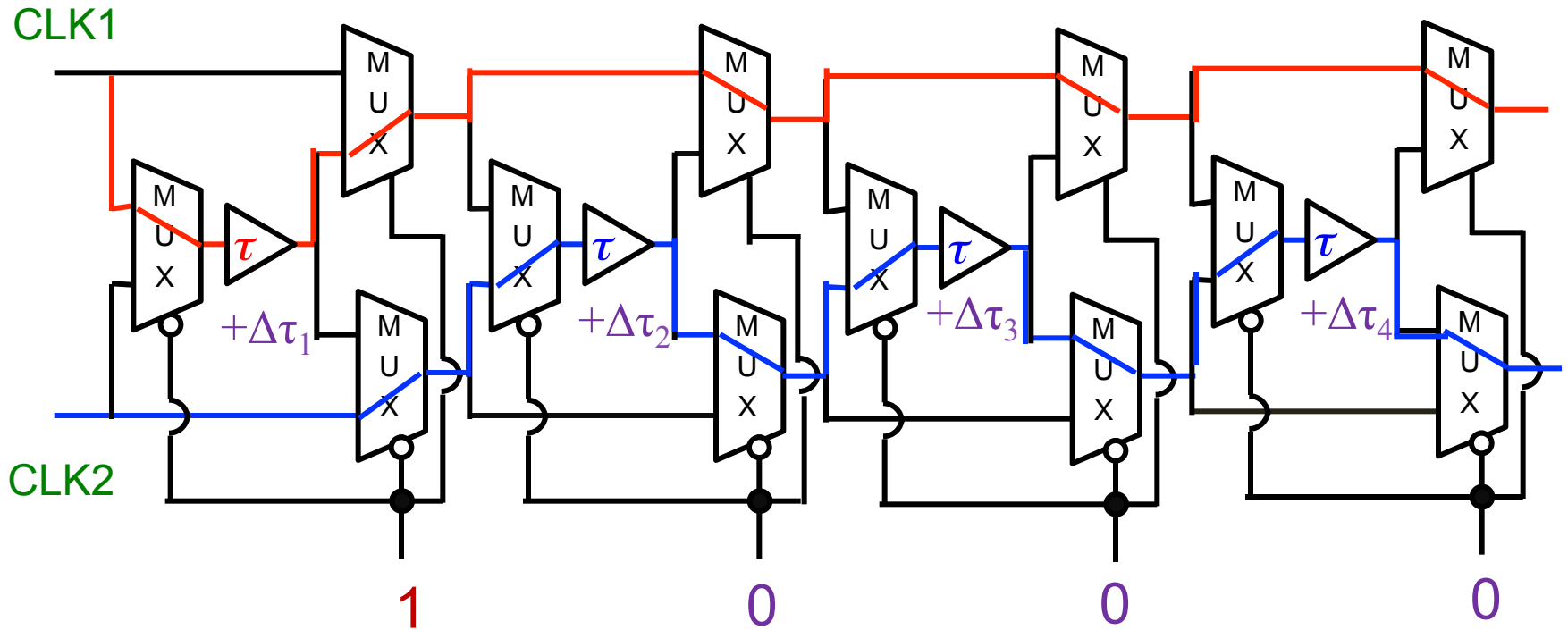


遅延セルの選択状況

CLK1  $\tau+\Delta\tau_1$

比較器配列  
出力

# DWAあり デジタル入力1 時刻1



遅延セルの選択状況

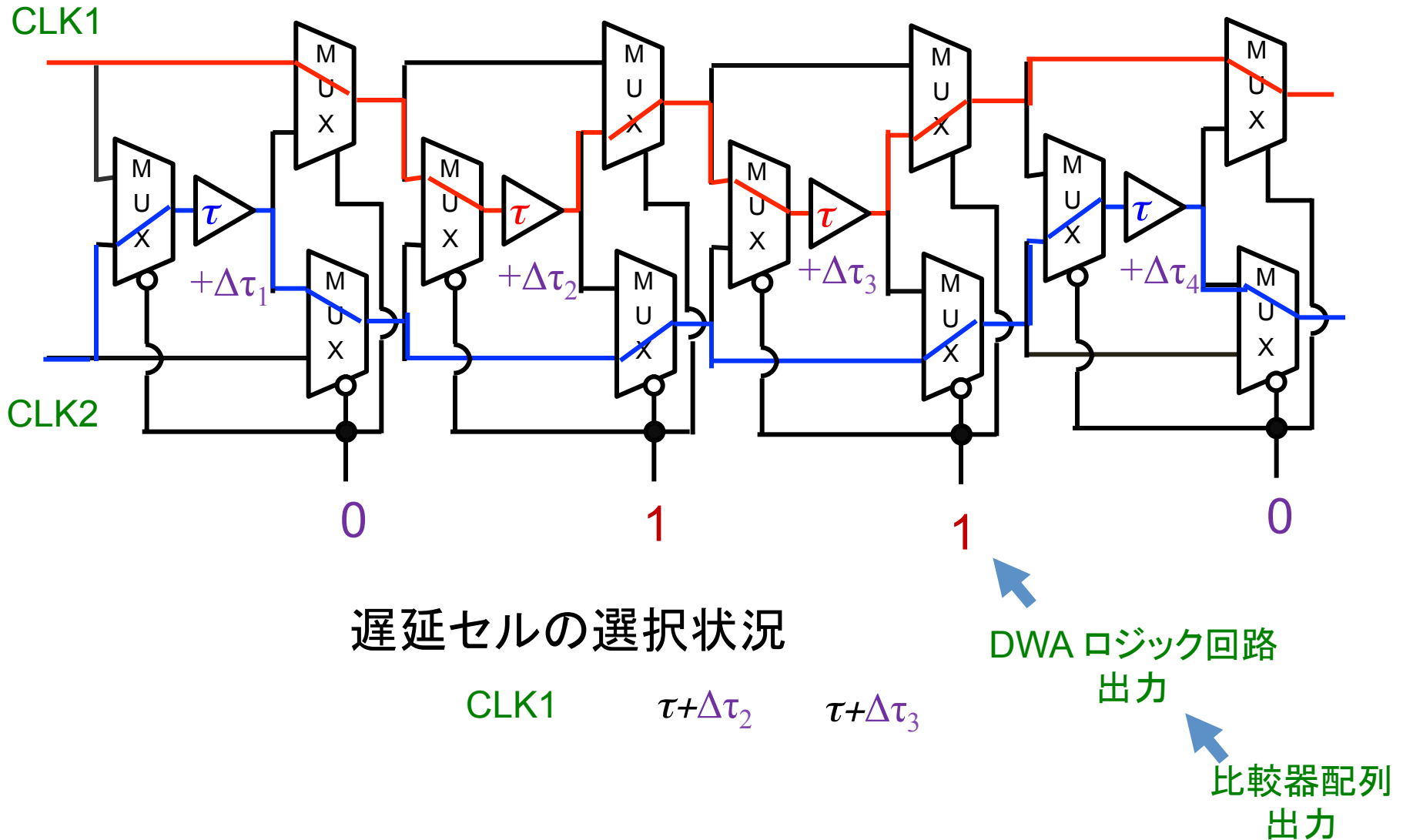
CLK1  $\tau + \Delta\tau_1$

DWA ロジック回路  
出力

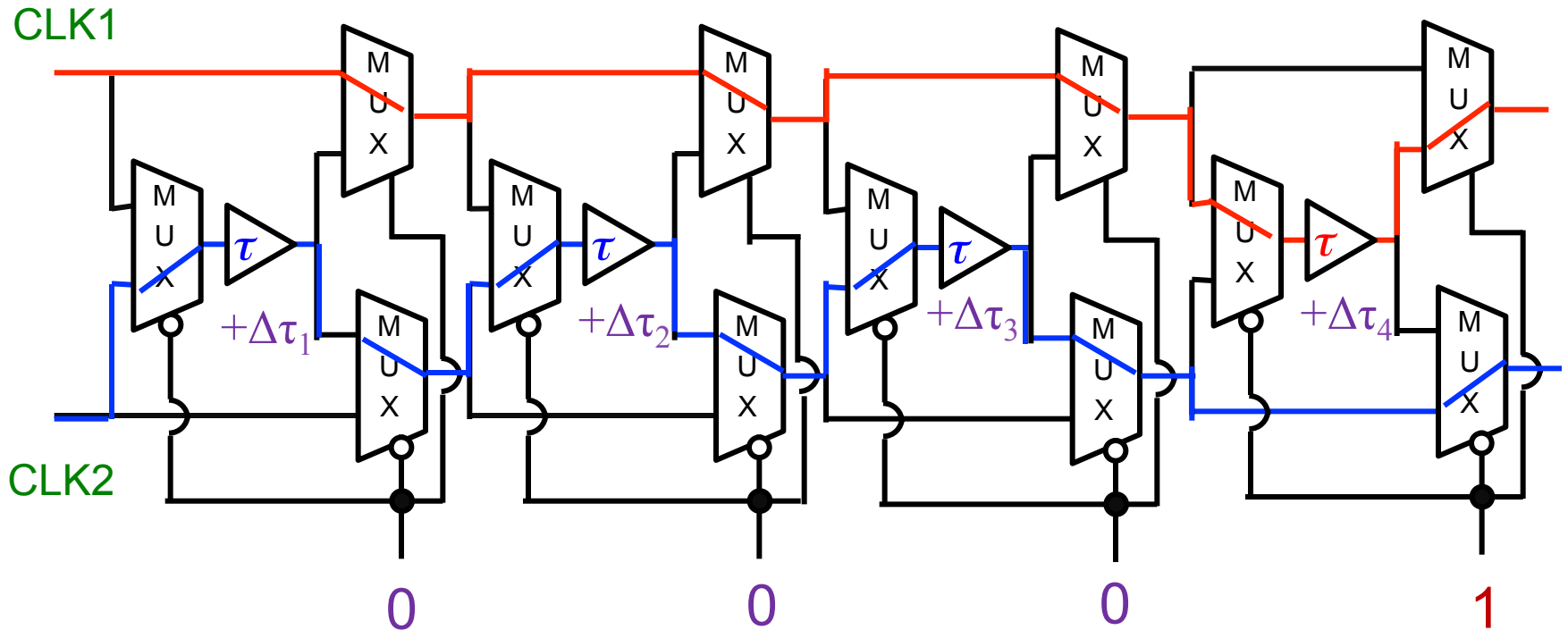
比較器配列  
出力



# DWAあり デジタル入力2 時刻2



# DWAあり デジタル入力1 時刻3



遅延セルの選択状況

CLK1  $\tau + \Delta\tau_4$

DWA ロジック回路  
出力

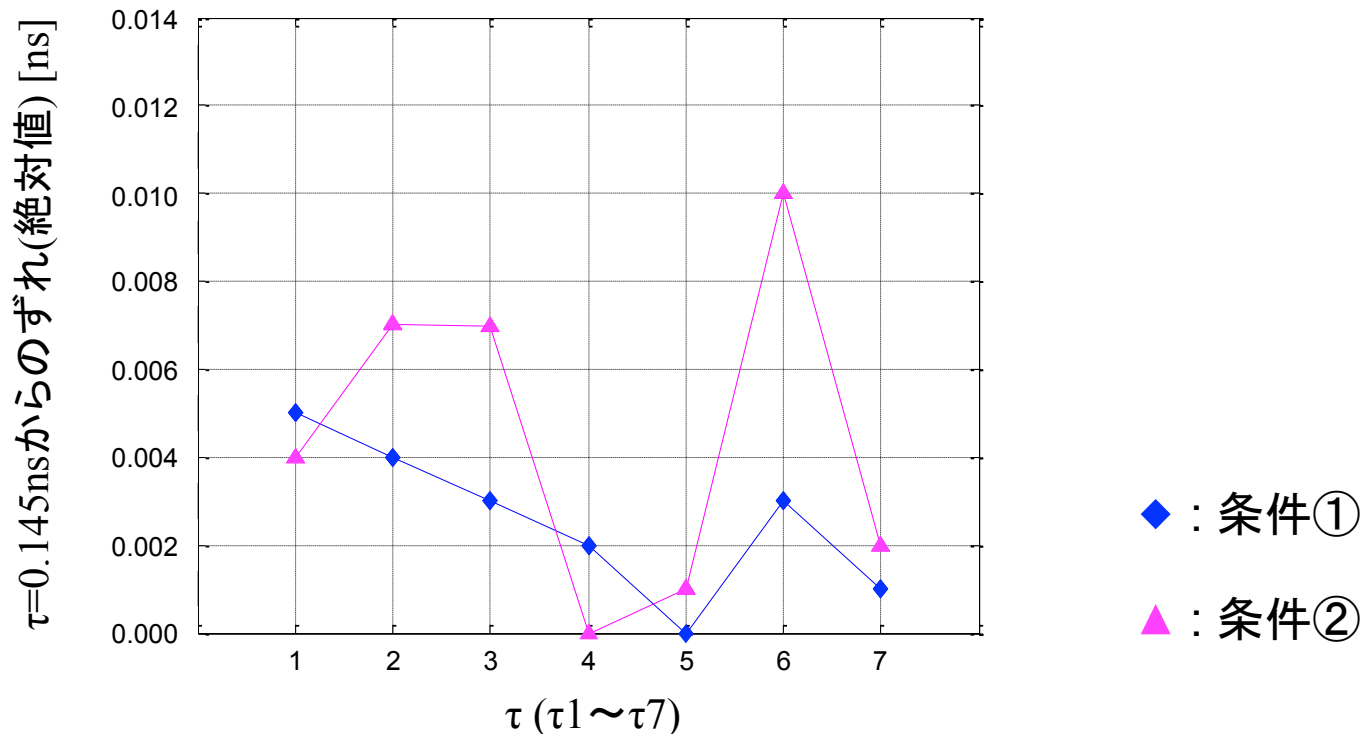
比較器配列  
出力

# 遅延ばらつきの影響の検証

- 遅延ばらつき：ガウス分布でランダムに生成  
最大で $\tau=0.145\text{ns}$  の $\pm 10\%$ 程度の誤差とした

MATLABシミュレーション

- シミュレーション時に生成した遅延パラメータ

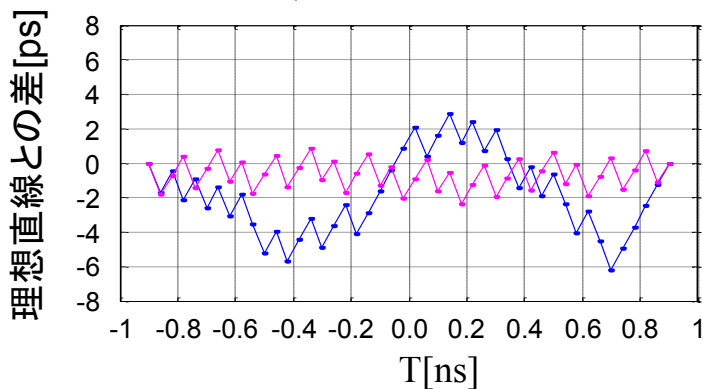


# DWAの効果検証 (MATLABシミュレーション)

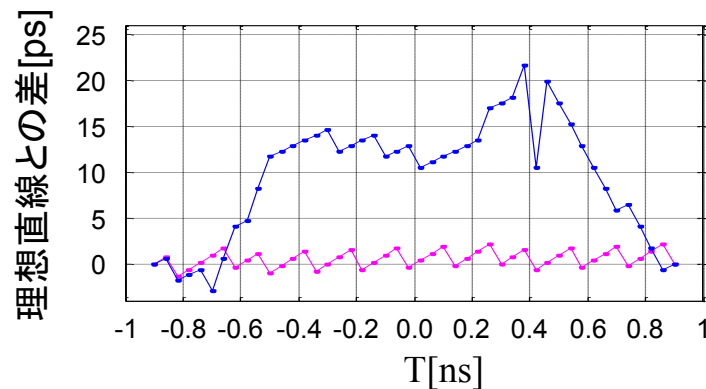
・3-bit  $\Delta\Sigma$  TDC (遅延時間 :  $\tau=0.145\text{ns}+\Delta\tau_N$ )

条件①

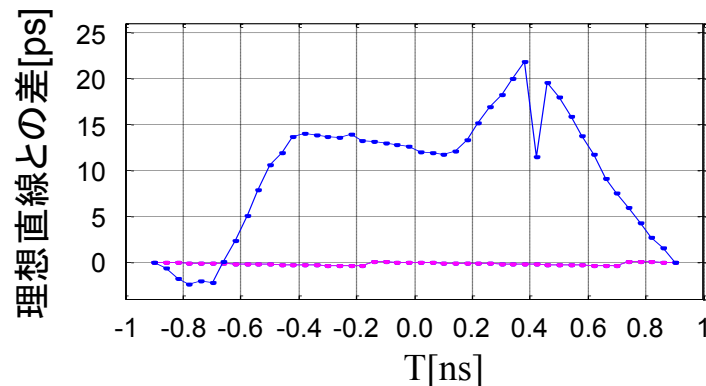
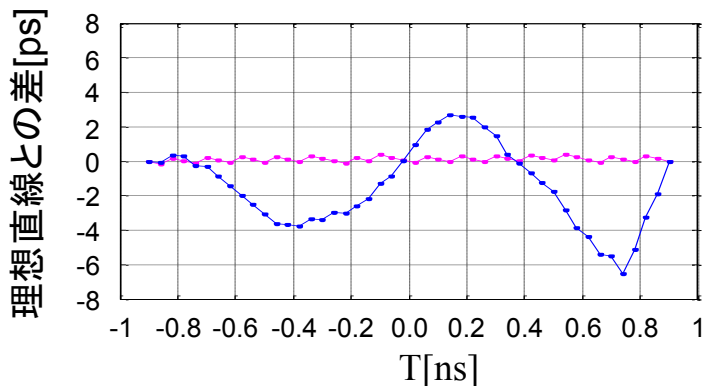
● 出力数 : 99点



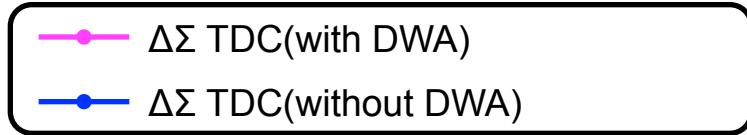
条件②



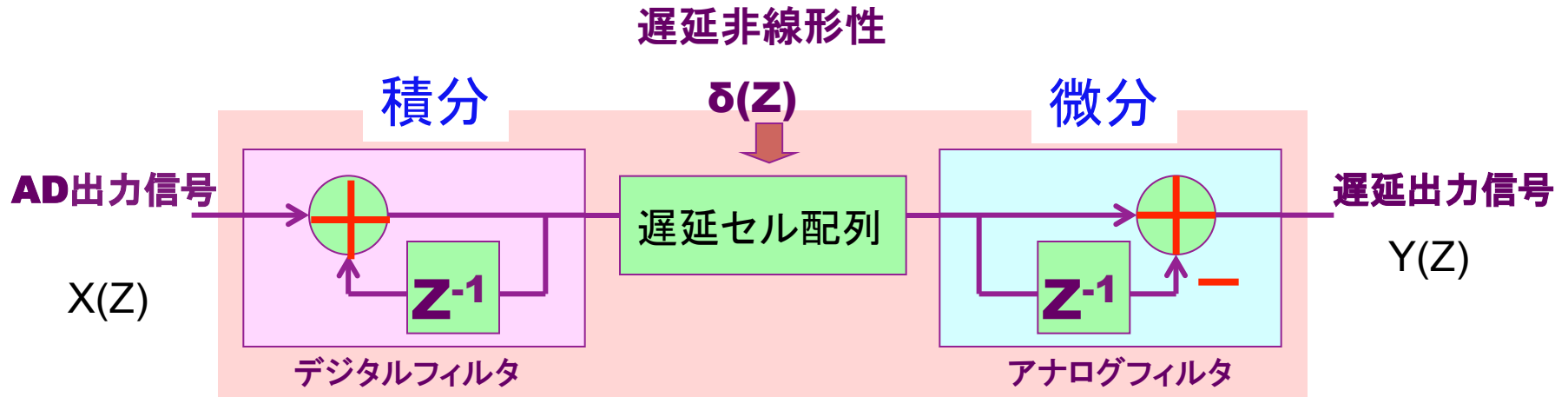
● 出力数 : 599点



✓ 遅延ミスマッチの影響が軽減  
➤ 出力の線形性を改善



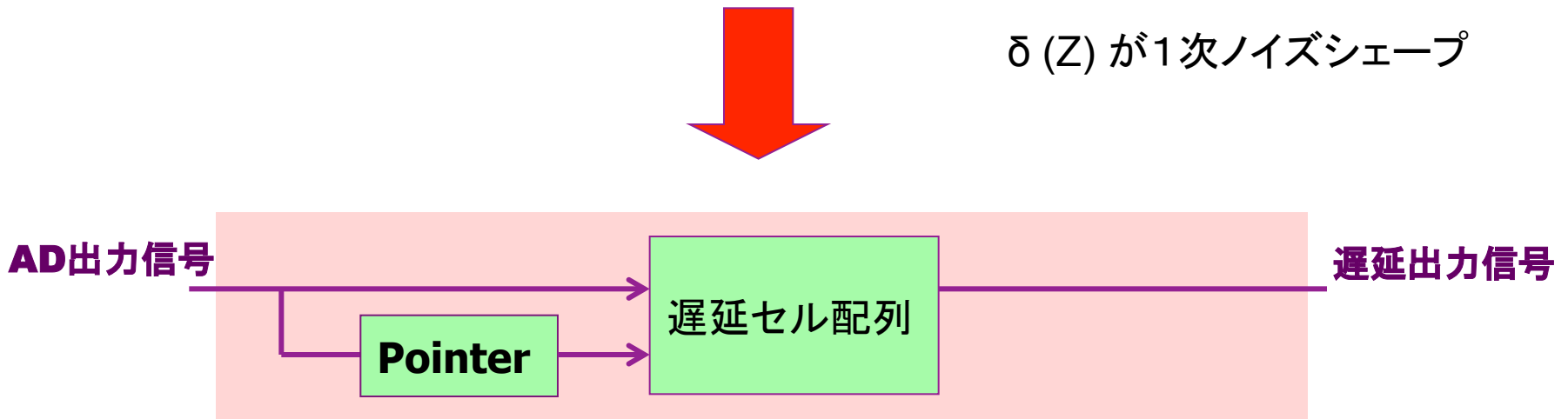
# DWA自体も $\Delta\Sigma$ 変調の構造



直接実現できない

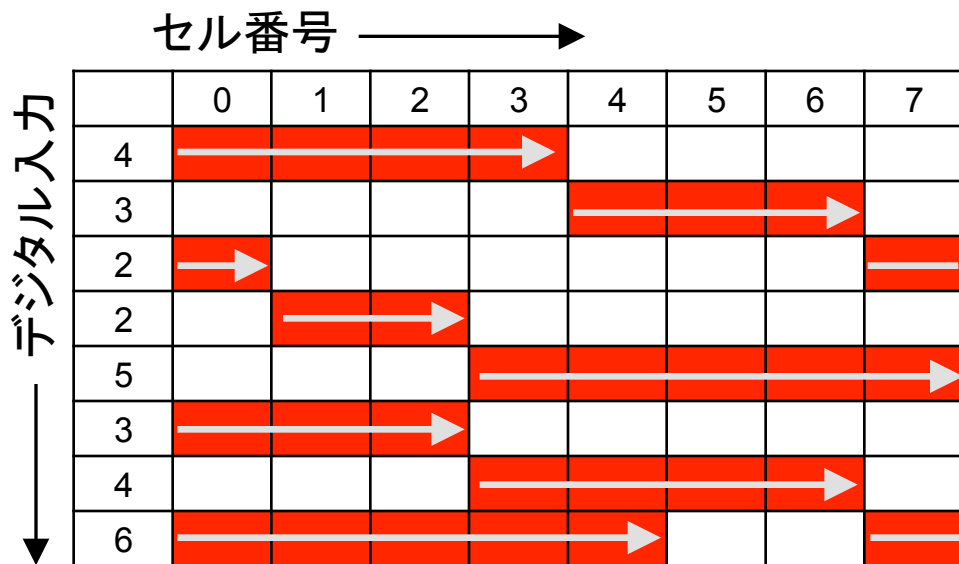
$$Y(Z) = X(Z) + (1 - 1/Z) \delta(Z)$$

$\delta(Z)$  が1次ノイズシェープ

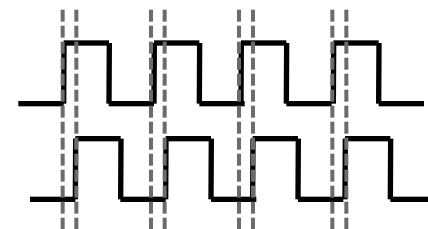


等価実現

# ΔΣTDCでのDWAアルゴリズム動作と効果



群馬大 小林Gr:  
ΔΣTDCにDWA使用の提案

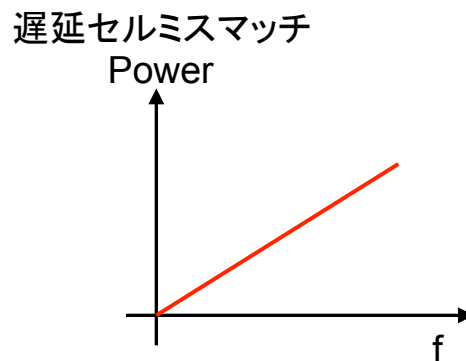
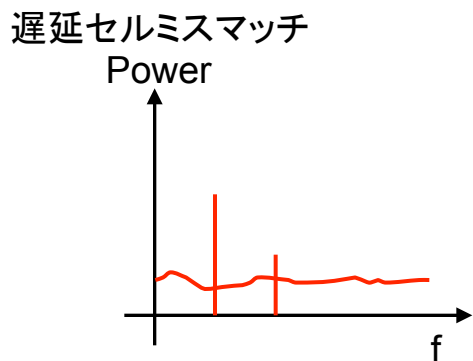


- デジタル入力によりシフトする量を制御
- 積分して微分を等価的に実現
  - 遅延セルミスマッチが1次ノイズシェープ

繰り返し信号を測定する



DC成分のノイズが減少すれば理想に近づく



Simulinkで回路の各ポイントで波形を見る際  
実際に回路を動かしているように  
連続時間で波形が確認できる。



誤動作、回路の設計ミスをしていても  
動画のように波形が見られるので、  
瞬時にミスが確認でき検証時間が短縮。

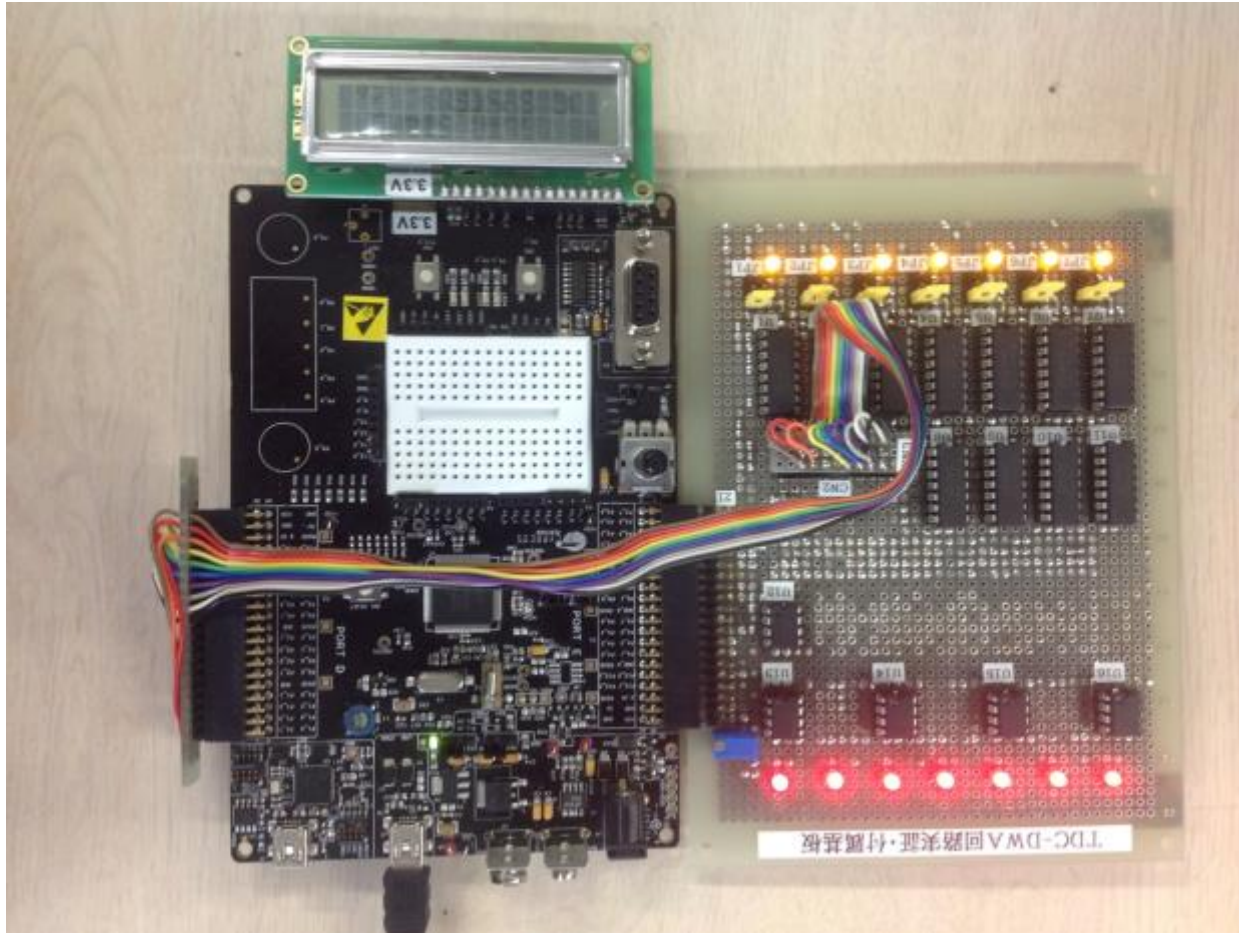
他のツールの場合  
波形を見たくても断片的に見なくてはならない  
シミュレーションが完全に終了後でない  
と確認できない。

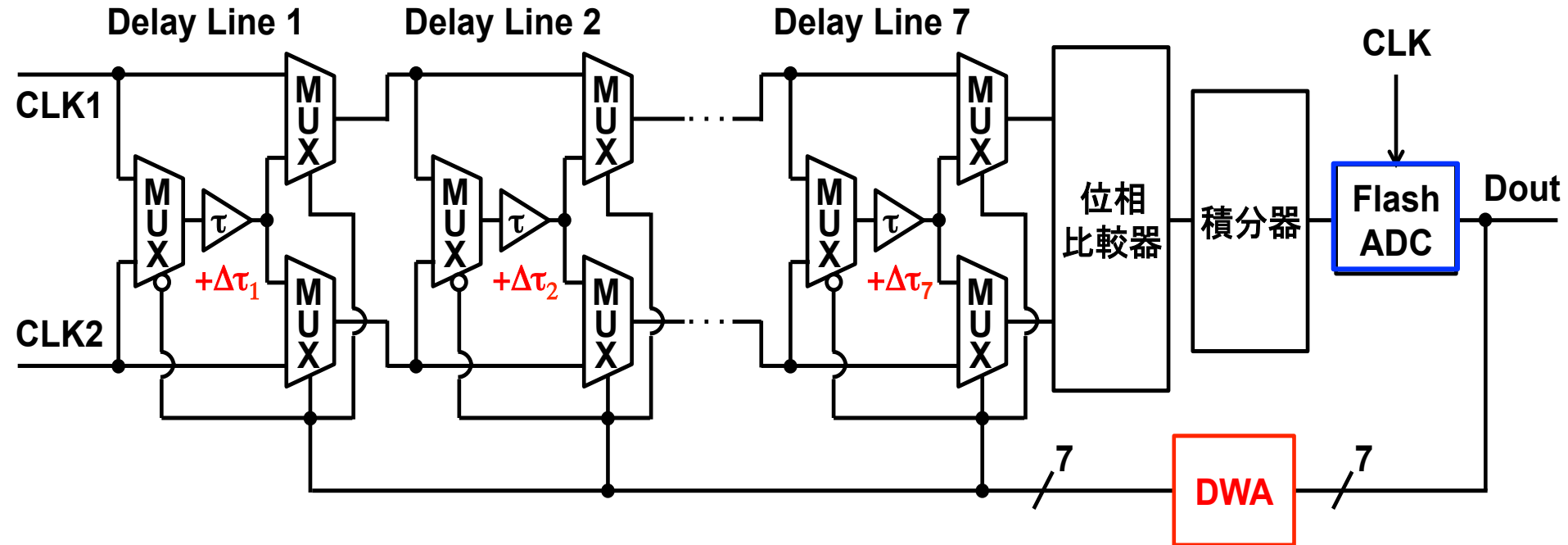
回路解析において、Simulinkを使うことで視覚的に回路をとらえることができるので、複雑な回路解析も正確に行うことができる。



- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - **アナログFPGA実現**
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

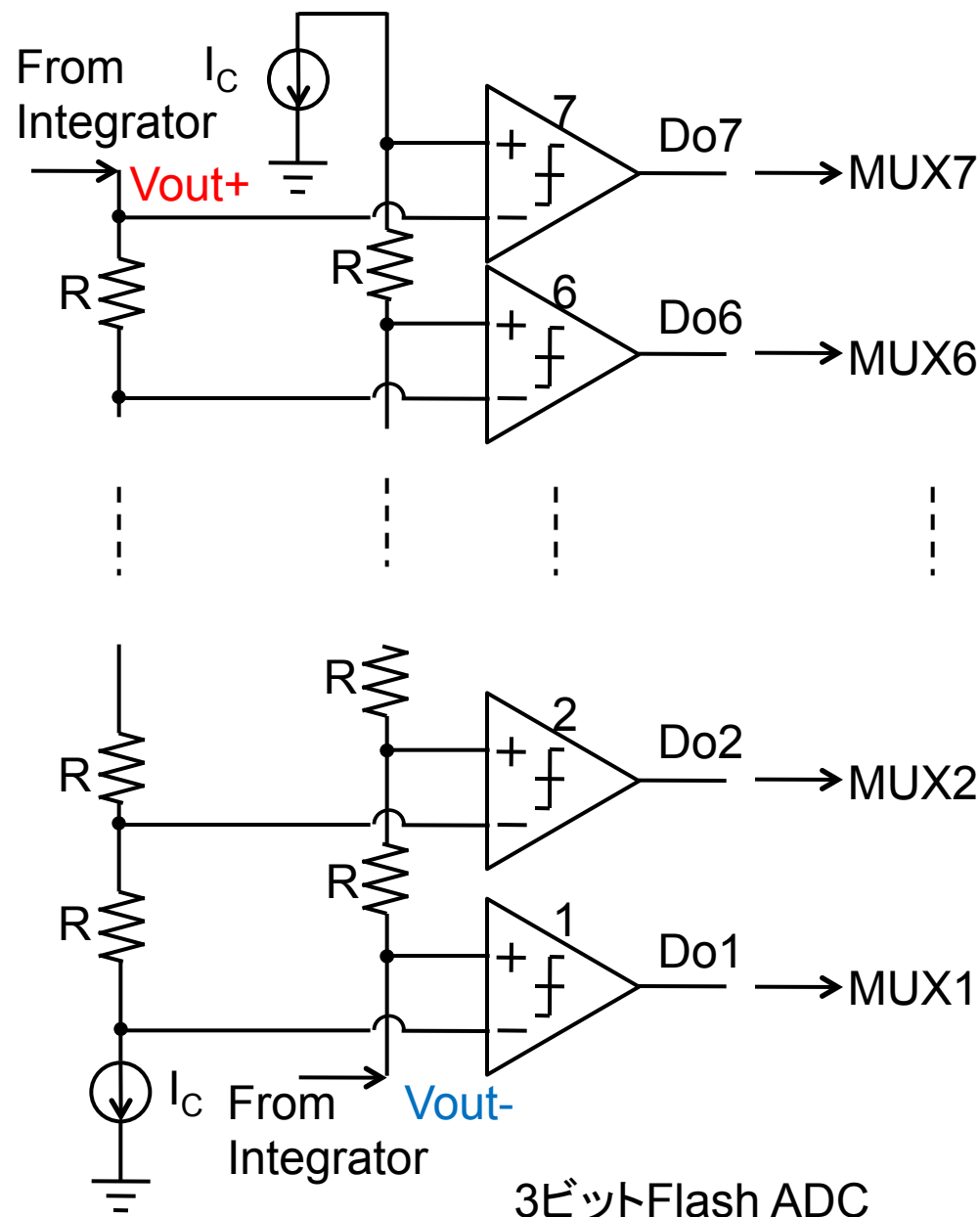
# マルチビット $\Delta\Sigma$ TDCのPSoC実装





ブロック図

遅延  $\tau$  は外付けのRC遅延で実現。  
 各遅延セルの抵抗Rは個別にスイッチで値が切り換え可能。  
 (意図的に遅延ばらつきを生成できる。)



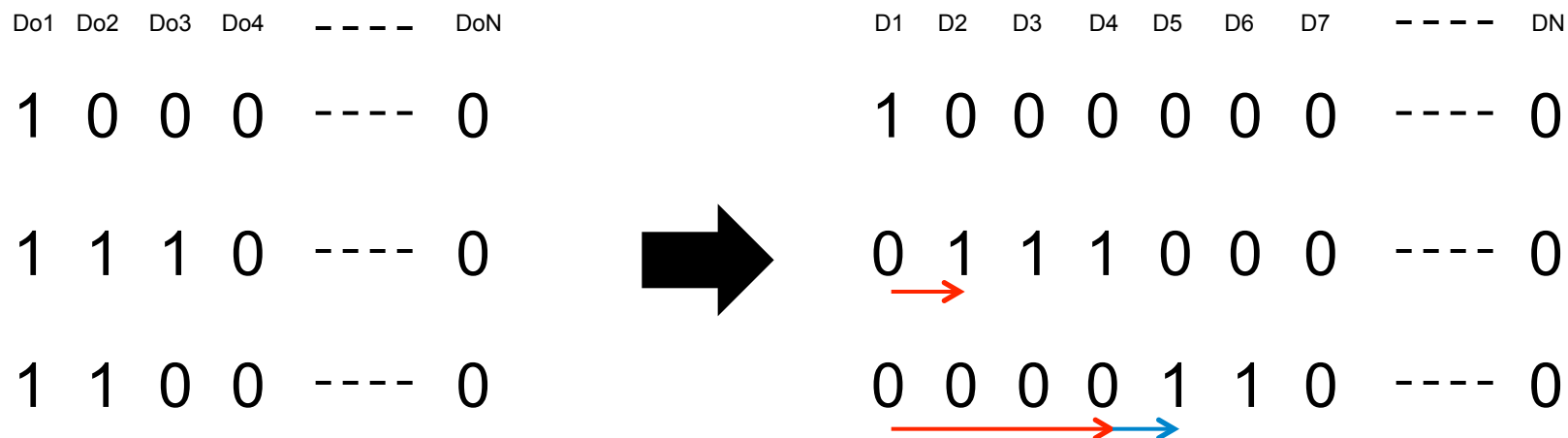
差動構成  
+  
ダイナミック抵抗ラダー

DWAロジック回路に入力  
クロックの遅延選択回路の  
Select 信号へ

3ビットFlash ADC

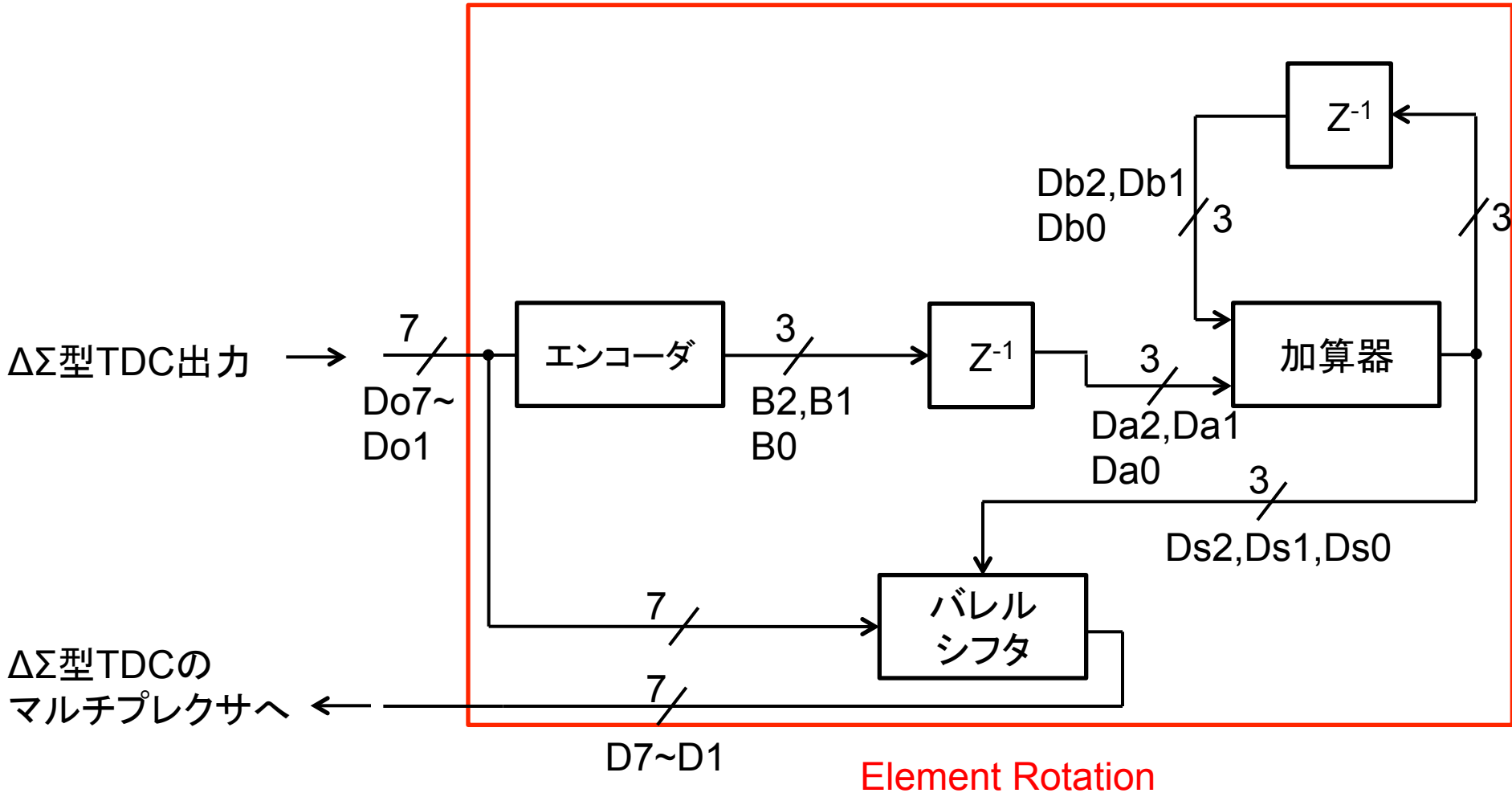


- 温度計出力コードの信号をシフトし、クロック毎に選択する遅延素子をシフト
- 前のクロックでの1の数とシフト回数を保持・加算し現在のクロックでのシフト回数を決定



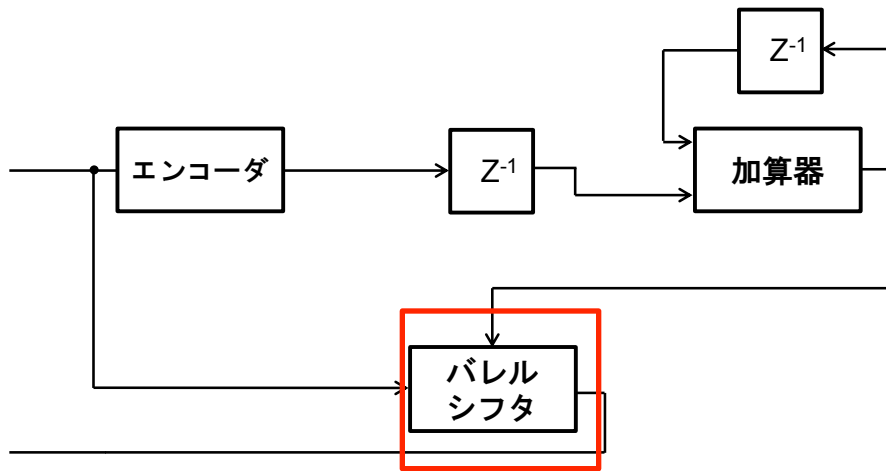
N個コンパレータ $\Delta\Sigma$ 型TDC出力

DWAロジック回路出力



エンコーダ、遅延回路、加算器、バレルシフタにより構成

# バレルシフタ (Barrel Shifter)



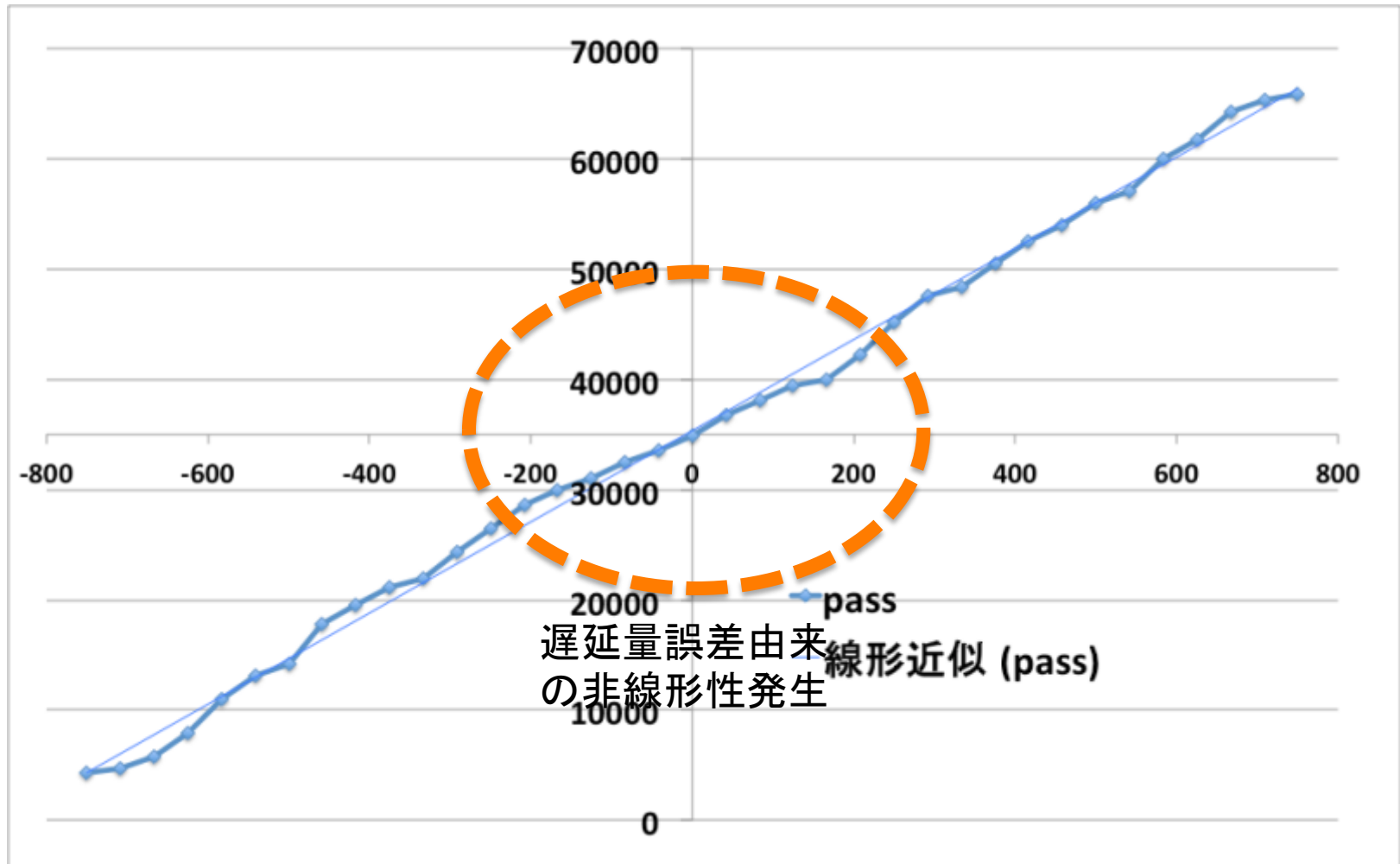
DWA論理回路のブロック図

入力信号を任意の数だけシフトする  
→右回転シフト回路

1	0	0	0	0	0	0	0	入力
0	1	0	0	0	0	0	0	1回シフト
0	0	0	1	0	0	0	0	3回シフト
0	0	0	0	0	1	0	0	5回シフト
1	0	0	0	0	0	0	0	N回シフト

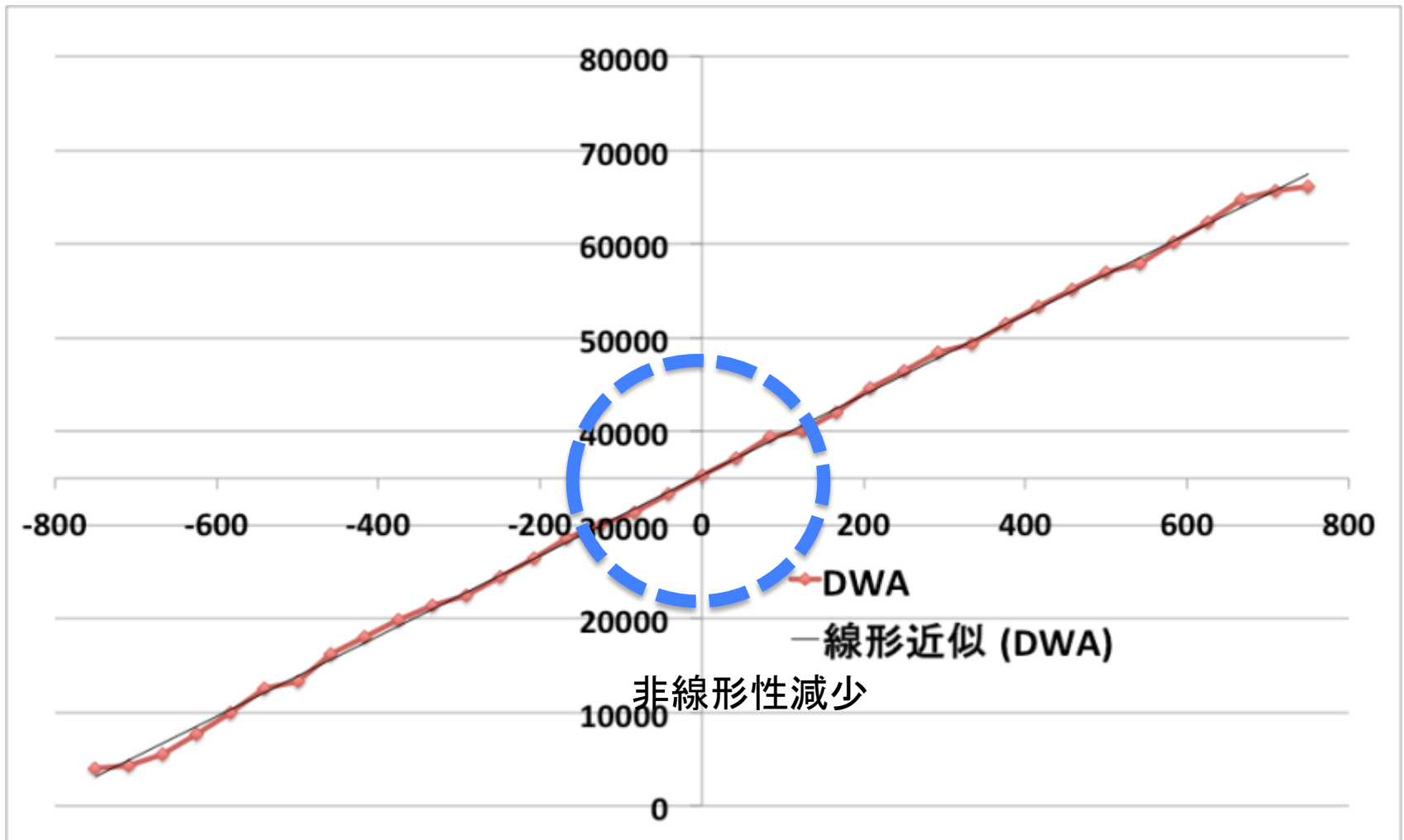
N回シフトで元の位置に戻る

# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果1(DWA不使用)

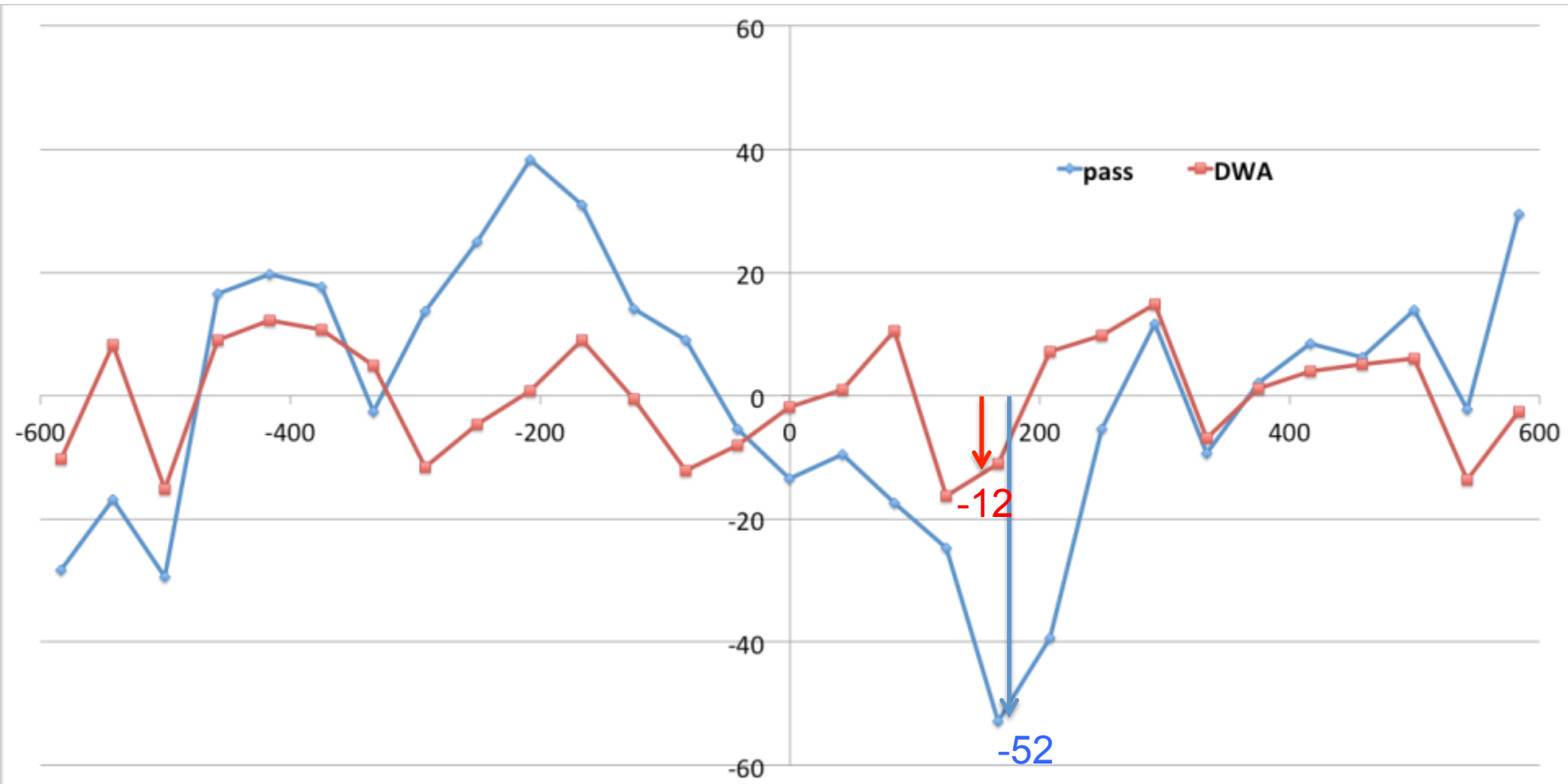




# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果1 (DWA使用)

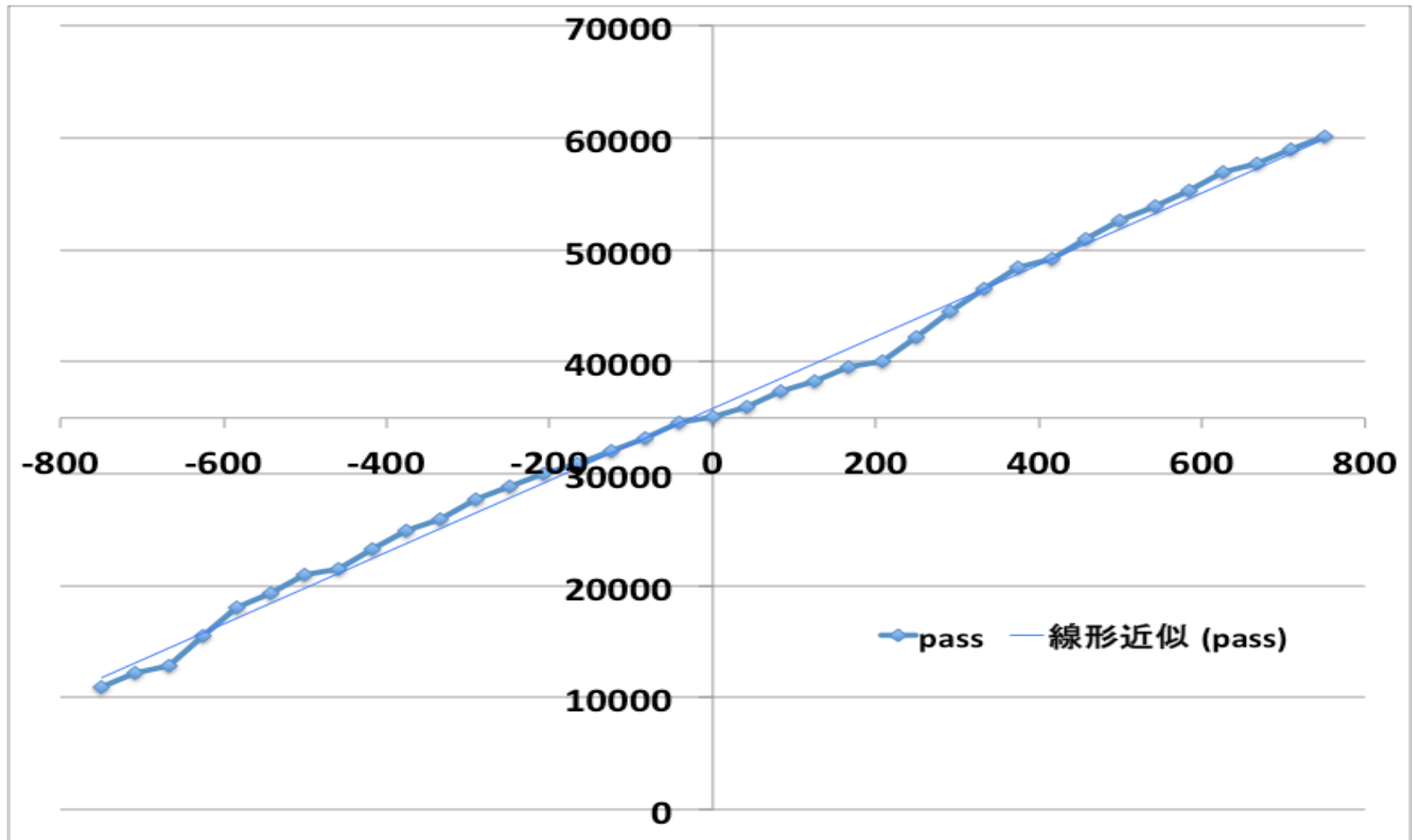


# 積分非直線性 INL

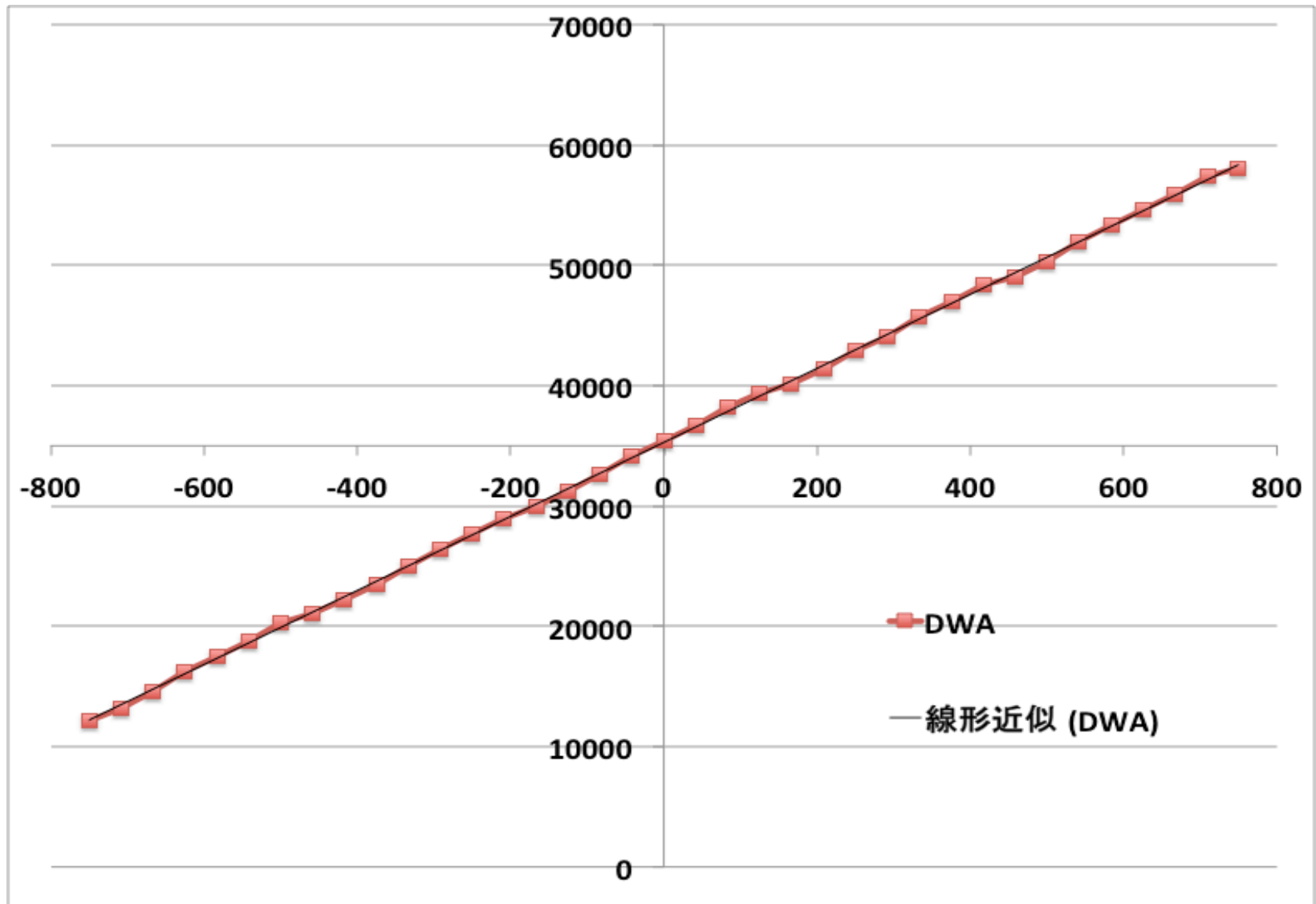


遅延素子由来のINLの減少を確認

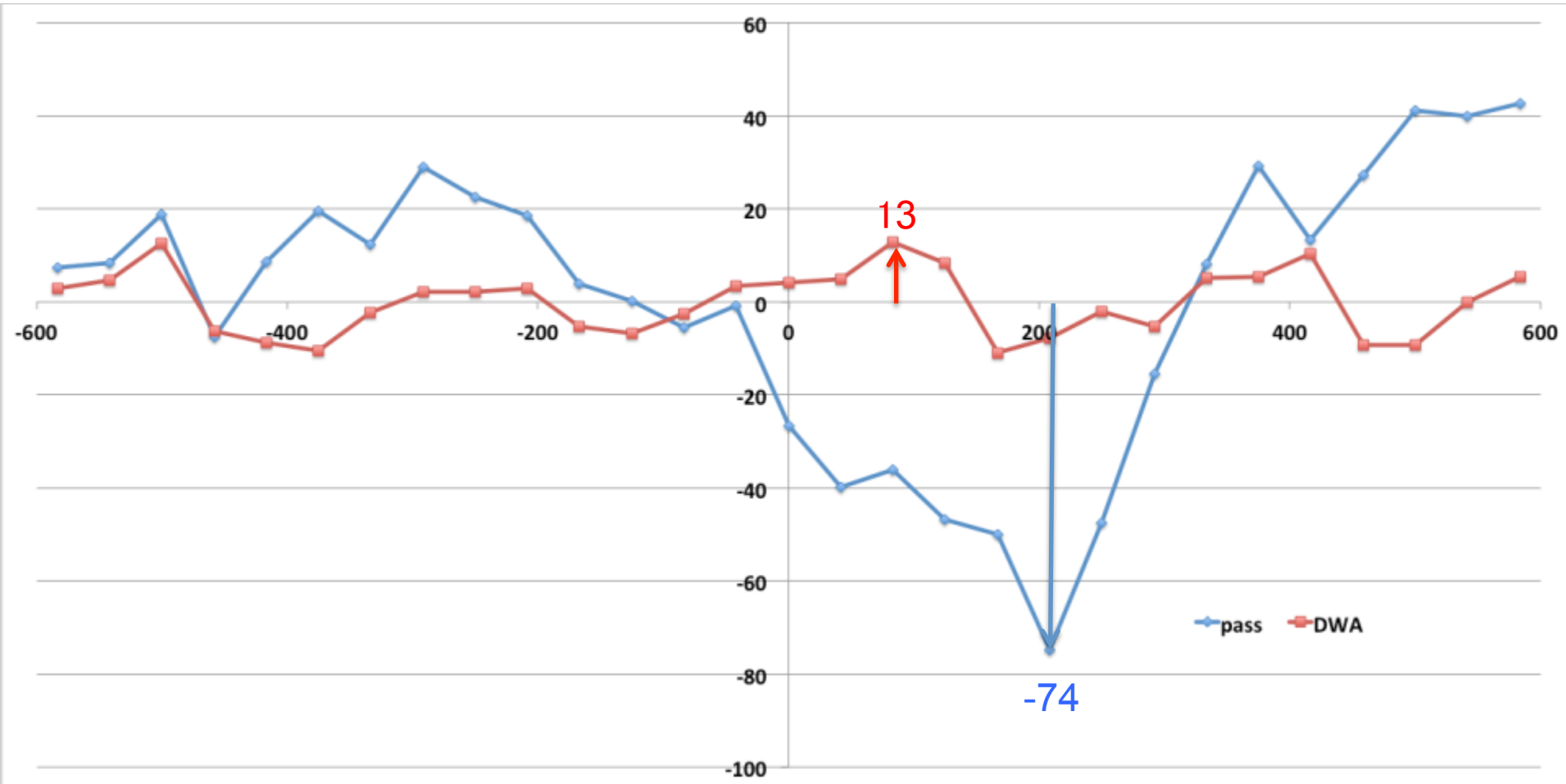
# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果2(DWA不使用)



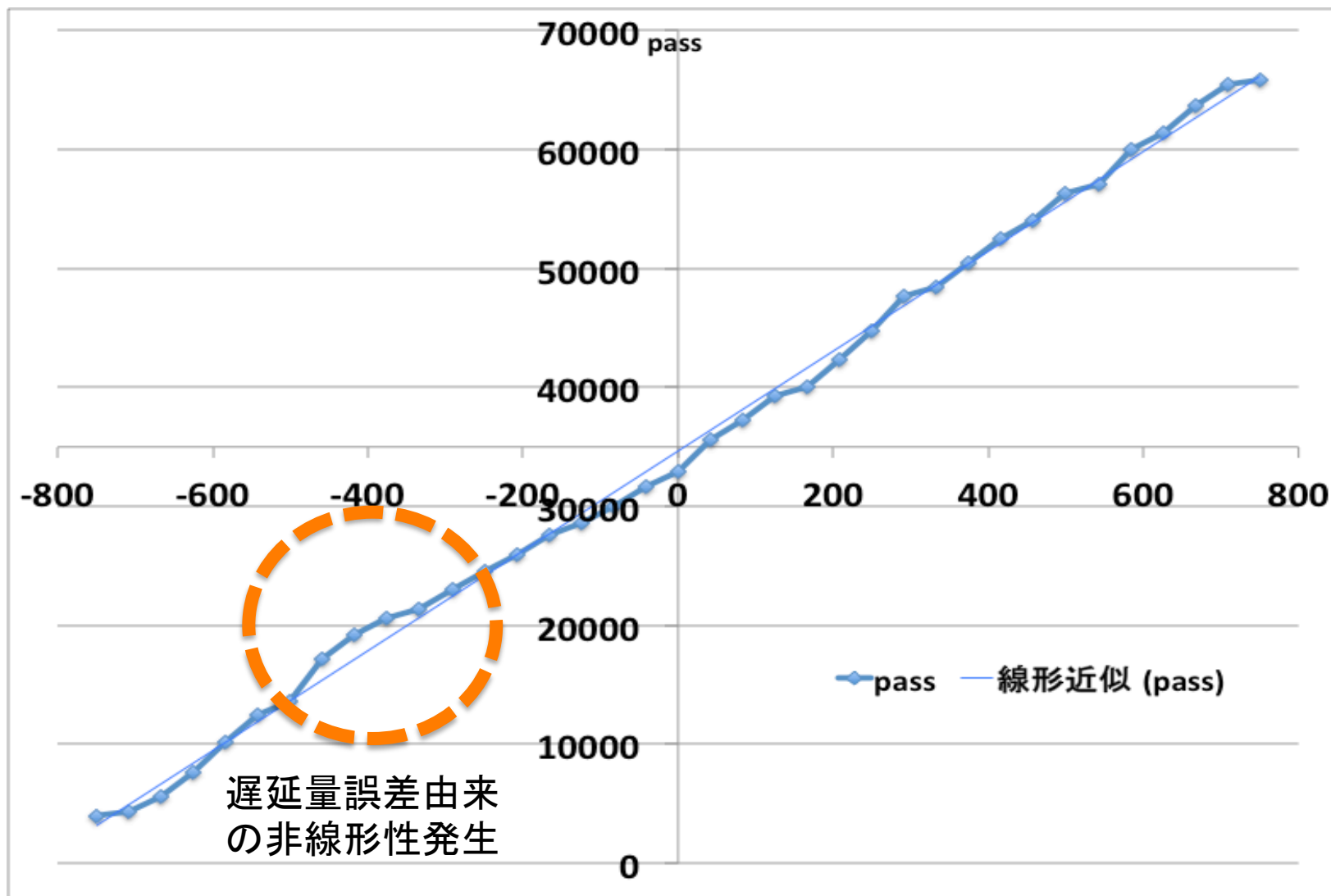
# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果2 (DWA使用)



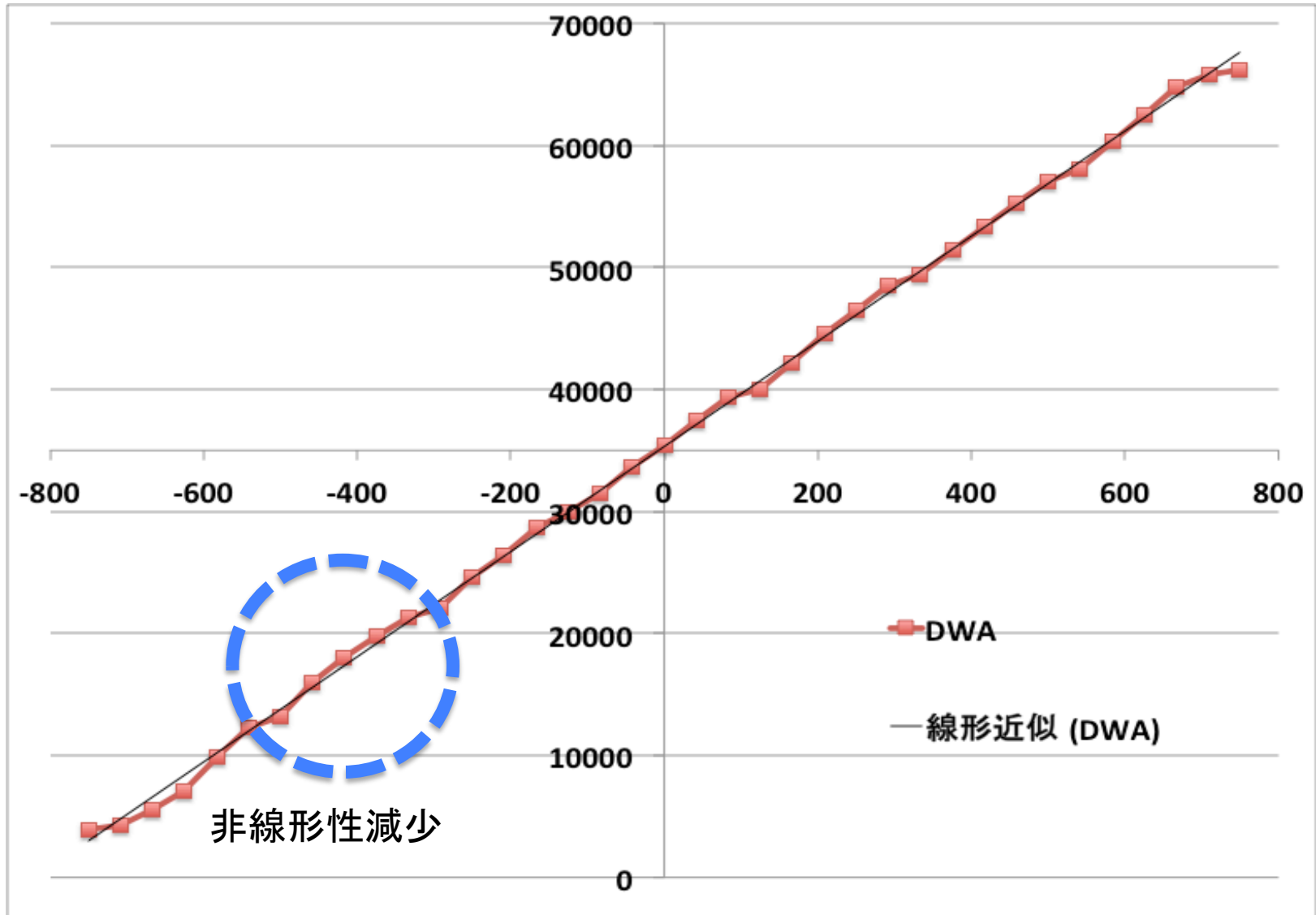
# 積分非直線性 INL



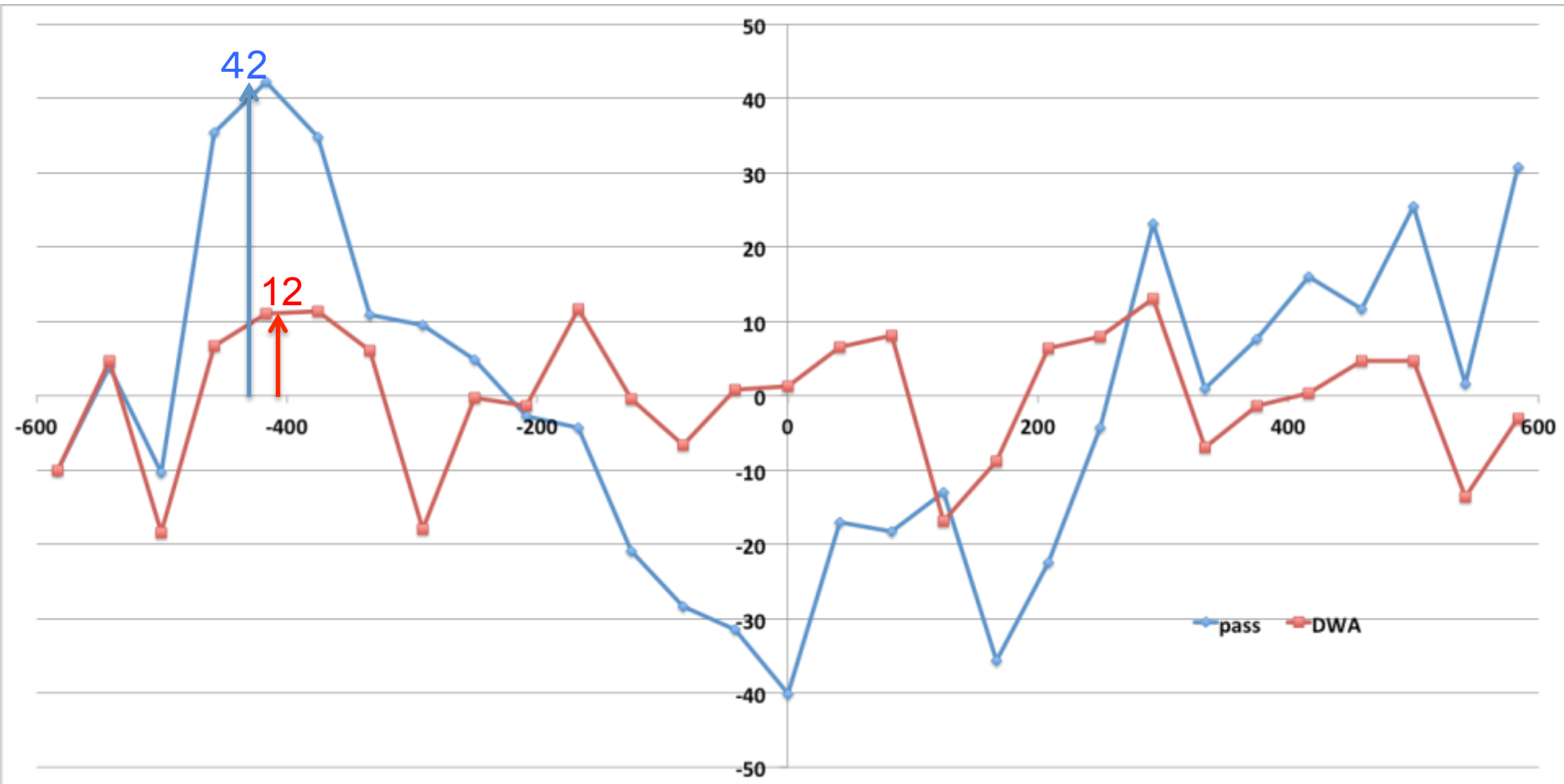
# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果3 (DWA不使用)



# $\Delta\Sigma$ TDC 測定結果3 (DWA使用)



# 積分非直線性 INL



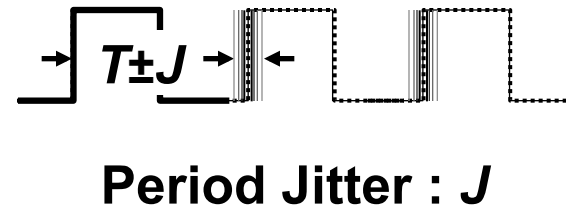
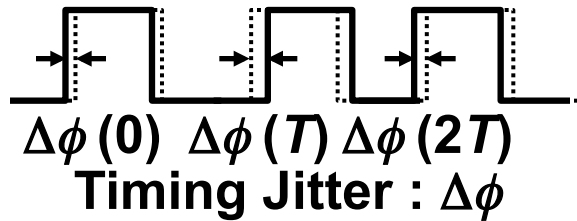


# 回路性能のまとめ

	Flash TDC	1-bit $\Delta\Sigma$ TDC	マルチビット $\Delta\Sigma$ TDC (without correction)	マルチビット $\Delta\Sigma$ TDC (with correction)
回路量	×	◎	○	○
時間分解能	×	◎	◎	◎
精度	△	◎	×	○
測定時間	◎	×	○	○

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

位相ノイズを持つクロックはシステムの誤動作の原因となる



クロックの位相ノイズ、ジッタの測定・テスト

通信システム、ADCの高性能化において重要

## クロックの位相ノイズ、ジッタの測定・テストの問題点



- 測定に長時間かかる
- スペクトルアナライザが必要



非常に高価！！

LSIの量産時のテストのためには...



たくさんのスペクトル  
アナライザが必要



大幅にコスト増加！！

スペクトルアナライザを用いず位相ノイズ、ジッタを測定・テストする



低コストの位相ノイズ、ジッタ測定を可能にする！

## $\Delta\Sigma$ TDC

線形性：良

回路規模：小

時間分解能：高

デジタル演算で周波数特性が得られる



チップ内テスト容易化回路による低コスト・高品質テストの実現が可  
(BIST: Built-In Self Test)

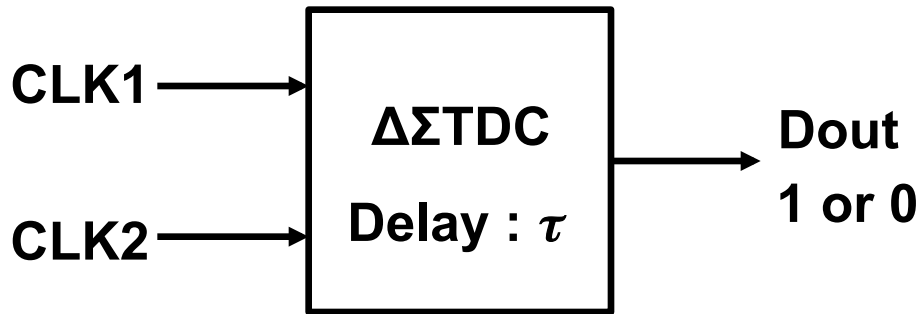
外部に端子を接続する必要がない

||

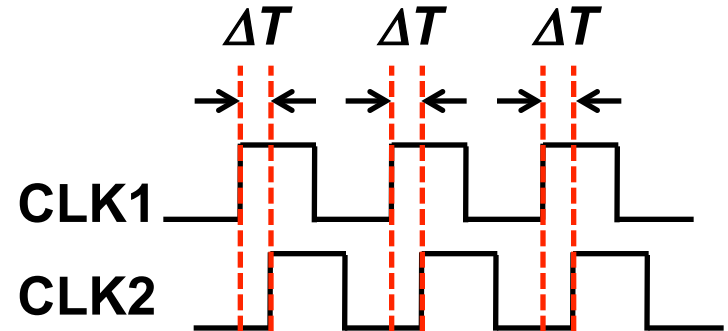
さらなる位相ノイズがのる心配がない



高性能



繰り返しクロックの時間差： $\Delta T$



$\Delta T$ がDoutのパルス"1"の個数に比例

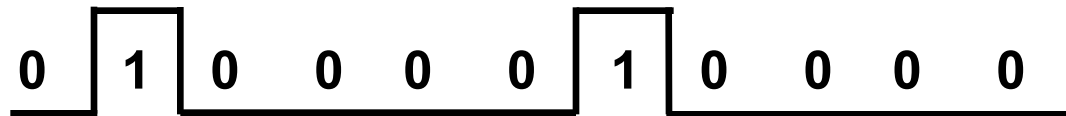
$\Delta T$

1の数

Dout

小

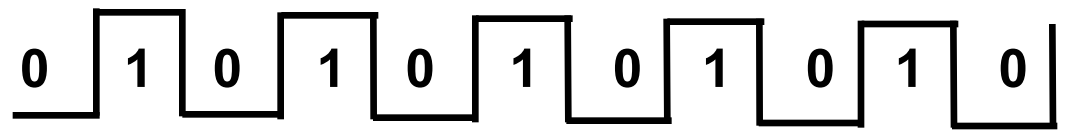
少



中

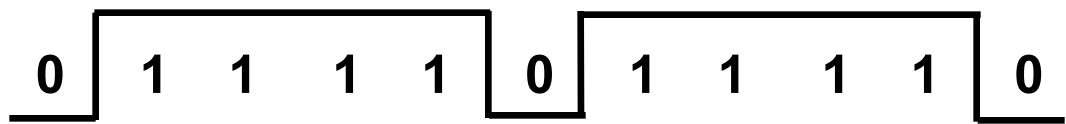


中

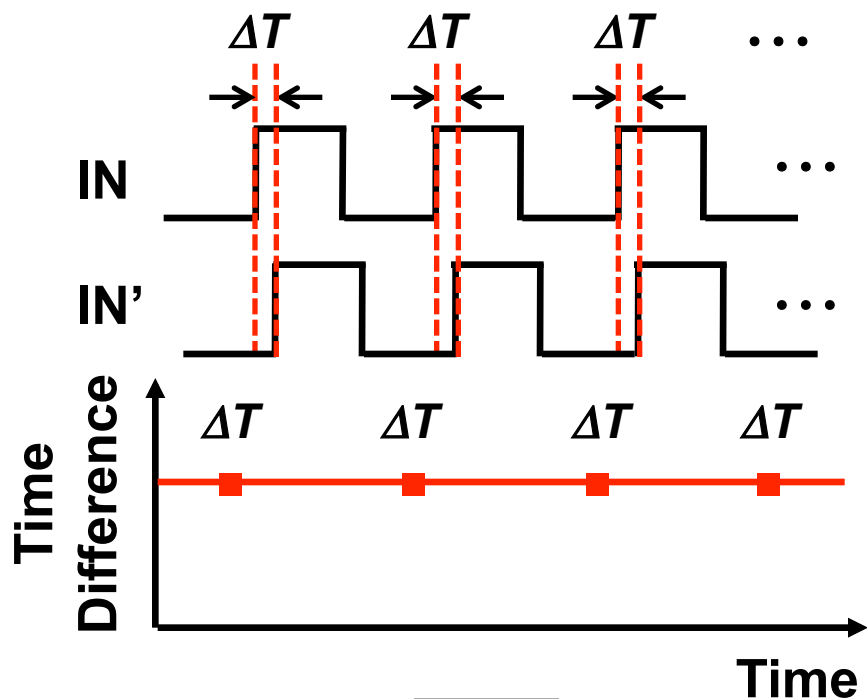


大

多



## 位相ノイズがない信号

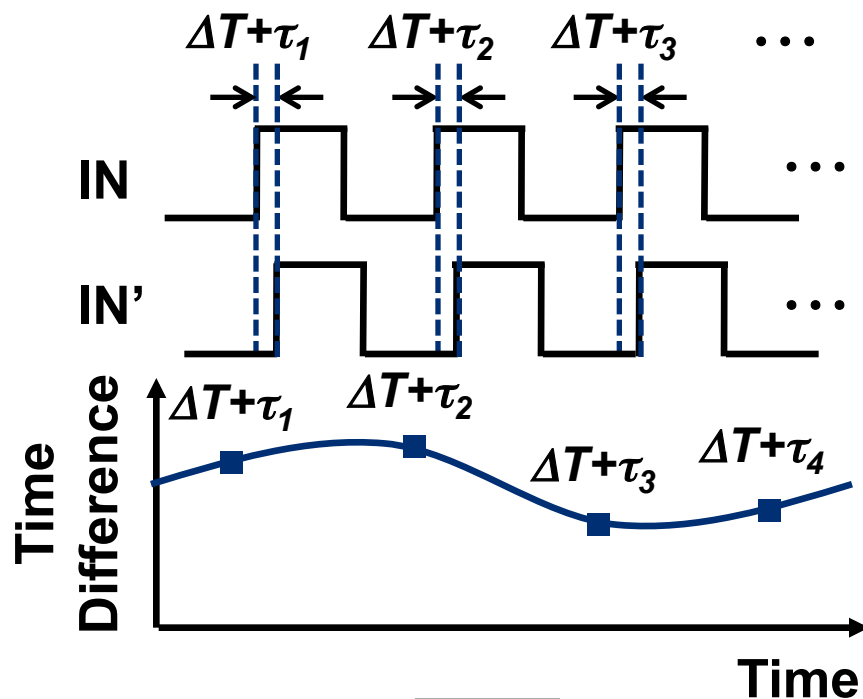


FFT



DC成分のみスペクトルが出る

## 位相ノイズを持つ信号

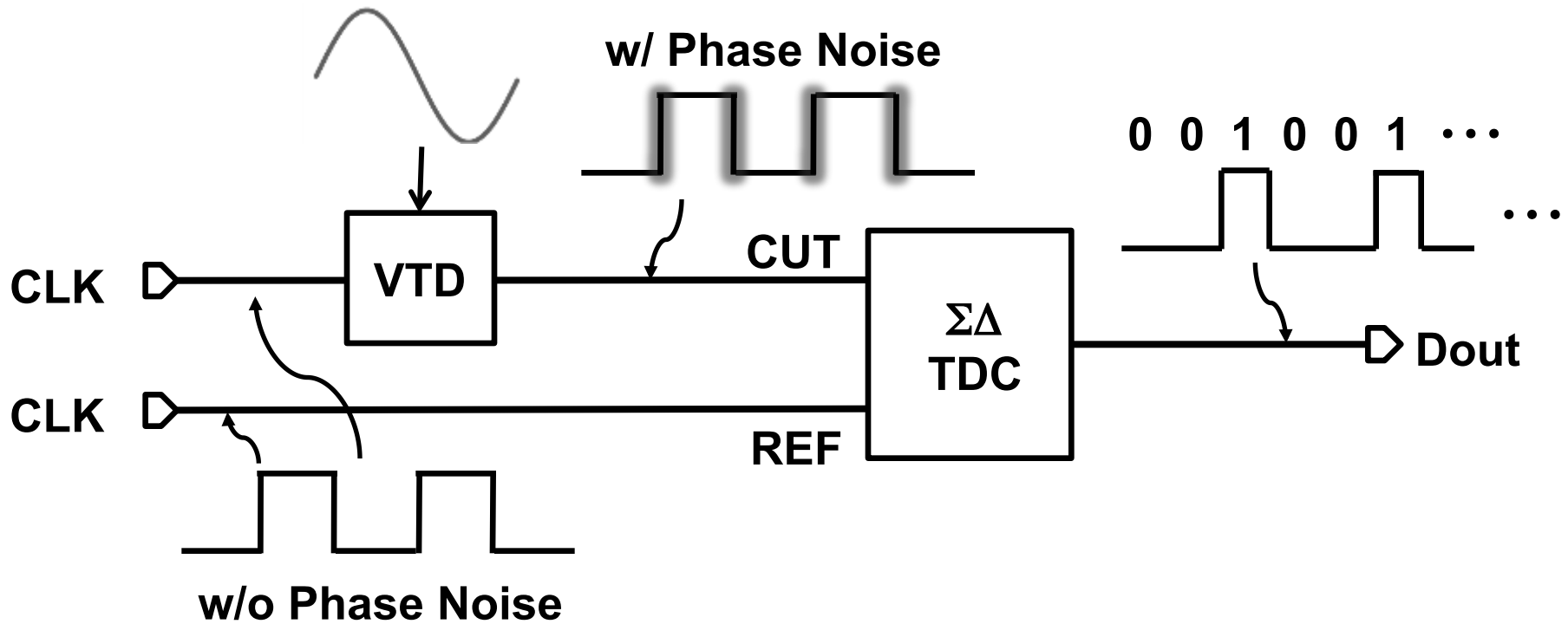


FFT

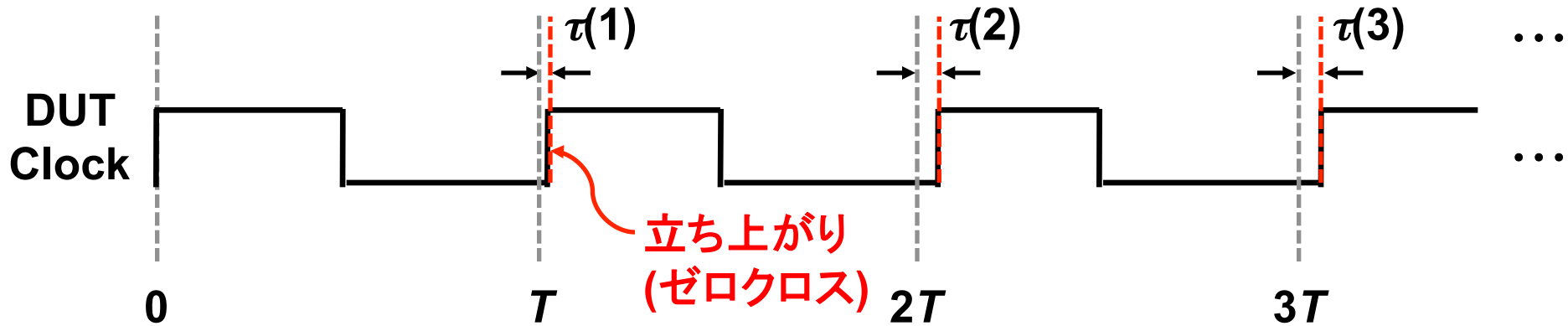


位相ノイズ測定可能





**VTD : Variable Time Delay**



クロックの正弦波近似

$$clock(t) \approx \sin(2\pi f_{in}t + \phi(t)) \quad f_{in} = \frac{1}{T}$$

立ち上がりエッジのゼロクロス点変動関数 :  $\tau(m)$        $m$  : number of edges

立ち上がりエッジの  $m$  番目のゼロクロス

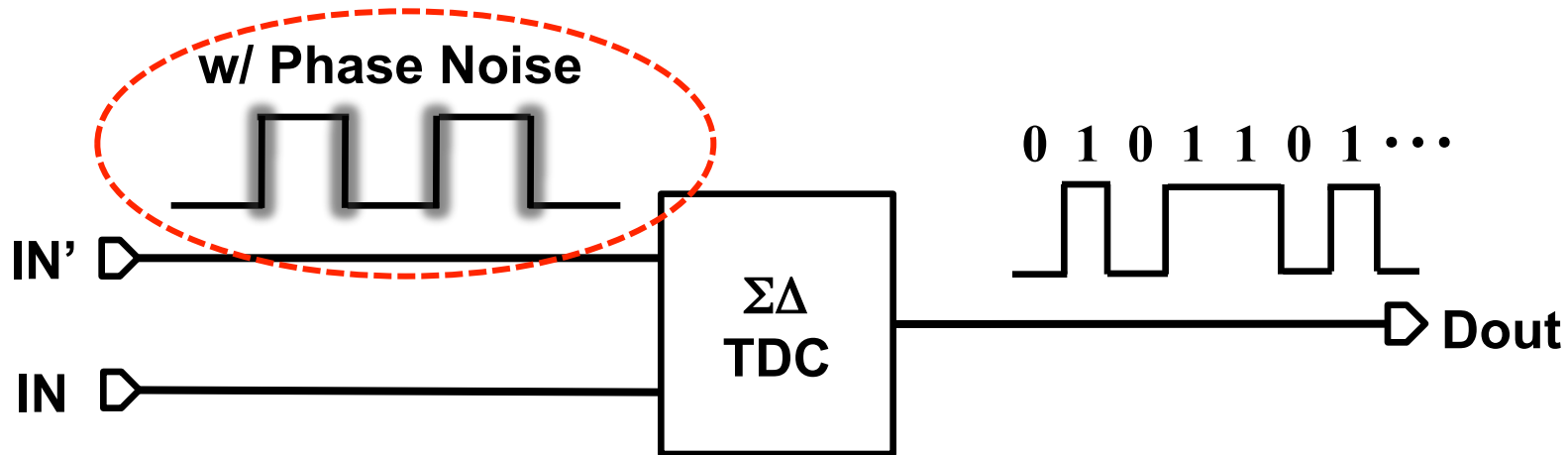
$$2\pi f_{in}(mT + \tau(m)) + \phi(mT) = 2\pi m$$

$$\therefore \phi(mT) = -2\pi f_{in}\tau(m) : \text{位相ノイズ(時間領域)}$$

①  $\tau(m) = T \cdot \alpha_j \cdot \sin(\omega_j mT)$  の場合(単一正弦波の位相変動)       $0 \leq \alpha_j \leq 1$

$$\phi(mT) = -2\pi f_{in}\tau(m) = -2\pi\alpha_j \cdot \sin(\omega_j mT) : \text{位相ノイズ(時間領域)}$$

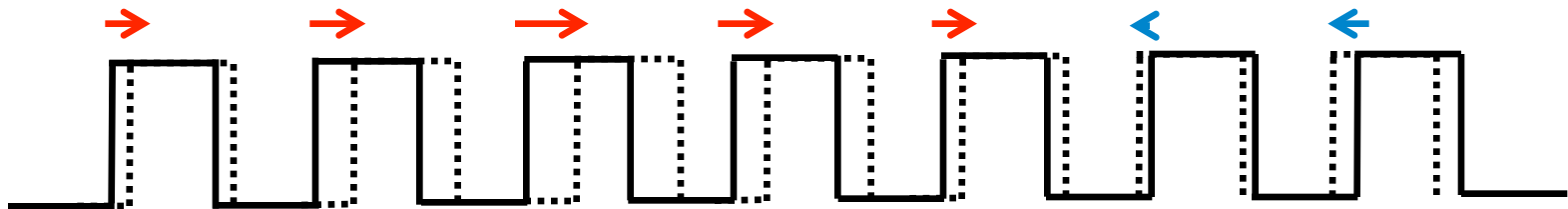
$$\Phi(\omega_j) = \frac{1}{2} (2\pi\alpha_j)^2 : \text{位相ノイズ(周波数領域)}$$



$IN'$ に位相変動を与えることで疑似的な位相ノイズを実現する



正弦波の位相変動をあたえる



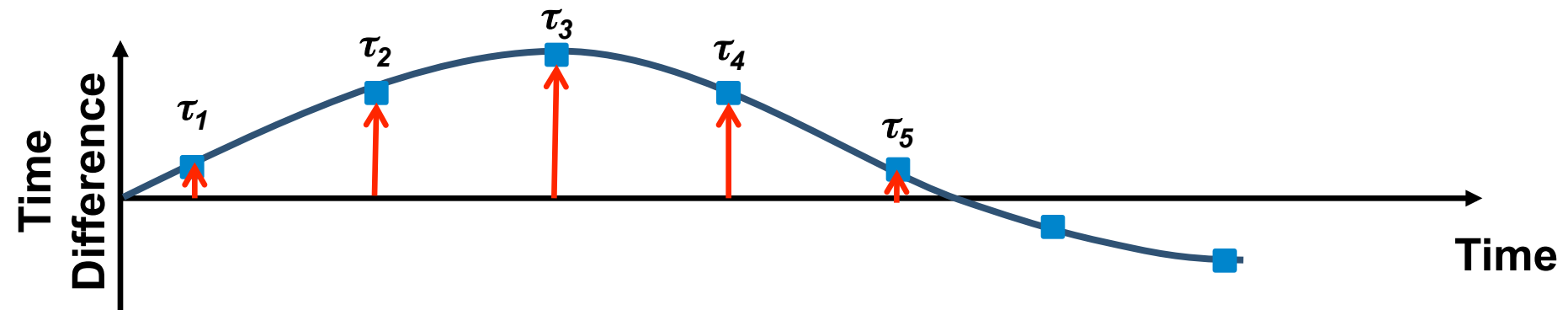
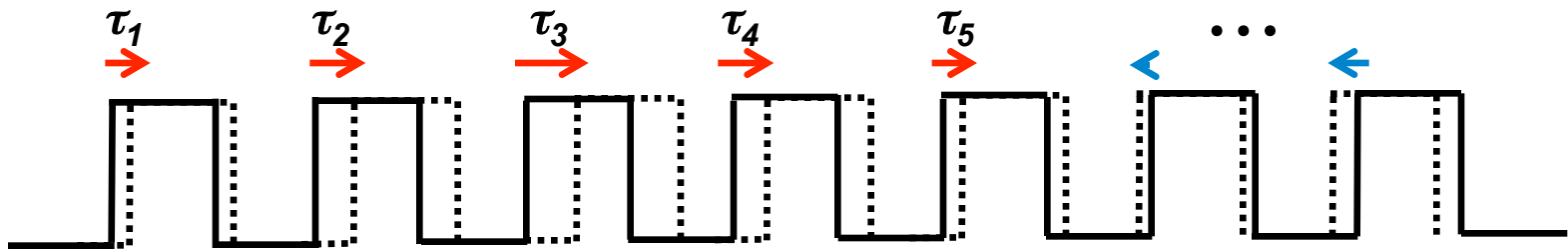
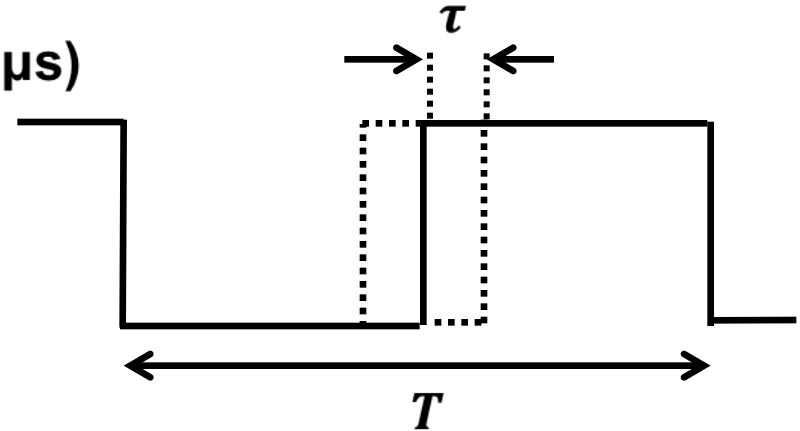
実線：基準CLK 点線：位相変動後CLK

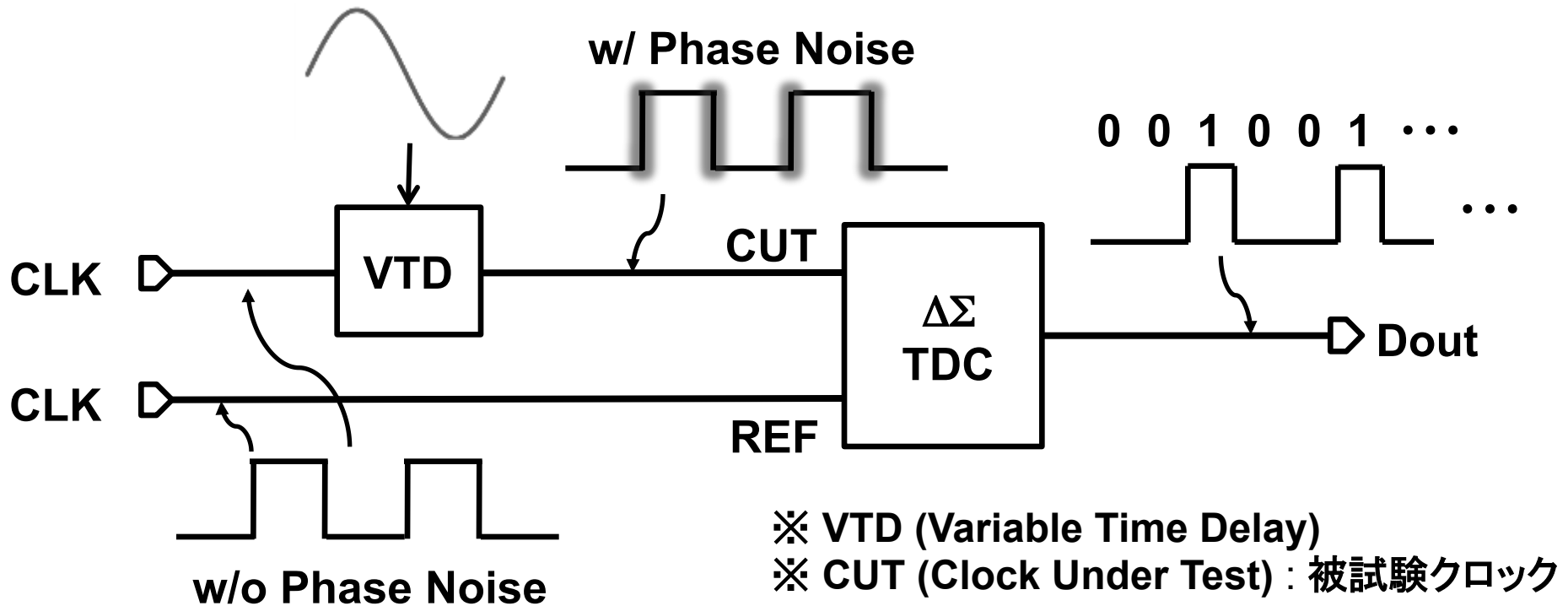
MATLAB ( Simulink ) によるシミュレーション

- CLKの周波数 :  $f_{in} = 1 \text{ MHz}$  ( $T = 1 \mu\text{s}$ )

正弦波の位相変動

- 周波数 :  $f_j = 10\text{kHz}$
- 位相変動 :  $-0.1\mu\text{s} \leq \tau \leq 0.1\mu\text{s}$



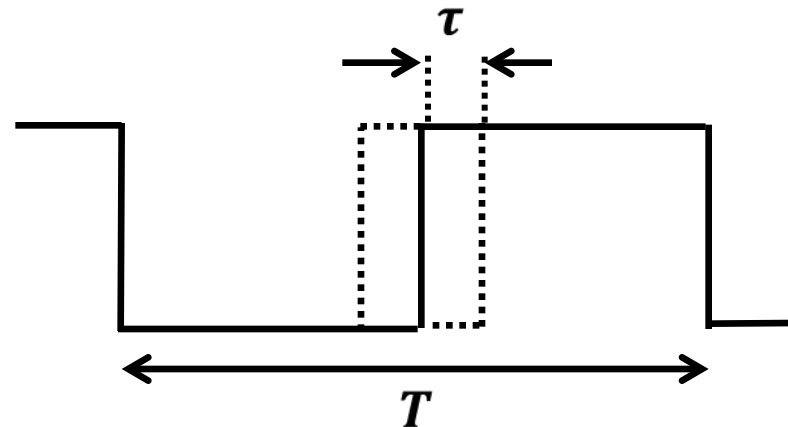


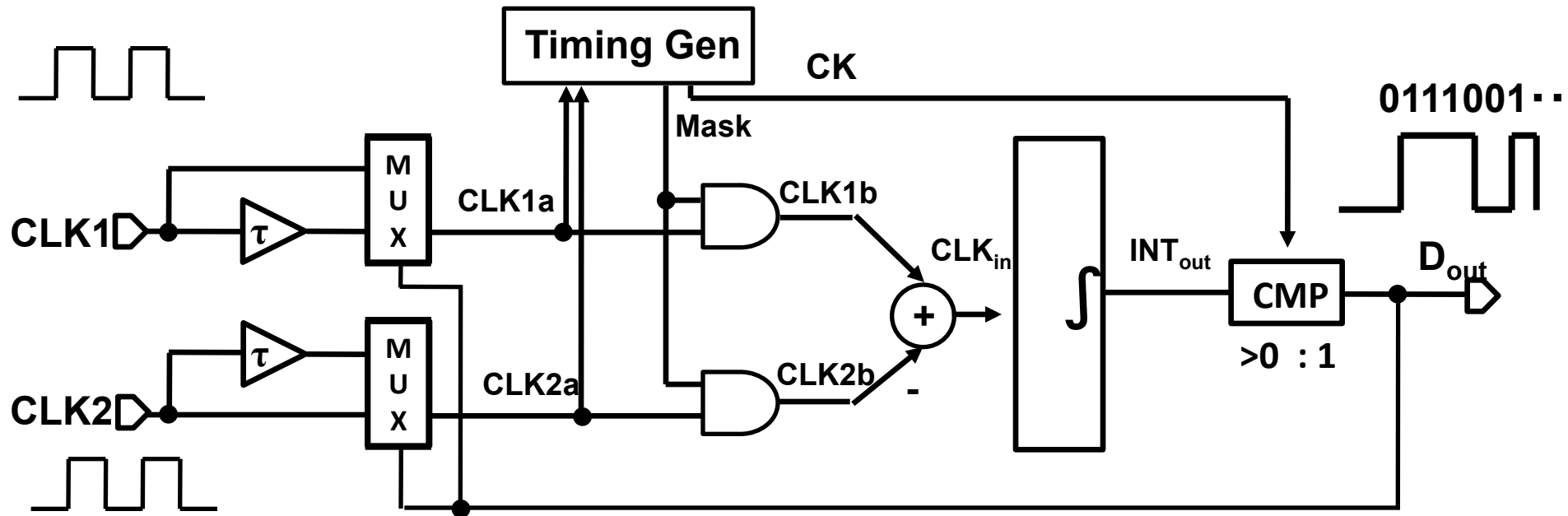
## MATLAB ( Simulink ) によるシミュレーション

- CLKの周波数 :  $f_{in} = 1 \text{ MHz}$  ( $T = 1 \mu\text{s}$ )

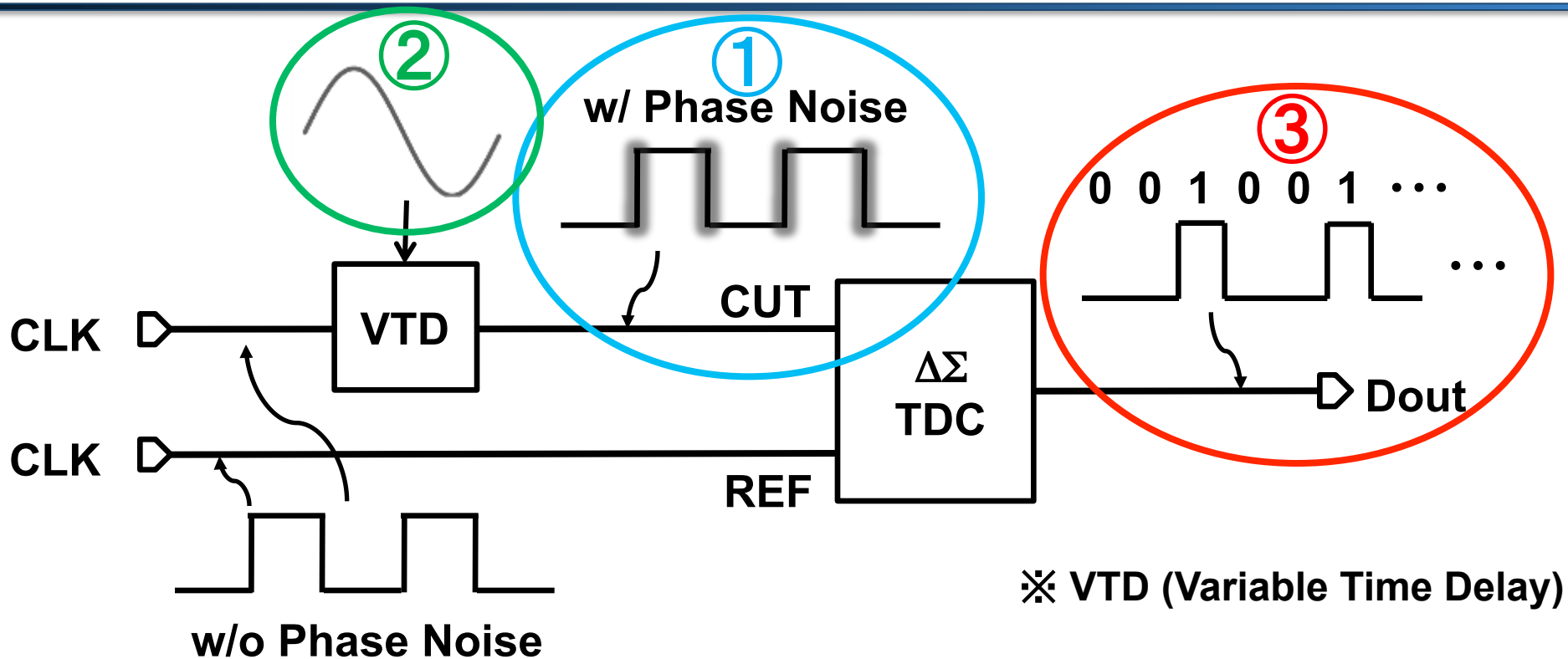
正弦波の位相変動

- 周波数 :  $f_j = 10 \text{ kHz}$
- 位相変動 :  $-0.1 \mu\text{s} \leq \tau \leq 0.1 \mu\text{s}$



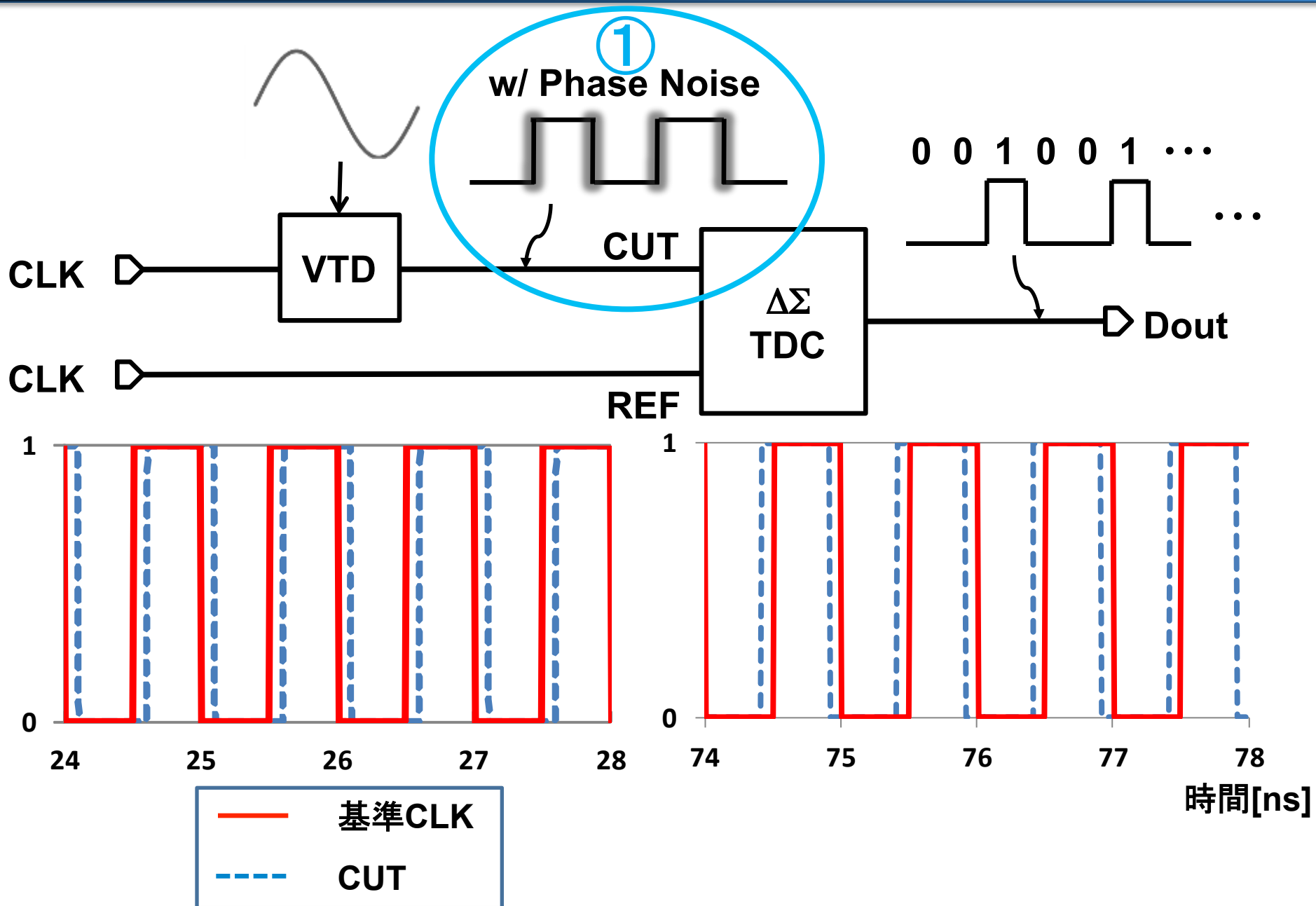


入力周波数	1 MHz
位相ノイズ	単一正弦波 10 kHz
データ点数	4096



- ① 位相変動後のCUT(被試験クロック)を測定
- ② ③のFFT結果と比較するために測定
- ③ 出力D<sub>OUT</sub>を測定

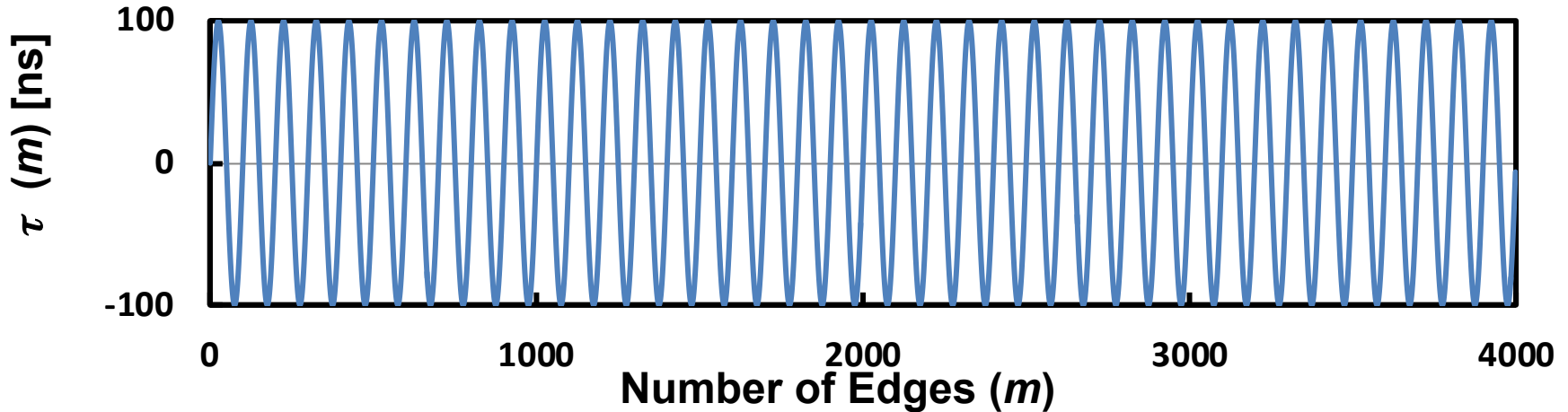
# ① 位相変動後の被試験クロックの波形



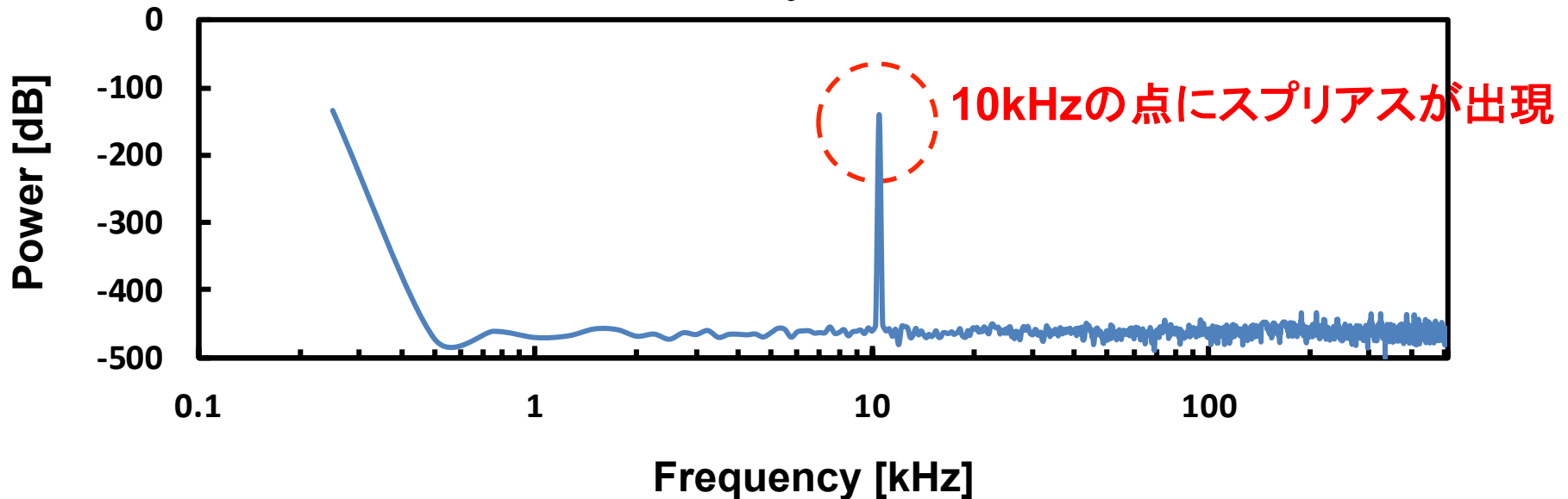


## ② 入力CLKに与えた位相変動正弦波のFFT 113

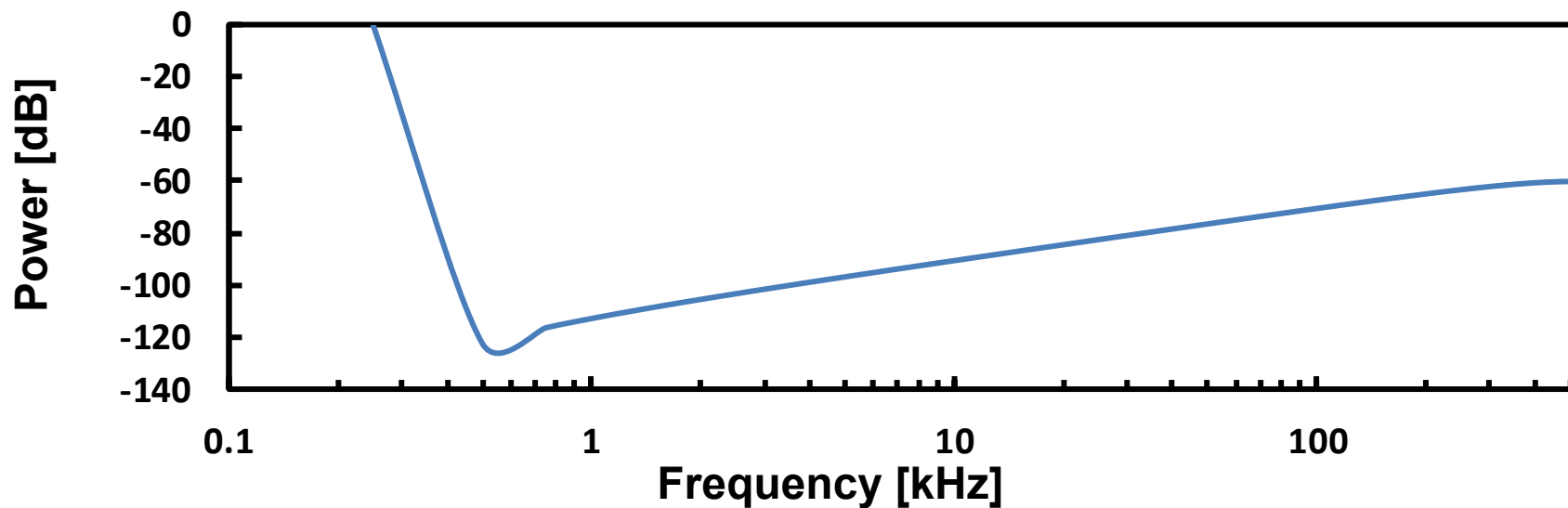
入力に加えた正弦波  $\phi(t) = -2\pi\alpha_j \cdot \sin(2\pi f_j t)$  ,  $f_j = 10\text{kHz}$



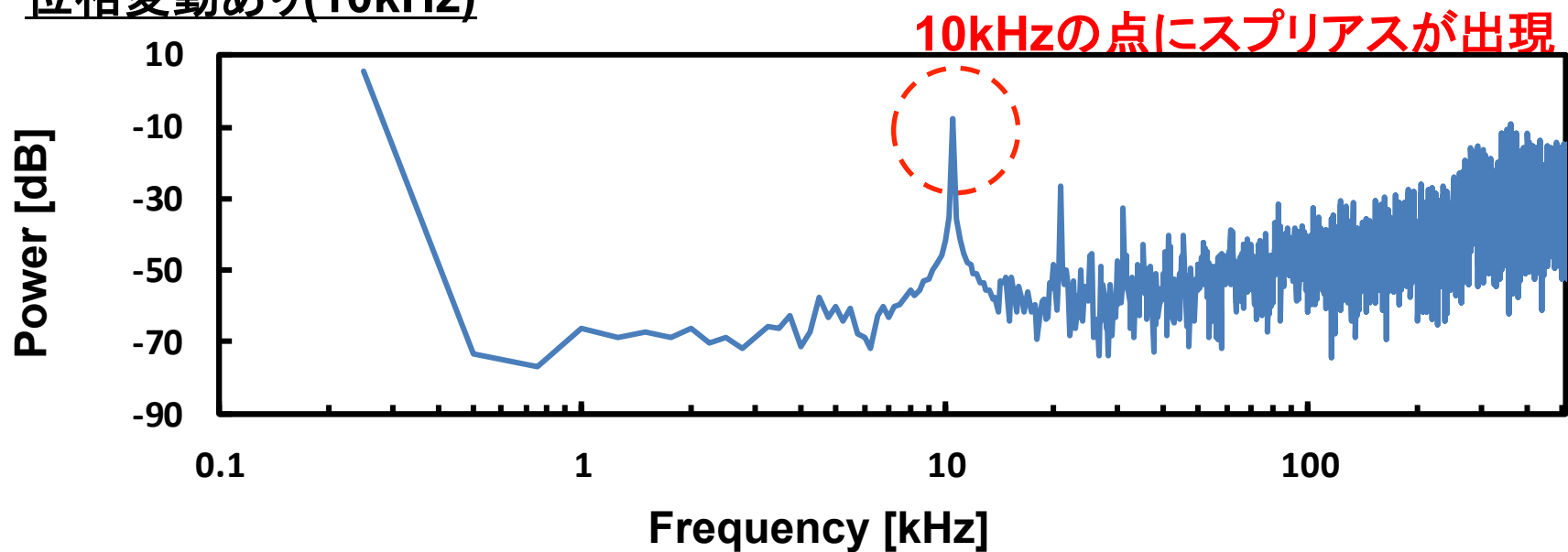
FFT 0~3999 $\mu\text{s}$ までの4000点



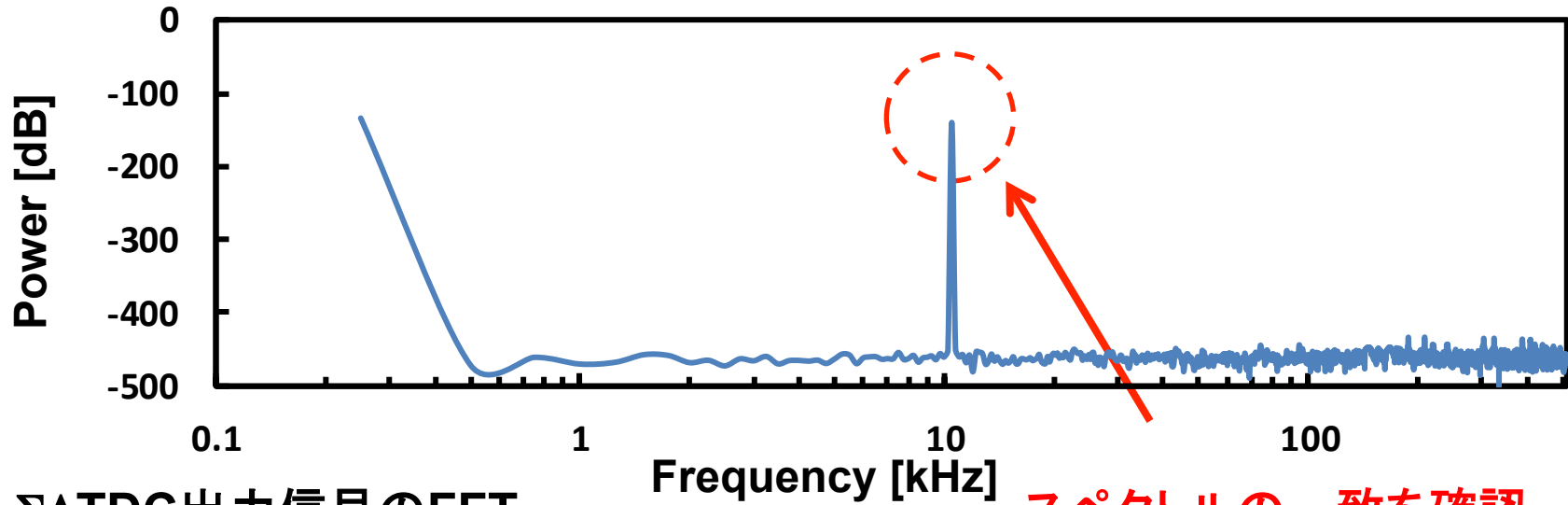
## 位相変動なし



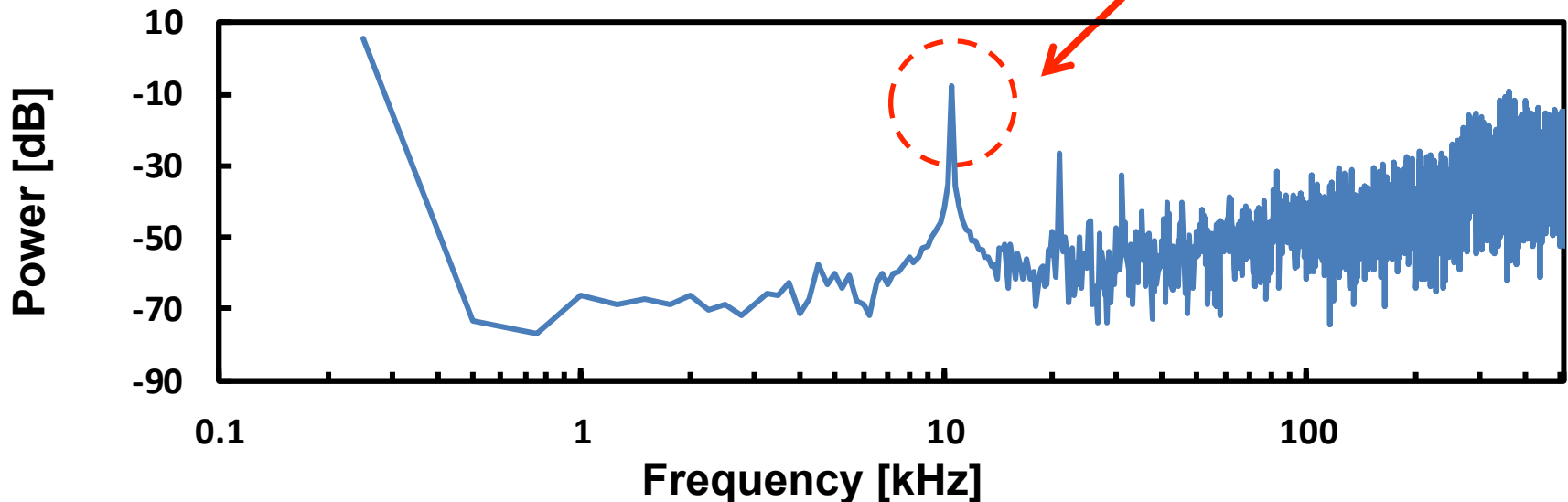
## 位相変動あり(10kHz)



## 入力CLK信号のFFT



## $\Sigma\Delta$ TDC出力信号のFFT



## まとめ

- $\Delta\Sigma$ TDCを用いた位相ノイズ測定の原理を提案した
  - この手法よりスペクトルアナライザを用いない安価な測定が可能
  - オンチップで測定できるので高性能な測定が可能
- 提案手法の正当性をMATLABを用いたシミュレーションで確認した
  - 単一正弦波の位相変動で、その周波数成分にスプリアスがでていることを確認
  - 入力信号の位相ノイズと出力信号の位相ノイズのスペクトルとの一致を確認

## 今後の課題

- 出現したスプリアスのパワーについての数式的議論
- 外部からの参照クロックが必要ない手法の検討

- (1) 時間分解能回路の研究背景
- (2) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - デルタシグマ変調技術
  - デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作
  - アナログFPGA実現
- (3) マルチビットデルタシグマ型タイムデジタイザ回路
  - マルチビット変調器の問題点
  - DWAアルゴリズム
  - アナログFPGA実現
- (4) 位相ノイズ測定への応用の検討
- (5) まとめ

2つのクロック間の立ち上がり時間差を高時間分解能で測定する  
デルタシグマ型タイムデジタイザ回路について

下記をご紹介します。

(1) デルタシグマ型タイムデジタイザ回路の構成と動作

(2) 開発した高精度化のアルゴリズムと

そのMATLABシミュレーションによる効果確認

(3) 回路設計、アナログFPGA(PSoC) 実現、測定評価結果

(4) 位相ノイズ測定への応用の検討

集積回路分野の研究者

フルカスタムIC重視、(アナログ)FPGAに関心少ない傾向



(アナログ)FPGAは「破壊的イノベーション」になる(?)



Time is *GOLD* !!

$\Delta\Sigma$ TDC is a key.

この研究をご支援いただいています  
半導体理工学研究センター(STARC)に  
感謝いたします。



## [フラッシュ型TDCの最初の論文](#)

- [1] Y. Arai, T. Baba, “A CMOS Time to Digital Converter VLSI for High-Energy Physics”,  
IEEE Symposium on VLSI Circuits (1988).

## [\$\Delta\Sigma\$ 変調技術の発明者 安田靖彦先生の回顧・解説文](#)

- [2] 安田 靖彦「技術の生みの親・育ての親」郵政研究所月報 巻頭言 (2001年7月).

## [\$\Delta\Sigma\$ TDCの最初の論文](#)

- [3] B. Young, K. Sunwoo A. Elshazly, P. K. Hanumolu, “A 2.4ps Resolution 2.1mW Second-order Noise-shaped Time-to-Digital Converter with 3.2ns Range in 1MHz Bandwidth,” IEEE Custom Integrated Circuits, San Jose (Sept. 2010)

## [マルチビット \$\Delta\Sigma\$ TDCの線形性向上技術](#)

- [4] S. Uemori, M. Ishii, H.Kobayashi, et. al., “Multi-bit Sigma-Delta TDC Architecture with Improved Linearity,”  
Journal of Electronic Testing : Theory and Applications, Springer, vol. 29, no. 6, pp.879-892 (Dec. 2013).

## [\$\Delta\Sigma\$ TDCの位相ノイズ測定法への提案](#)

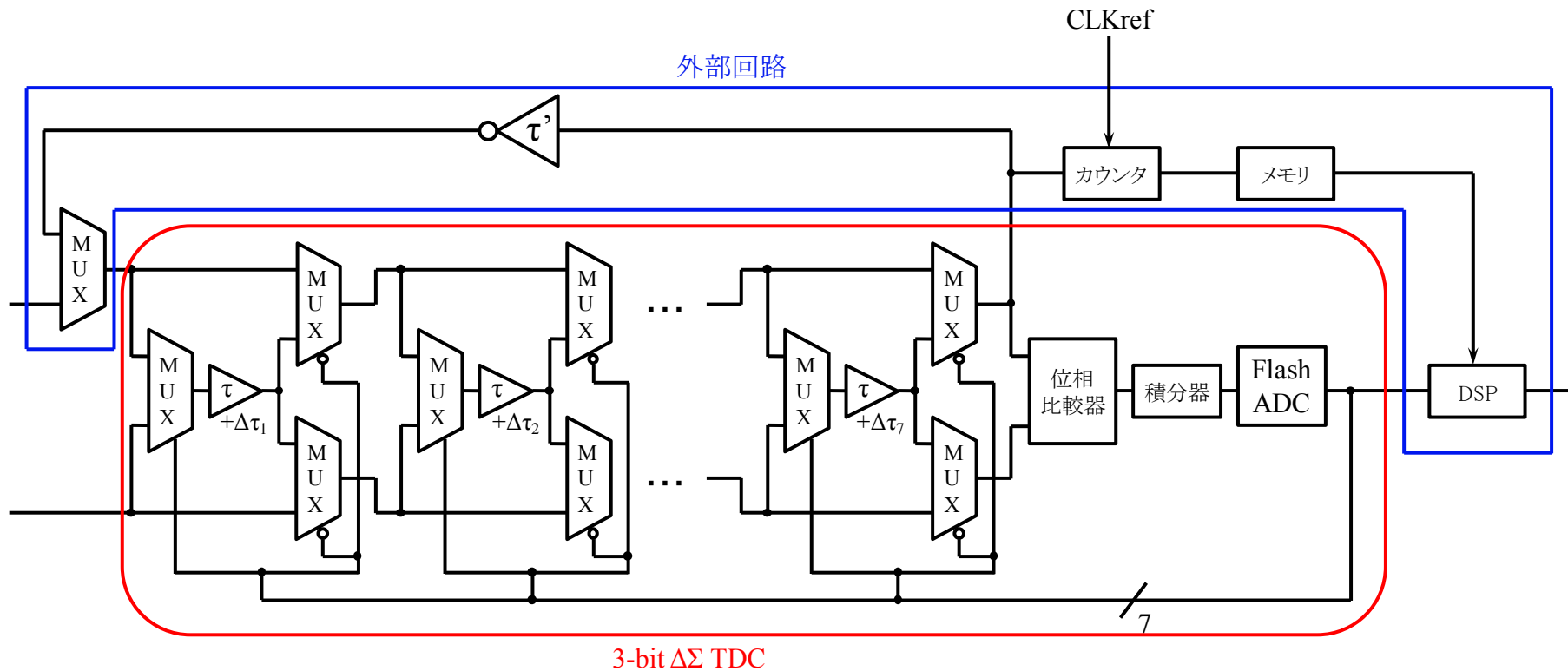
- [5] D. Hirabayashi, Y. Osawa, N. Harigai, H. Kobayashi et. al., ”Phase Noise Measurement with Sigma-Delta TDC”,  
IEEE International Test Conference, Poster Session, Anaheim, CA (Sept. 2013).
- [6] 大澤 優介、平林 大樹、針谷 尚裕、小林 春夫、新津 葵一、小林 修「デルタシグマTDCを用いた位相ノイズ測定」  
電気学会 電子回路研究会 島根 (2014年7月)

## [シングルビット \$\Delta\Sigma\$ TDCのアナログFPGA実現](#)

- [7] 平林 大樹、荒川 雄太、河内智、石井 正道、上森 聡史、佐藤 幸志、小林 春夫、新津 葵一、高井 伸和  
「デジタル信号タイミング試験用BOSTの検討」電気学会 電子回路研究会, 熊本(2012年10月)

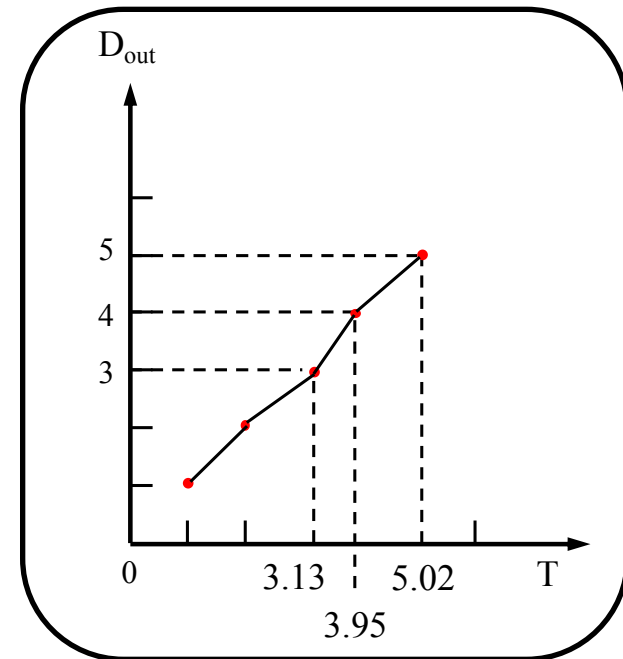
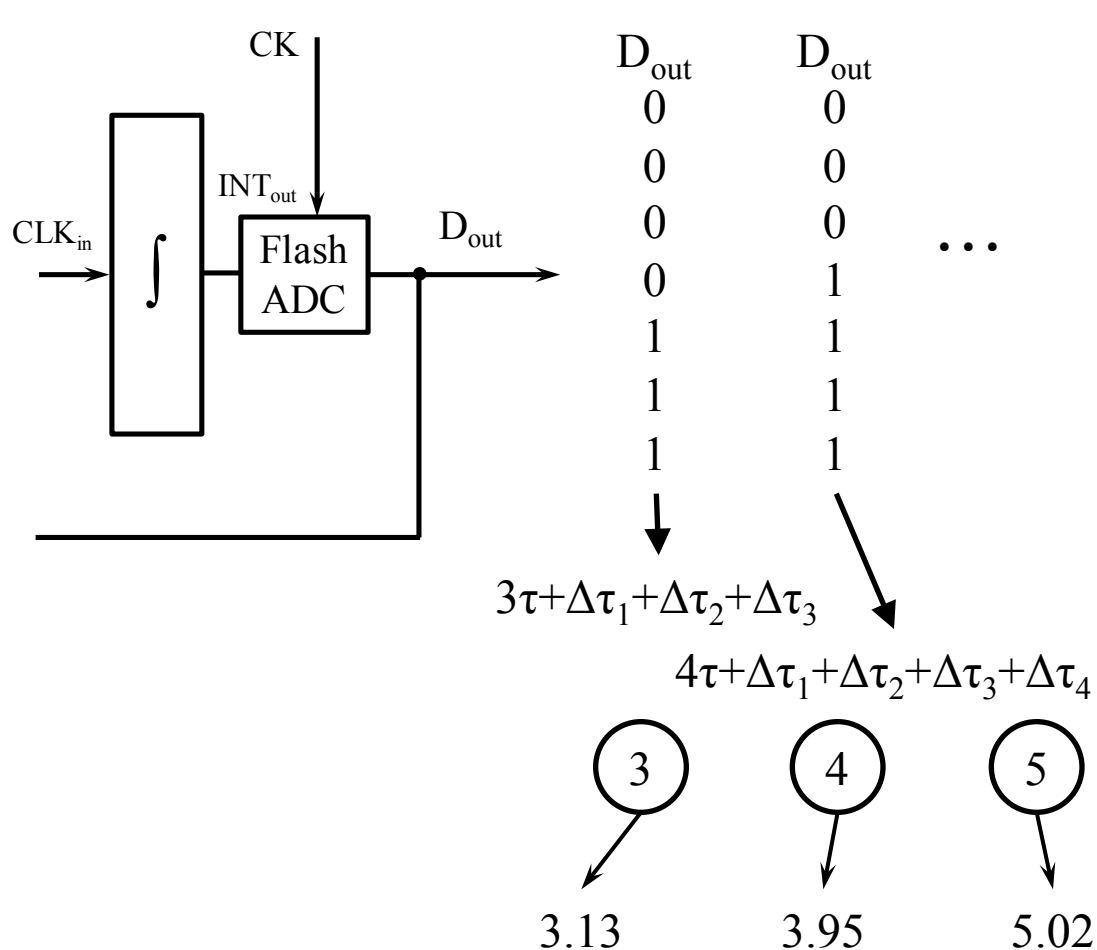
- マルチビット $\Delta\Sigma$ TDC回路の  
遅延セルミスマッチの自己校正

# 自己校正の全体構成

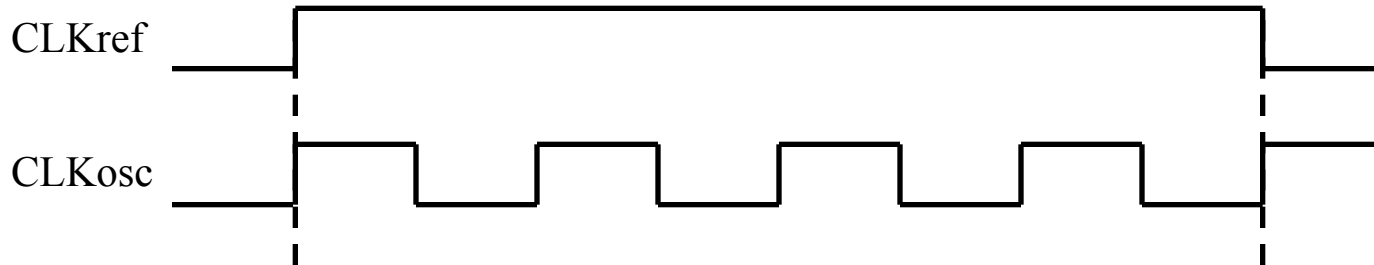
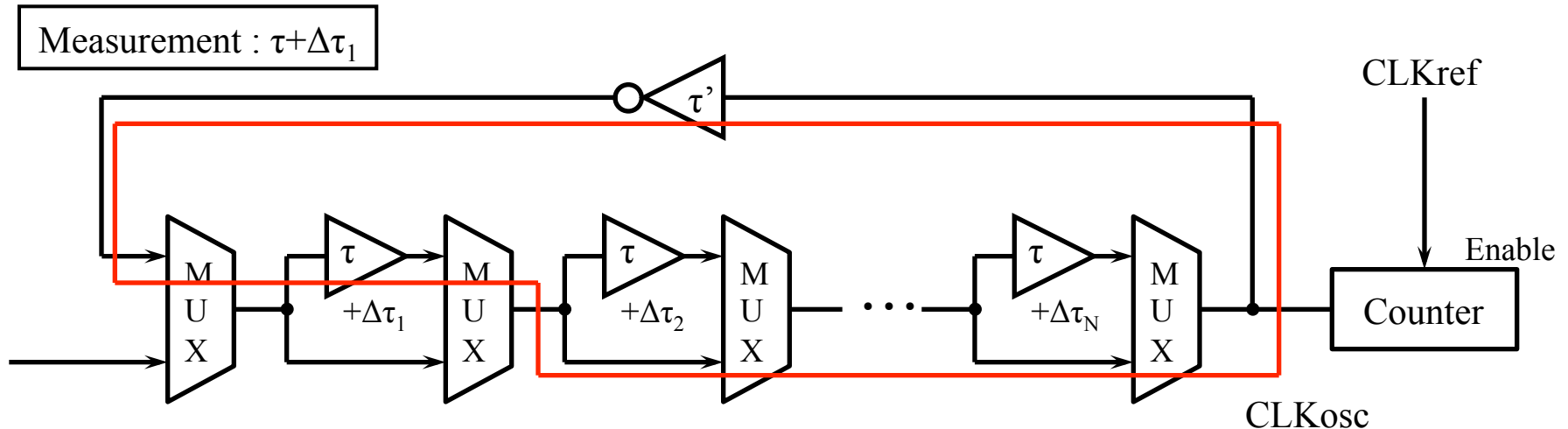


- インバータ、カウンタ、メモリ、マルチプレクサを追加
- 各遅延値を測定しメモリに格納
- クロック間立ち上がり時間差を測定
- メモリから遅延データを読み出し出力補正

# 自己測定遅延値を用いた出力補正方法 124

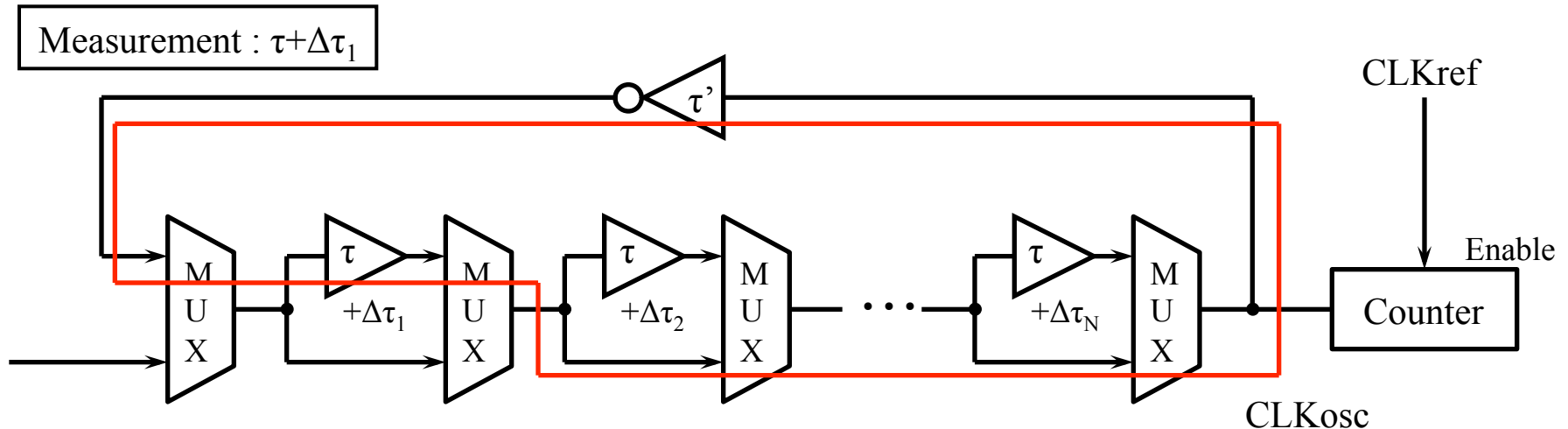


- 誤差を含む遅延値を考慮して出力することで線形化を目指す
- 細かい遅延値がわかれば精度の向上可能
  - 遅延値の自己測定が必要



- リング発振回路構成として自己測定
- カウンタでパルス数を数え発振周波数を求める
- デジタル的に測定可能

# 遅延時間の自己測定方法



発振周波数  
CLKosc

$$f = \frac{1}{2(\tau' + \tau + \Delta\tau_1)}$$

発振周波数から  $\Delta\tau_1$  を計算可能

同様に  
 $\Delta\tau_2, \Delta\tau_3, \Delta\tau_4, \dots, \Delta\tau_N$   
を測定可能

- 測定遅延値情報はメモリに格納
  - その情報を基に出力時に補正

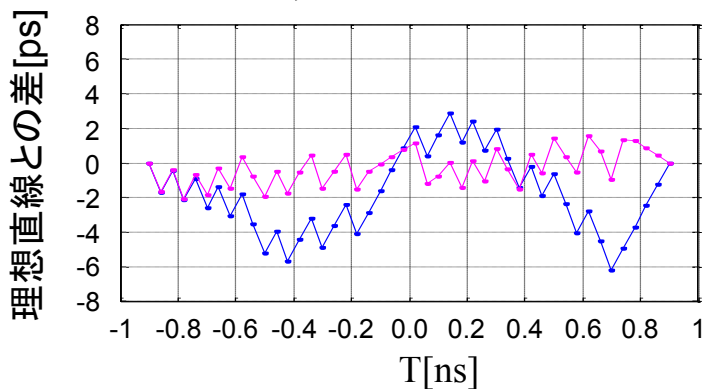
# 測定済遅延値による自己校正の検証

・3-bit  $\Delta\Sigma$  TDC (遅延時間 :  $\tau=0.145\text{ns}+\Delta\tau_N$ )

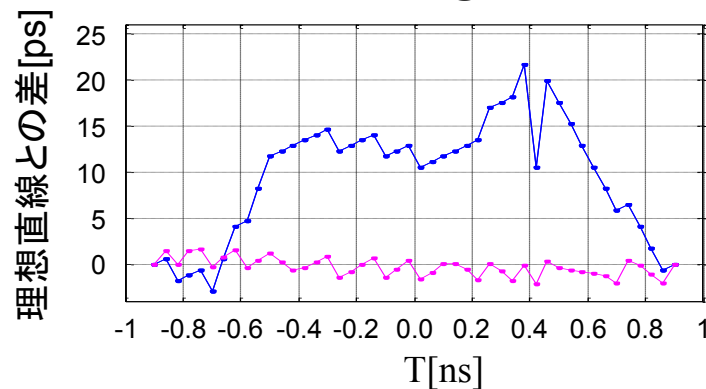
MATLAB シミュレーション

条件①

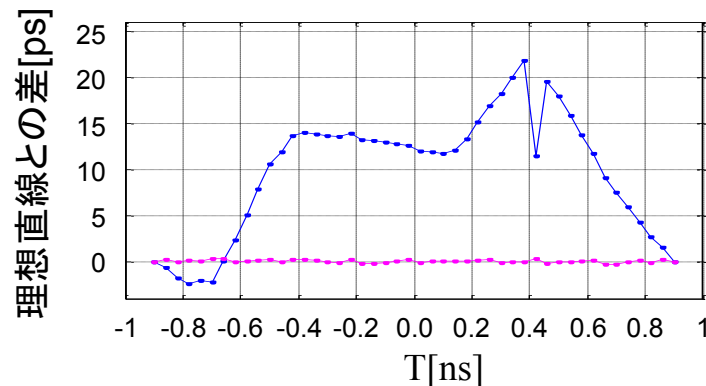
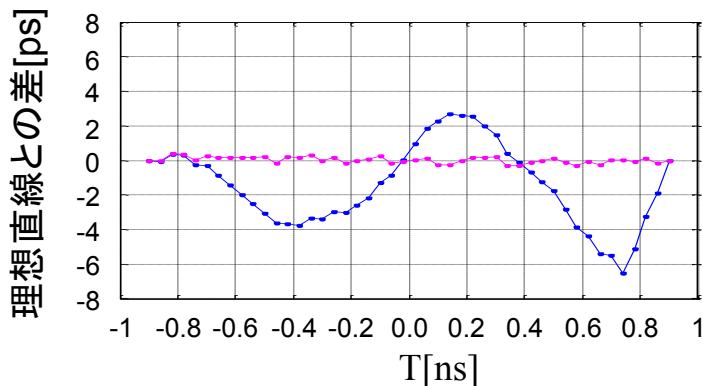
● 出力数 : 99点



条件②



● 出力数 : 599点



✓遅延ミスマッチの影響が軽減  
➤ 出力の線形性を改善

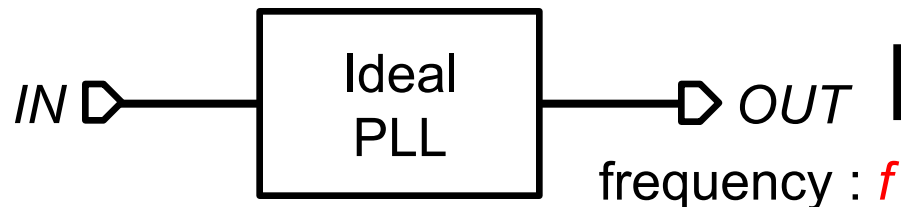
●  $\Delta\Sigma$  TDC(with Self-Calibration)  
●  $\Delta\Sigma$  TDC(without Self-Calibration)

- 位相ノイズ測定の  
回路レベルシミュレーション

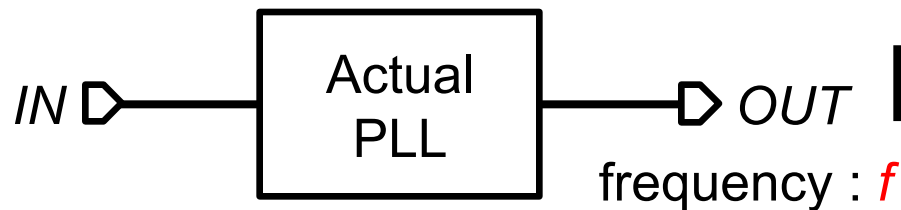
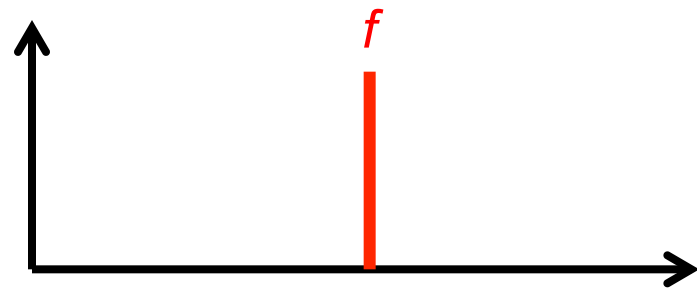


# 従来の位相ノイズ測定

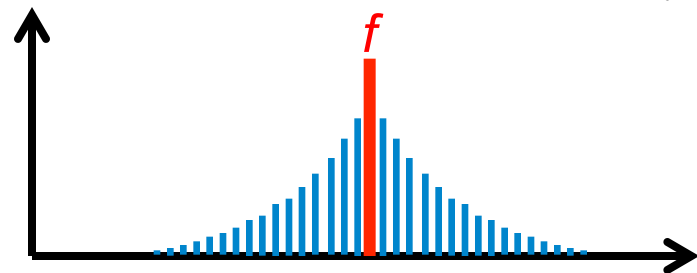
## 位相ノイズとは



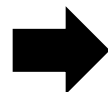
FFT



FFT



位相ノイズ = 周波数の変動



システムの誤動作の原因となる

## 位相ノイズ測定

### 従来の位相ノイズ測定

- スペクトラムアナライザが必要
- 長時間測定(十数秒)

高コスト



大量のLSIの  
平行試験

大量のスペクトラムアナライザ



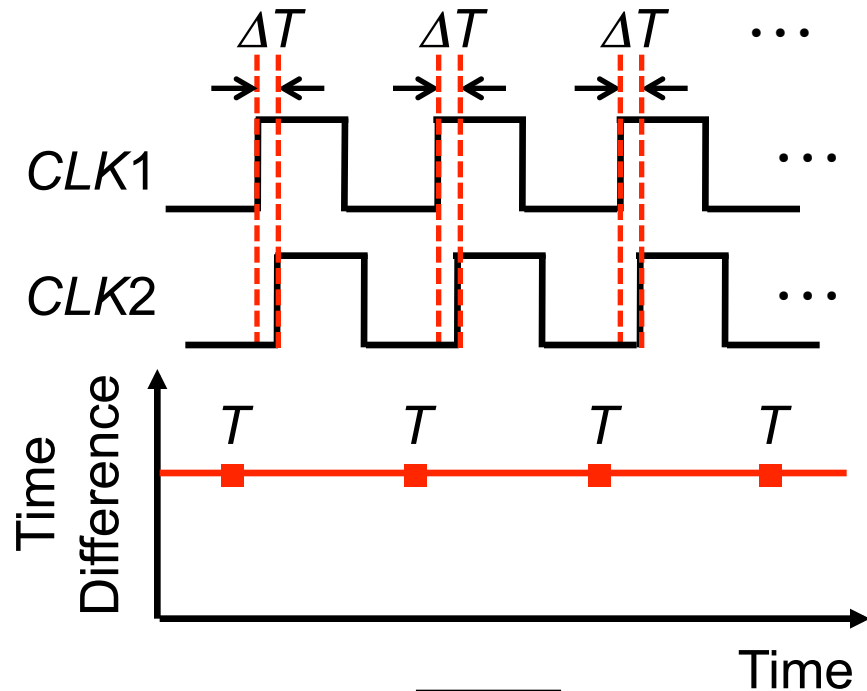
非常に高コスト

$\Delta\Sigma$  TDCを利用した位相ノイズ測定を提案

測定時間: 十数秒  $\rightarrow$  数ミリ秒

# 位相ノイズ測定原理

## 位相ノイズがない信号

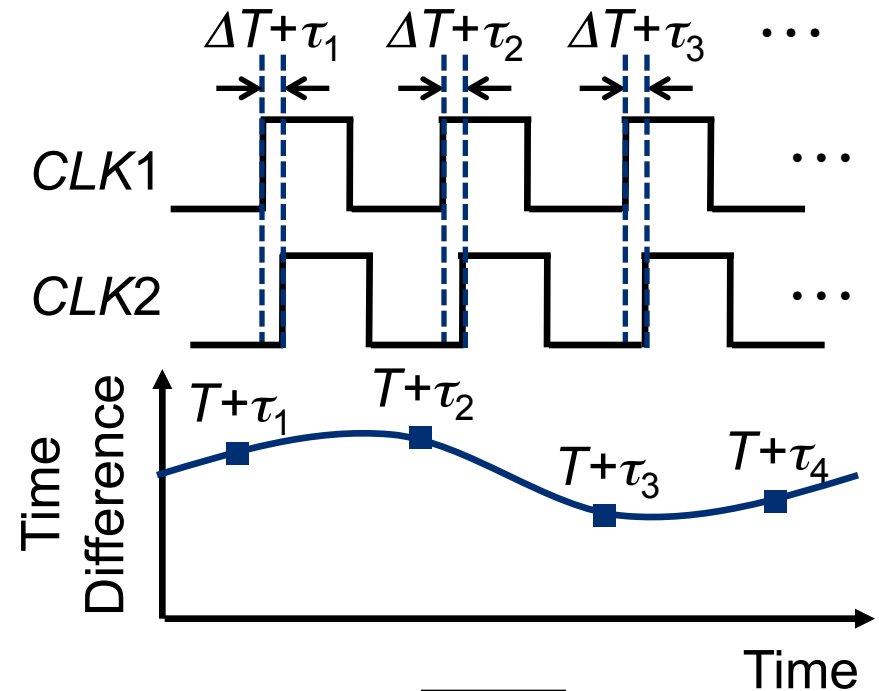


FFT



DC成分のみスペクトルが出る

## 位相ノイズを持つ信号

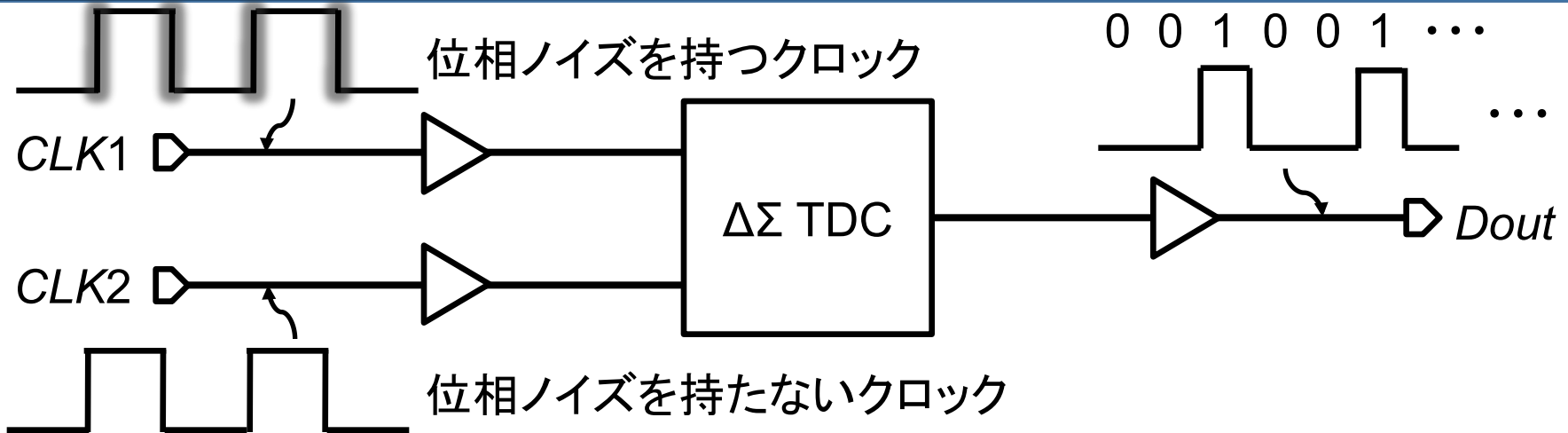


FFT



位相ノイズ測定可能

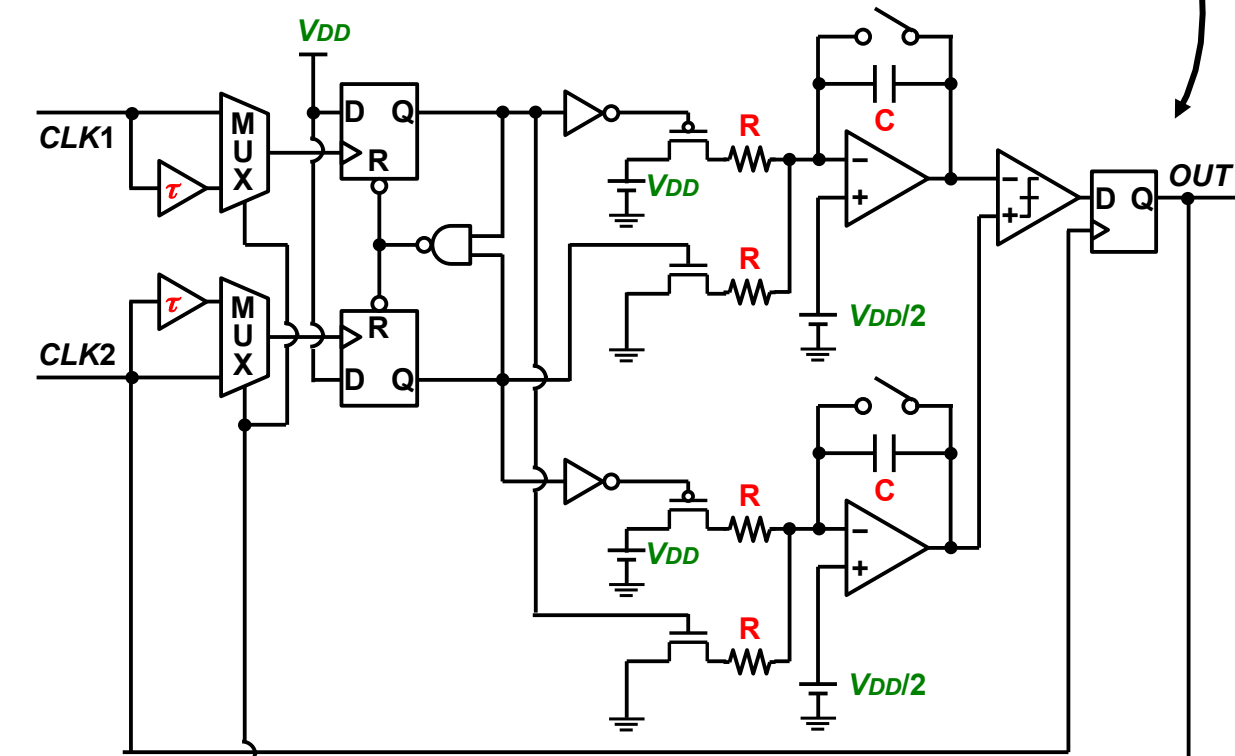
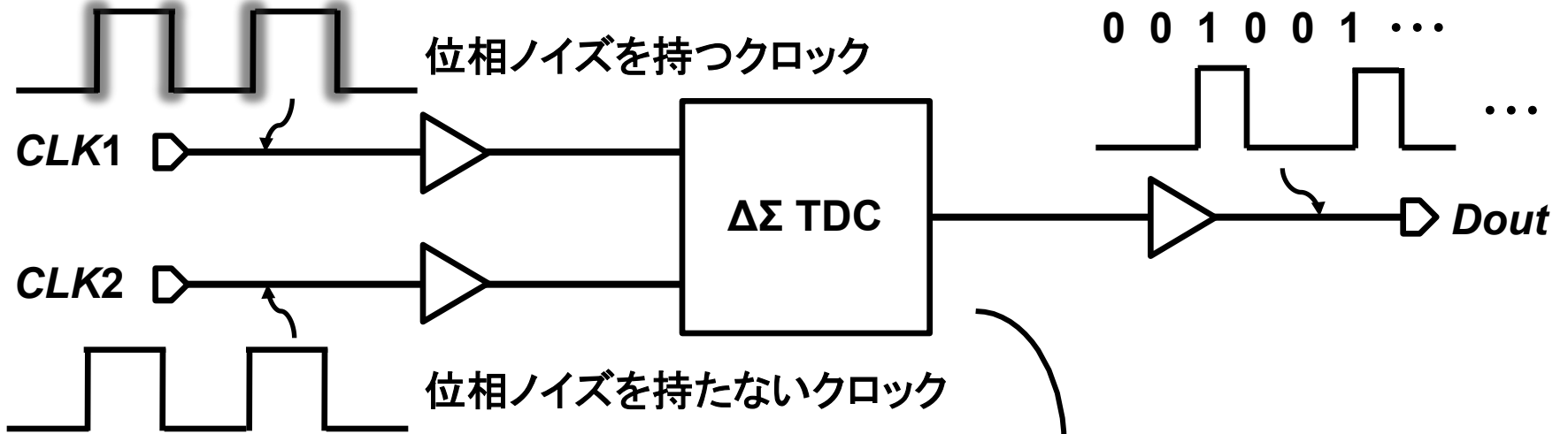
# 位相ノイズシミュレーション条件



## シミュレーション条件

シミュレーションツール	Spectre	
プロセス	180nm CMOS	
遅延素子	500ps	
入力周波数	10.24MHz	
位相ノイズ	単一正弦波	10kHz
	正弦波合成	10kHz, 50kHz
データ点数	4096	

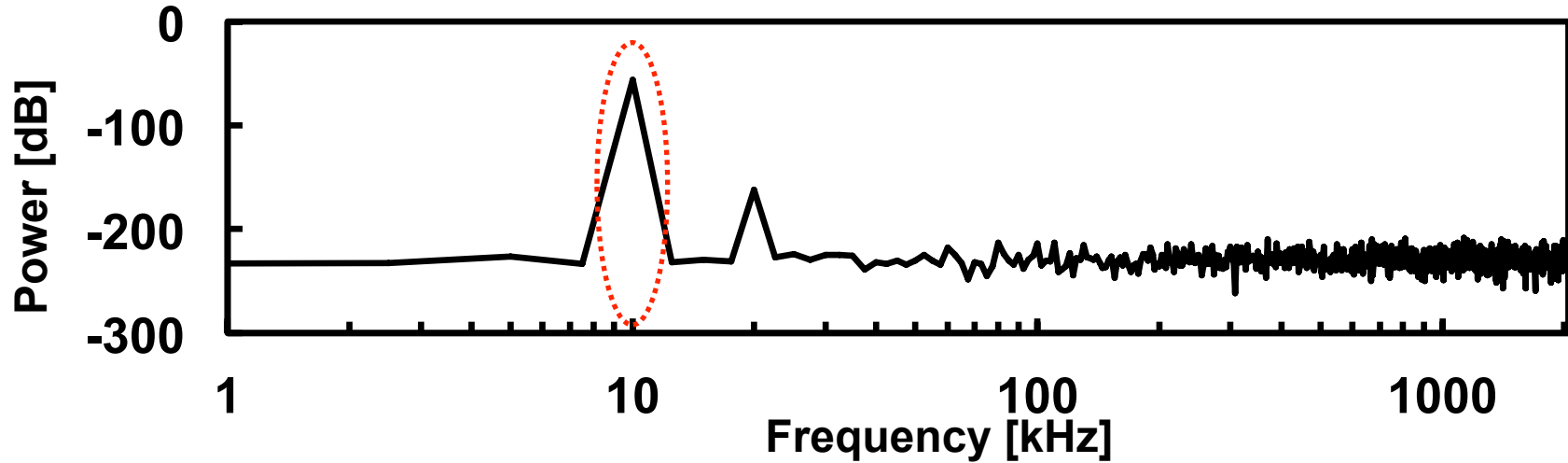
# 位相ノイズシミュレーション回路



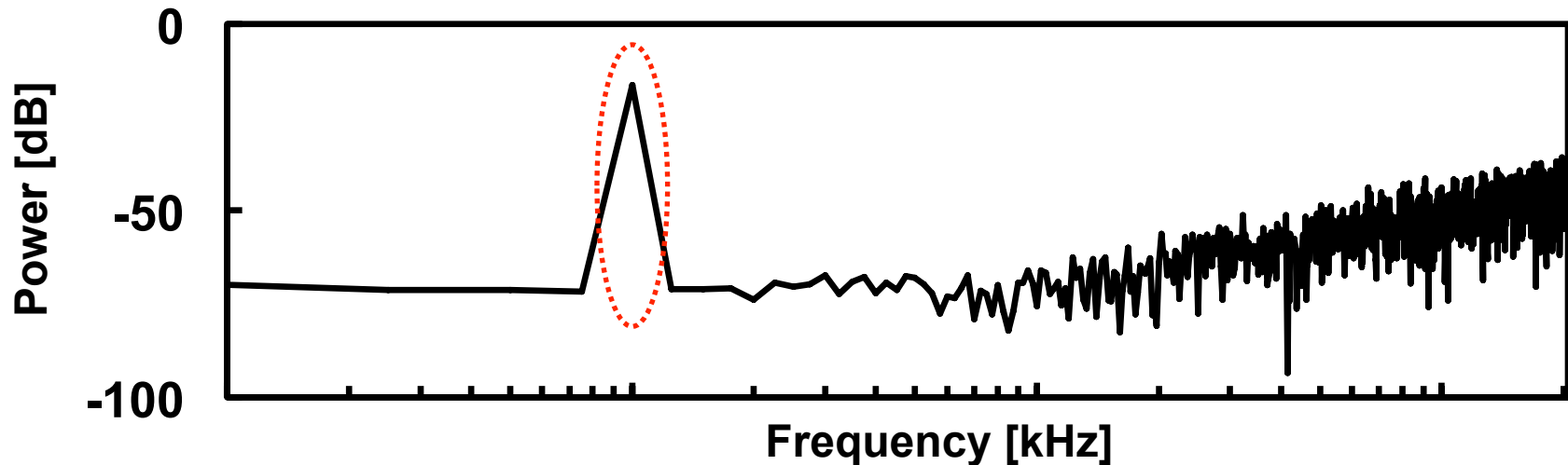
ΔΣ TDCのパラメータ

$V_{DD}$	1.8V
$V_{ref1}$	1.8V
$V_{ref2}$	900mV
$\tau$	500ps
R	3k $\Omega$
C	10pF

位相ノイズを持つ入力クロックのスペクトル



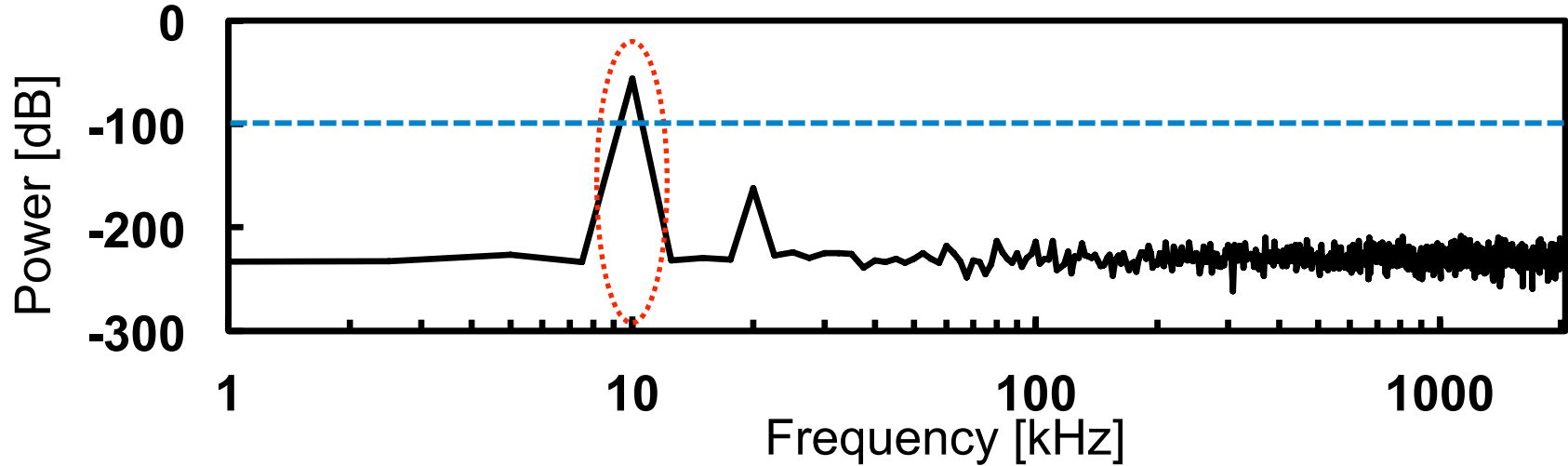
出力のスペクトル



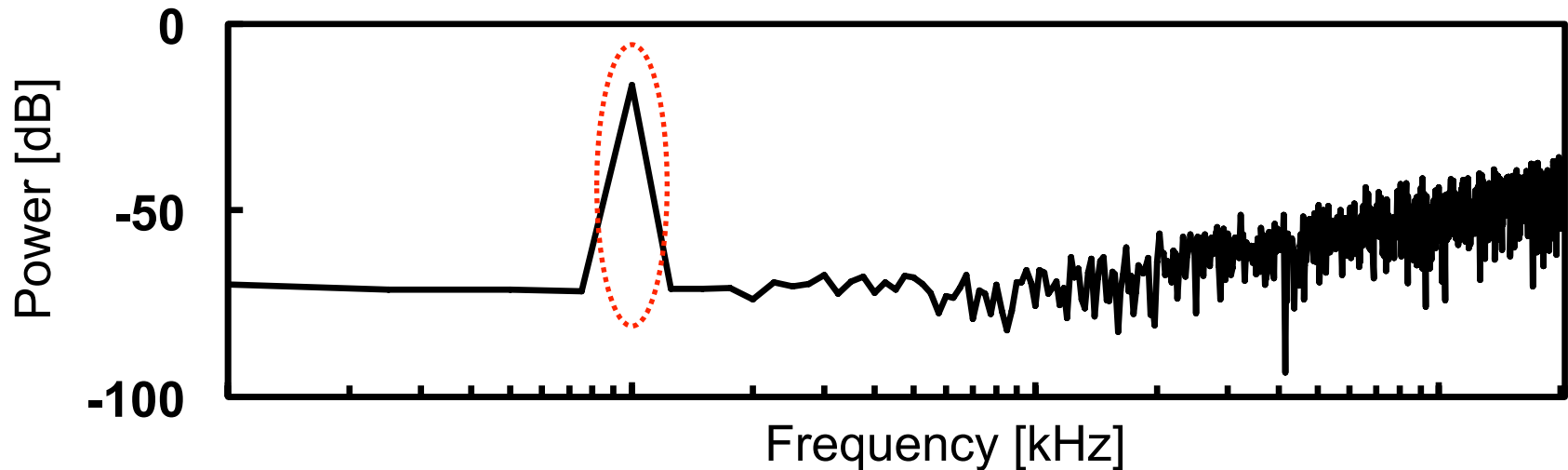
単一正弦波の位相変動の測定を確認

# 単一正弦波の位相変動シミュレーション

位相ノイズを持つ入力クロックのスペクトル



出力のスペクトル



単一正弦波の位相変動の測定を確認

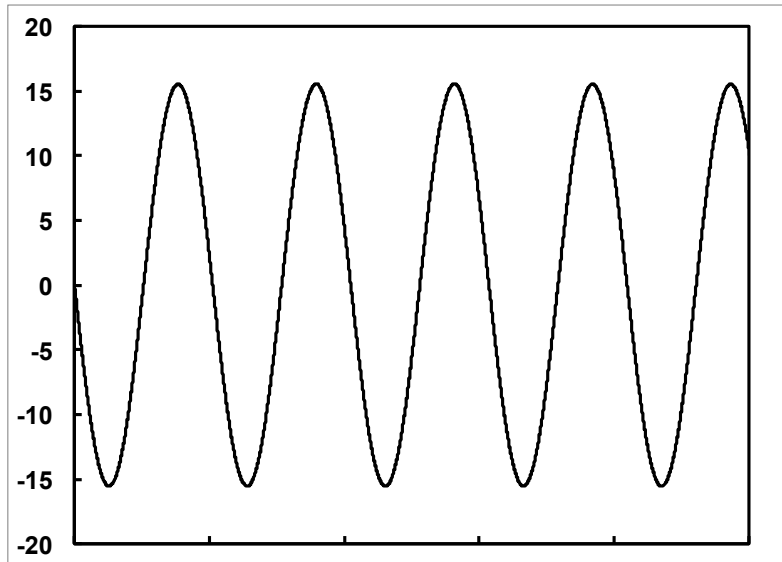
# 正弦波合成の位相変動

実際の位相ノイズには複数の周波数成分が含まれている

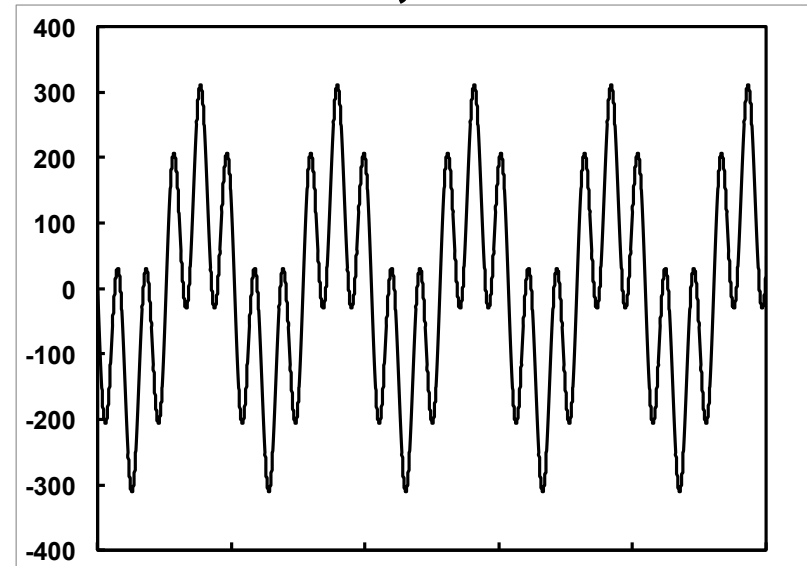


正弦波合成の位相変動測定をシミュレーションによって確認

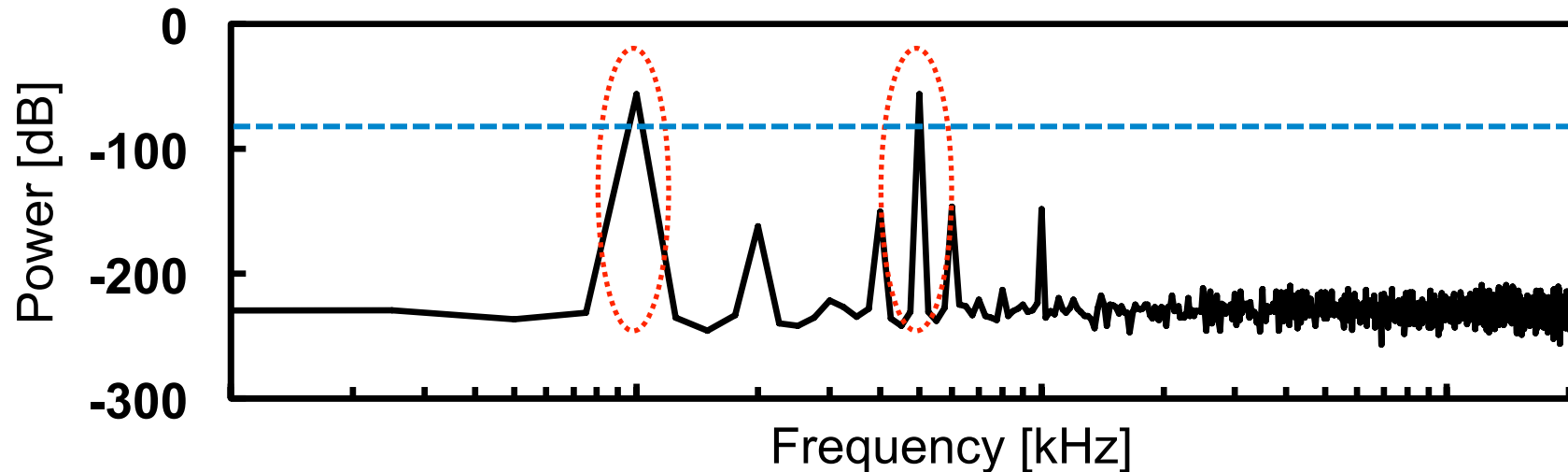
**10kHz**



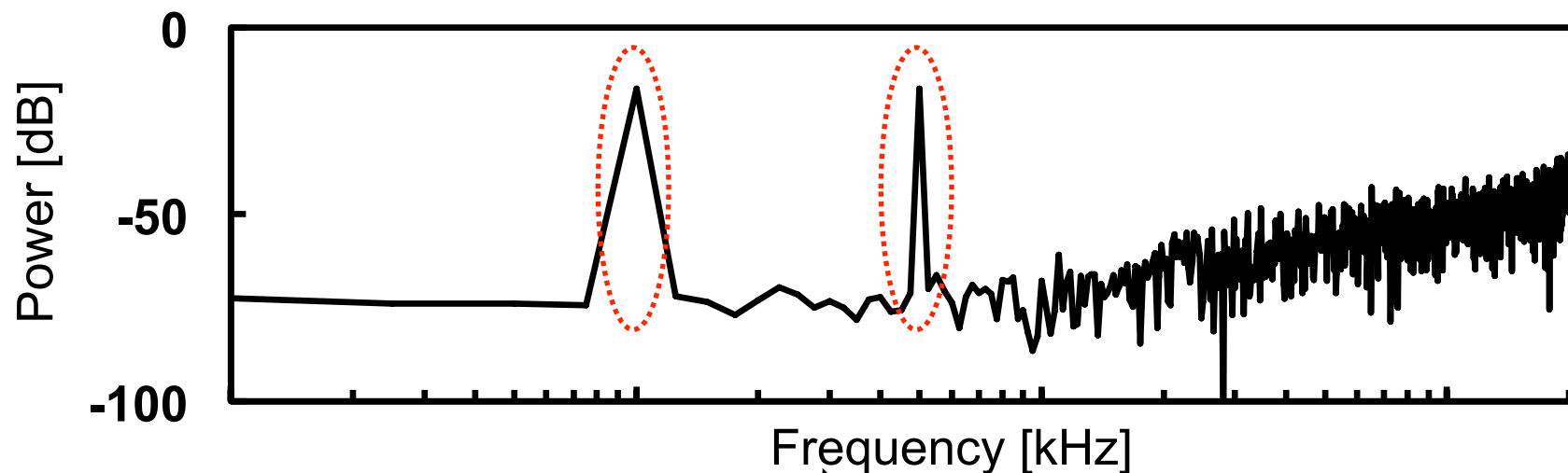
**10kHz, 50kHz**



位相ノイズを持つ入力クロックのスペクトル



出力のスペクトル



正弦波合成の位相変動を測定可能



低コスト・高品質位相ノイズ試験